

www.salampnu.com

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

- ✓ نمونه سوالات پیام نور : بیش از ۱۱۰ هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه
- تستی و تشریحی
- ✓ کتاب ، جزوه و خلاصه دروس
- ✓ برنامه امتحانات
- ✓ منابع و لیست دروس هر ترم
- ✓ دانلود کاملاً رایگان بیش از ۱۴۰ هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور

www.salampnu.com

طرح درس

مقدمات نظري فيزيكي نيمرسانا

مشخصه هاي عدم تعادل نيمرسانا

پيوندگاه p-n

باتري خورشيدي و ديود نور گسيل

ترانزيستورهاي با اثر ميدان پيوندي

ترانزيستورهاي پيوندي دو حاملتي

1فيزيک قطعات نیمه رسانا

اهداف درس

شناخت اصول نیمرسانا

معرفی نیمرساناهای کاربردی

کاربرد نیمرسانا در فیزیک، صنعت و ...

جایگاه درس

درس فیزیک قطعات نیمرسانا از دروس اختیاری دوره کارشناسی فیزیک می باشد.

فصل اول : مقدمات نظریه فیزیکی نیمرساناها

- ساختار بلور جامدات را می توان به انواع بلوری ،چند بلوری ،و آمورف رده بندی کرد.

کتابخانه الکترونیکی **PNUEB**
WWW.PNUEB.COM

مشخصه‌های جریان - ولتاژ dc

$$p_n - p_{no} = \Delta p_n$$

$$D_p \frac{d^2 \Delta p_n}{dx^2} - \frac{\Delta p_n}{\tau_p} = \frac{\partial p_n}{\partial t} = 0$$

$$\Delta p = K_1 \exp\left(-\frac{x}{\sqrt{D_p \tau_p}}\right) + K_2 \exp\left(\frac{x}{\sqrt{D_p \tau_p}}\right)$$

که K_1 و K_2 ثابت‌هایی هستند که باید تعیین شوند. شرایط مرزی عبارت‌اند از

$$p_n = \begin{cases} p_n(0) = p_{no} e^{V/V_T}, & x = 0 \text{ به‌ازای} \\ p_{no}, & x = \infty \text{ به‌ازای} \end{cases}$$

$$\Delta p_n = p_{no}(e^{V/V_T} - 1)e^{-x/L_p}$$

1. جامدات چند بلوری

- نواحی کوچک متعددی وجود دارند، که هر یک ساختار خوش سازمانی دارد، لیکن این سازمان با نواحی مجاور آن متفاوت است.

$$L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$$

ماد L_p طول پخش حفره

$$I_p = qA \frac{D_p P_{p0}}{L_p} (e^{V/V_T} - 1) e^{-x/L_p}$$

جریان حفره در لبه لایه بار فضایی به ازای $x = 0$ ارزیابی می شود

$$I_p(0) = qA \frac{D_p P_{n0}}{L_p} (e^{V/V_T} - 1)$$

$$I_p = I_p(0) e^{-x/L_p}$$

$$\Delta n_p = n_{p0} (e^{V/V_T} - 1) e^{-x'/L_n}$$

$$I_n = I_n(0) e^{-x'/L_n}$$

$$I_n(0) = qA \frac{D_n n_{n0}}{L_n} (e^{V/V_T} - 1)$$

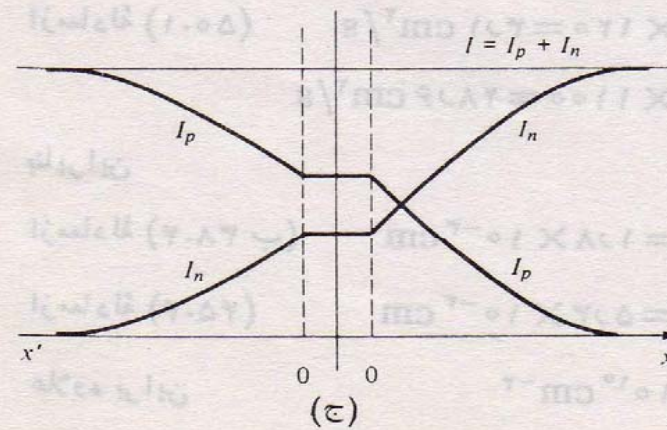
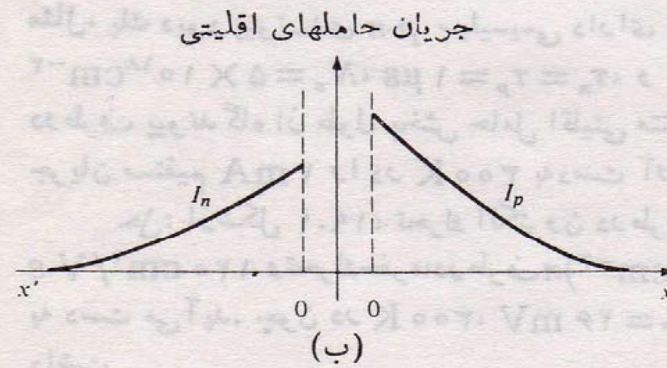
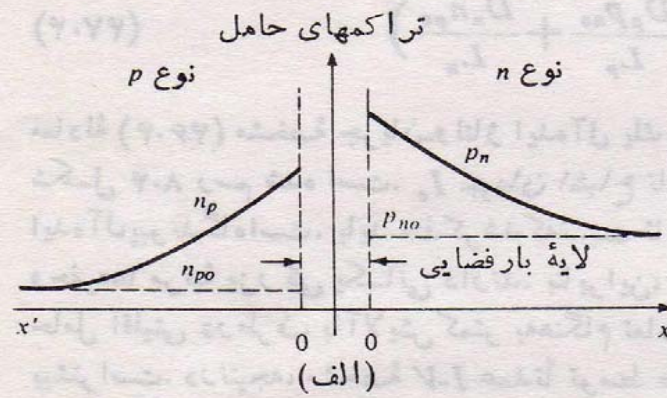
$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$$

L_n طول پخش الکترون

2. جامدات آمورف

- ساختار خوش-تعریفی ندارند؛ در حقیقت ، وجه تمایزشان ، بی شکلی آنها است.

$$I = I_n(\circ) + I_p(\circ) = I_o(e^{V/V_T} - 1)$$

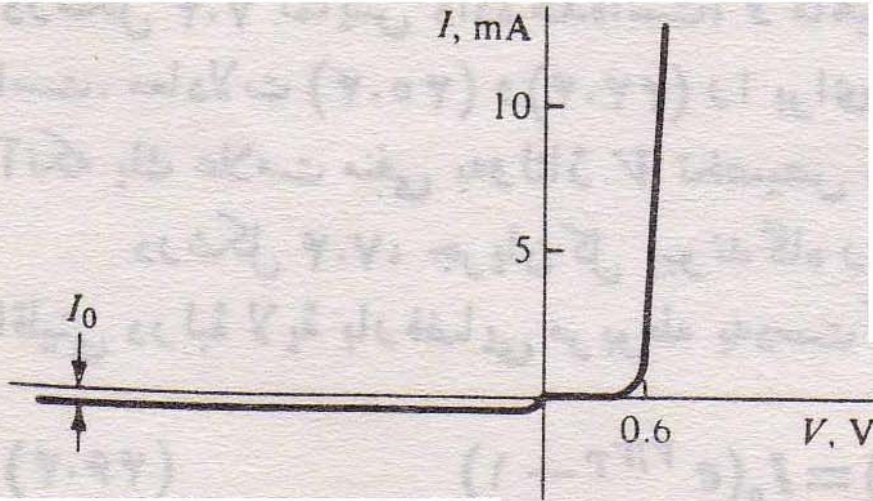


$p-n$ در پیش ولت
 حاملهای اقلیتی،
 اقلیتی، و (ج)

1 فیزیک قطعات نیمه رنفره.

3. جامدات بلورین

- اتمها در یک آرایه منظم سه بعدی مرتب شده اند که یک ساختار تناوبی به نام شبکه را تشکیل می دهند.
- می توان یک سلول واحد مشخص کرد که از تکرار آن در سه بعد ، جامد بلورین به وجود می آید.



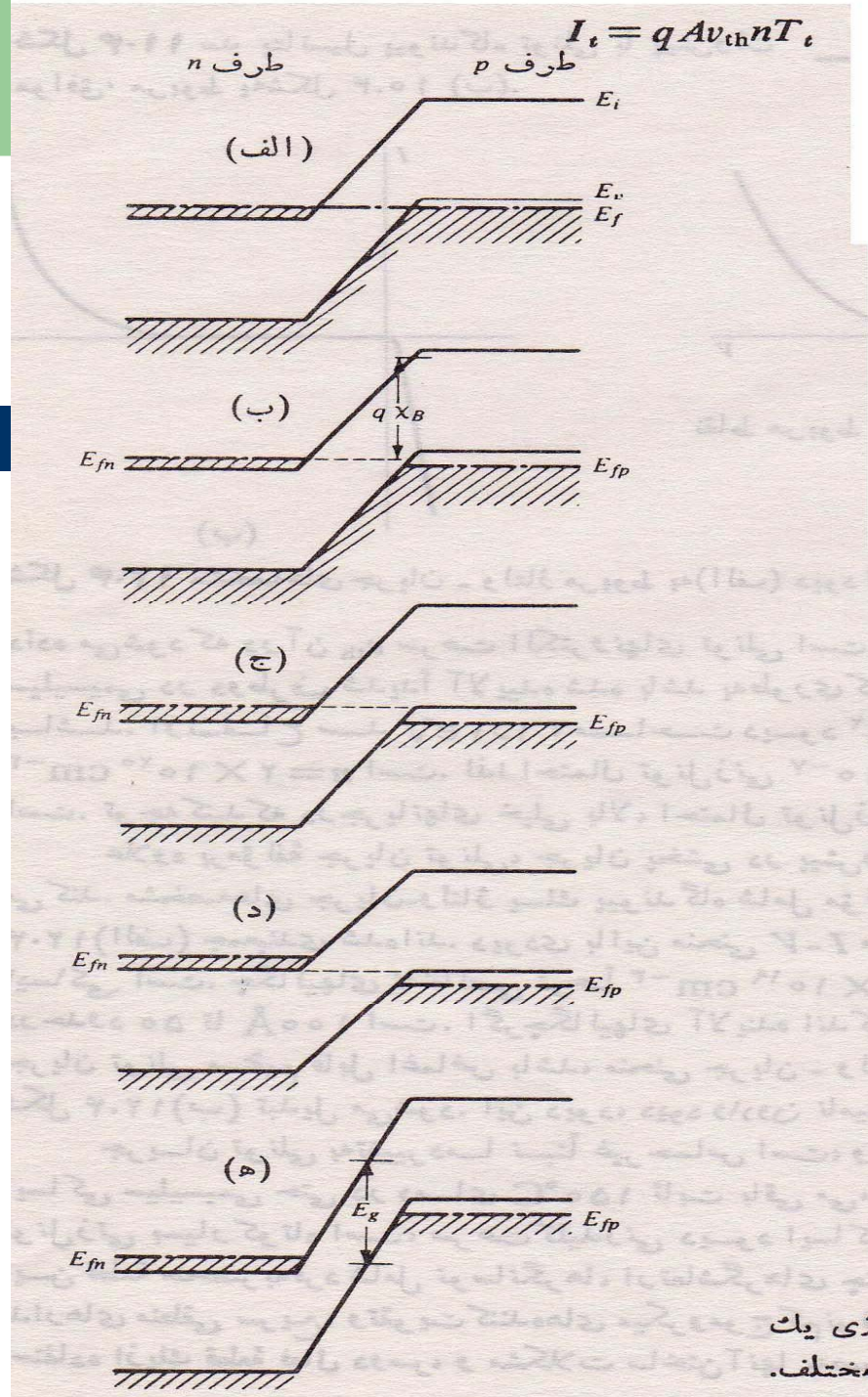
مشخصه جريان-ولتاژ
يك پيوند گاه $p-n$.

$$I_0 = qA \left(\frac{D_p p_{no}}{L_p} + \frac{D_n n_{po}}{L_n} \right)$$

I_0 جريان اشباع

انواع ساختارهای بلورین مرتبط با این درس

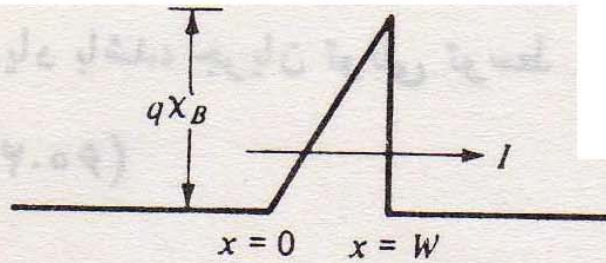
- بلور مکعبی ساده (SC)
- بلور مکعبی مرکز حجمی (bcc)
- بلور مکعبی مرکز سطحی (fcc)
- ساختار الماسی
- ساختار کانی روی-سولفید



نمودار نوار انرژی یک
 تونلی با پیش ولتهای مختلف.
 1 فیزی

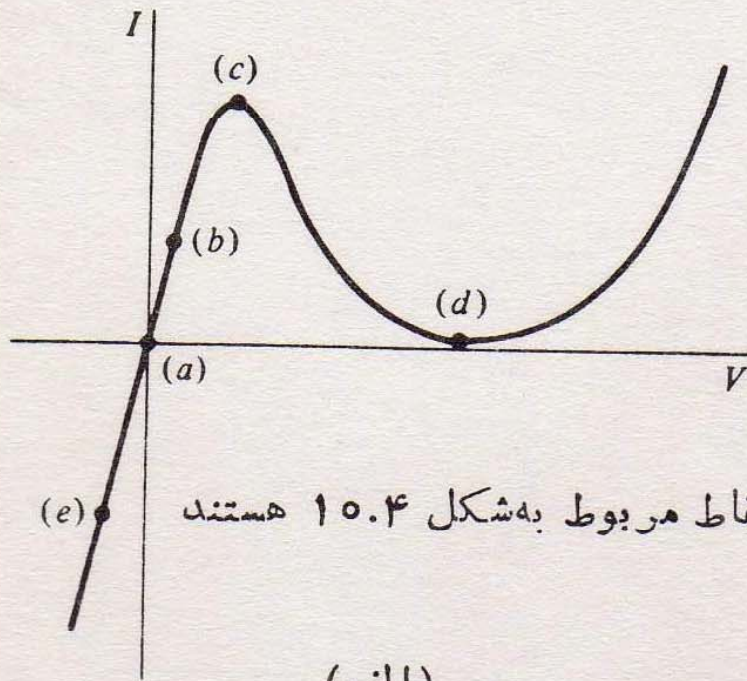
بلور مکعبی ساده (SC)

- هر گوشه از شبکه مکعبی توسط یک اتم اشغال شده است که هشت سلول واحد مجاور در آن سهم دارند.
- تعداد کمی از بلورها دارای این ساختارند، و پولونیم تنها عنصری است که به این شکل تبلور می یابد.



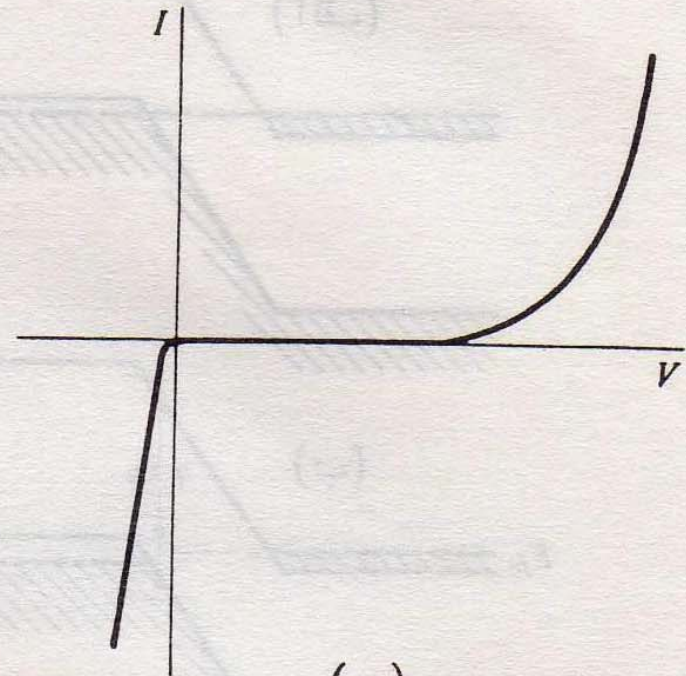
سد پتانسیل پیوندگاه تونلی با پیش ولت

موافق،



نقاط مربوط به شکل ۱۰.۴ هستند (e)

(الف)

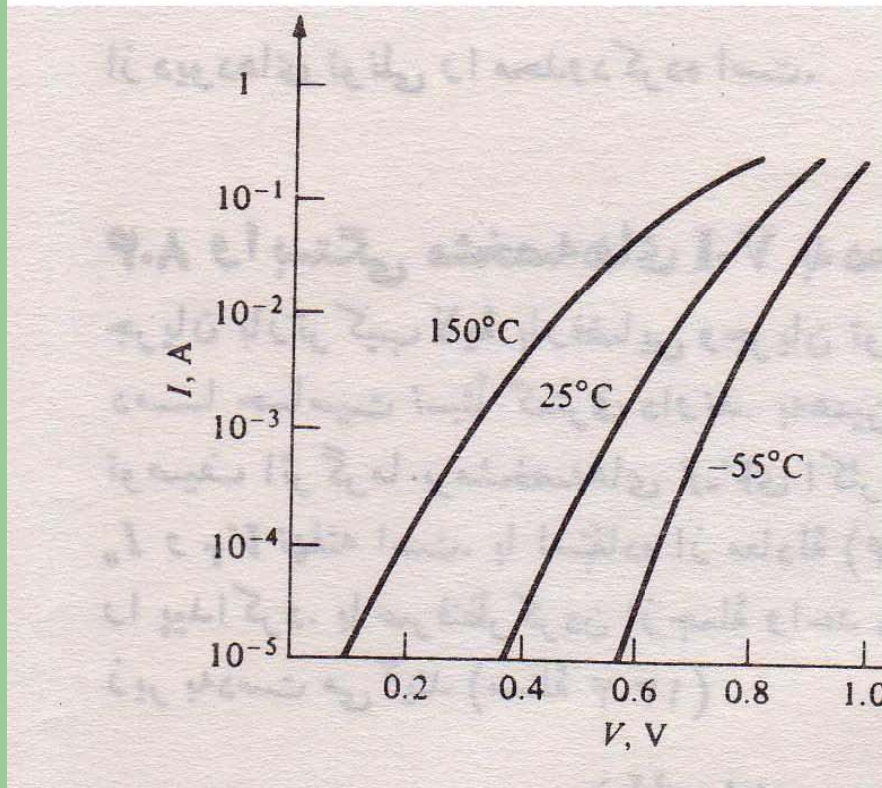


(ب)

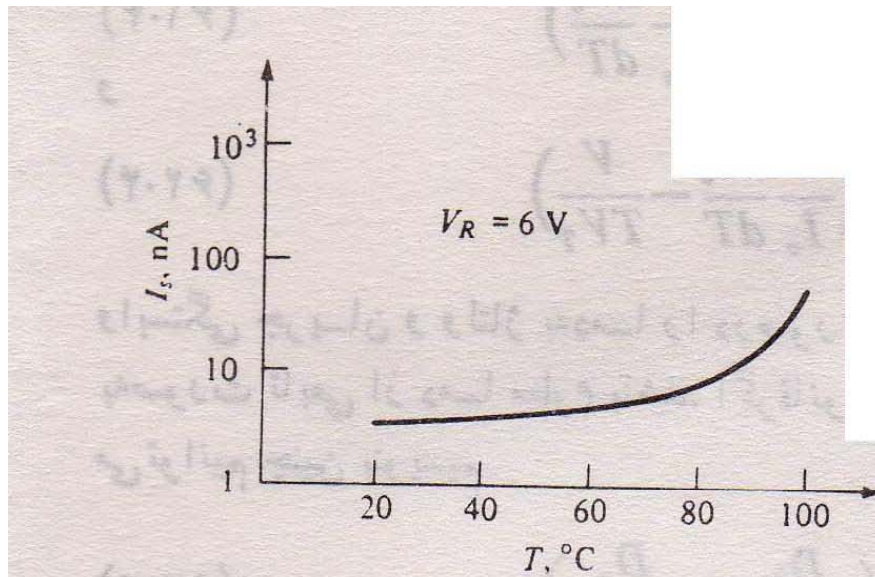
مشخصه‌های جریان - ولتاژ مربوط به (الف) دیود ایساکبی و (ب) دیود وارون.

بلور مکعبی مرکز حجمی (bcc)

- علاوه بر اتمهای گوشه ها، یک اتم نیز در مرکز مکعب واقع شده است.
- بلورهایی که شامل این ساختارند شامل سدیم، مولیبدن، و تنگستن هستند.



اثر دما بر مشخصه جریان-ولتاژ
 یک دیود سیلیسیمی صفحه‌ای.



جریان اشباع وارون به صورت
تابعی از دما در یک دیود $p-n$ سیلیسیمی.

$$\frac{1}{I} \frac{dI}{dT} = \frac{E_{g0} - qV}{kT^2}$$

بلور مکعبی مرکز سطحی (fcc)

- علاوه بر هشت اتم گوشه ها شامل یک اتم در هر یک از شش رخ مکعب است.
- تعداد زیادی از عناصر دارای این شکل بلوری هستند، مانند آلومینیم، مس، طلا، نیکل، و پلاتین.

تحليل و سيگنال کم دامنه ac

در این بخش نحوه به دست آوردن مقاومت ظاهری دیود را ابتدا با پیدا کردن توریع حامل سیگنال کم دامنه ارائه می کنیم. با نهادن يك ولتاژ کوچک بر ولتاژ V_{dc} ، ولتاژ اعمال شده کل عبارت خواهد بود از

$$v = V + v_a e^{j\omega t}$$

ساختار الماسی

- این ساختار را می توان به صورت دو زیر شبکه fcc در هم فرورفته تصور کرد که یکی از آنها نسبت به دیگری به اندازه یک چهارم فاصله در امتداد قطر مکعب جا به جا شده است.

شرط کم دامنه بودن سیگنال این است که سیگنال v_a اعمال شده در مقایسه با V_T کوچک باشد.

$$\exp \frac{v_a e^{j\omega t}}{V_T} = 1 + \frac{v_a e^{j\omega t}}{V_T}, \quad \frac{v_a}{V_T} \ll 1 \quad \text{به ازای}$$

$$p_n(\circ) = P_n(\circ) + p_{a,} e^{j\omega t}$$

$$p_{a,} = \frac{P_{no} v_a}{V_T} e^{v/V_T}$$

$$p_n = P_n + p_a e^{j\omega t}$$

معادله ac عبارت است از

$$D_p \frac{d^2 p_a}{dx^2} - \frac{p_a}{\tau_p} = j\omega p_a$$

که برای آن شرایط مرزی ac عبارت اند از

$$p_a = \begin{cases} p_{a,0}, & x=0 \text{ به ازای} \\ 0, & x=\infty \text{ به ازای} \end{cases}$$

$$p_a = p_{a,0} \exp\left(\frac{-x}{L_p} \sqrt{1 + j\omega\tau_p}\right)$$

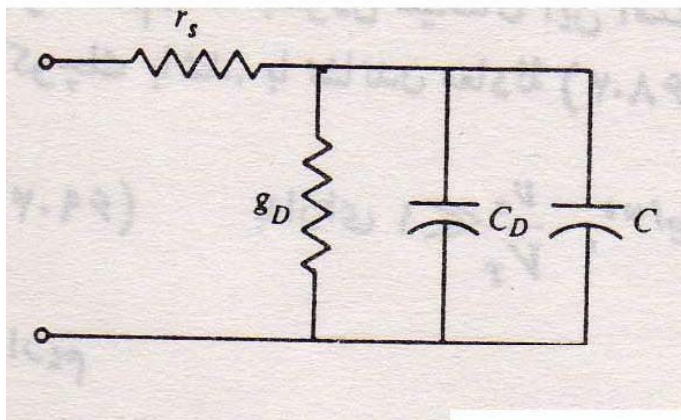
جریان حفره در $x=0$

با مشتق گیری از این چگالی حفره نشان دادن نتیجه در معادله

$$i_p(0) = \frac{v_a}{V_T} I_p(0) \sqrt{1 + j\omega\tau_p}$$

ساختار کانی روی-سولفید

- گالیم آرسنید (GaAs) دارای این ساختار است که به این ترتیب به وجود می آید که در ساختار الماسی، اتمهای Ga بر روی یک شبکه fcc و اتمهای As بر روی شبکه fcc دیگر قرار می گیرند.
- مواد دیگر این خانواده عبارتند از گالیم فسفید، روی-سولفید، و کادمیم سولفید.



مدار معادل يك ديود.

$$i_n(\omega) = \frac{v_a}{V_T} I_n(\omega) \sqrt{1 + j\omega\tau_n}$$

جریان ac کل پیوند گاه $p-n$

$$i = i_p(\omega) + i_n(\omega)$$

برای يك پیوند گاه p^+-n ، $i_p(\omega) = i$ و $I_p(\omega) = I$. لذا، دسانش ظاهری (گذارایی) دیود به

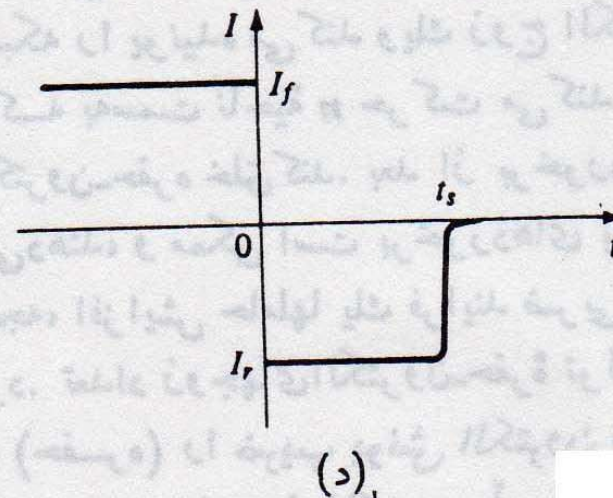
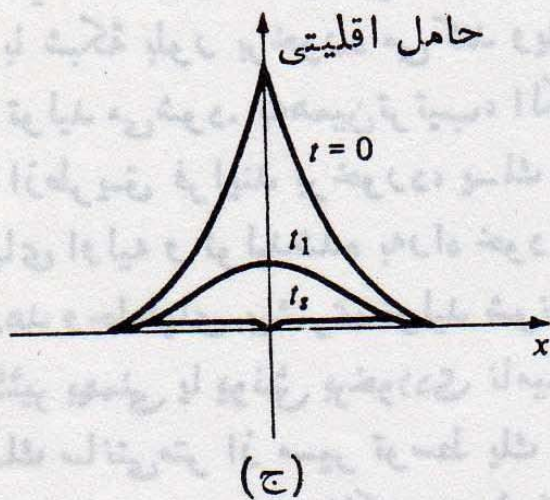
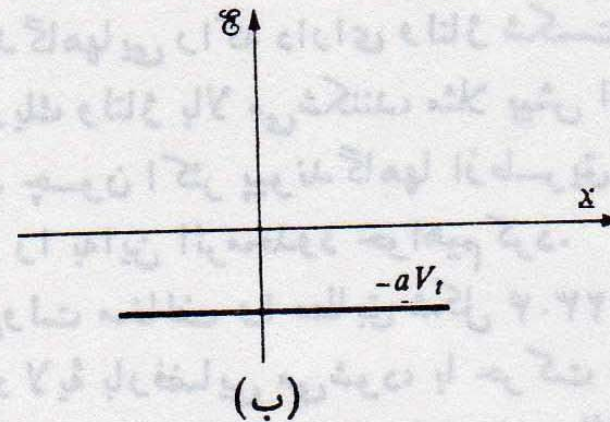
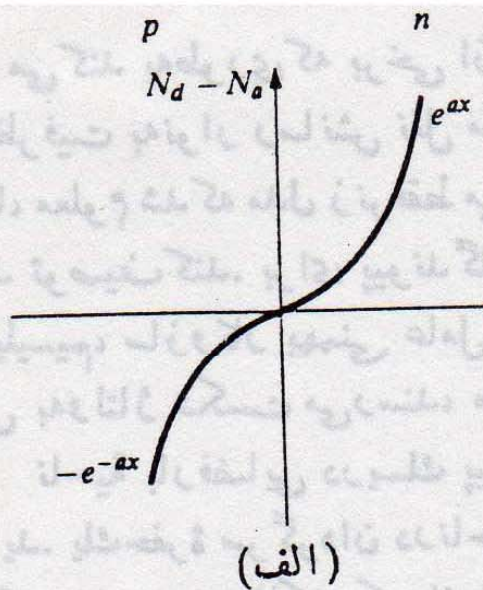
$$y = \frac{i_p(\omega)}{v_a} = \frac{I}{V_T} \sqrt{1 + j\omega\tau_p} \approx \frac{I}{V_T} + j \frac{\omega\tau_p I}{2V_T}$$

با به کار بردن $\omega\tau_p \gg 1$ برای تقریب بسامد پایین

تبدیل می شود.

الکترونیهای رسانش

- خارجی ترین الکترونها، به نام الکترونهاى ظرفیت ، در تعیین خواص الکتریکی جامد از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
- در قید تک تک اتمها نیستند و آزادند که بر اثر اعمال یک میدان الکتریکی، در رسانش جریان مشارکت کنند.



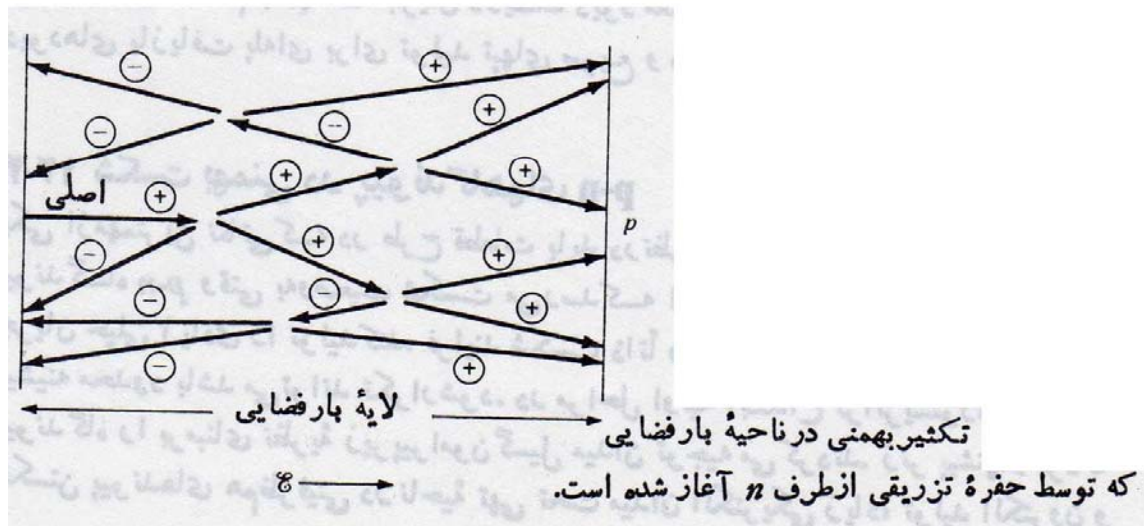
دیود «بازیافت پله‌ای» یا «شلاقی»: (الف) نمایه ناخالصی در نزدیکی پیوندگاه، (ب) توزیع میدان الکتریکی، (ج) توزیع حامل اقلیتی تزریقی، و (د) شکل موج جریان.

پیوند و الانسی

- الکترونهاى ظرفیت در میان پیکربندی زوجی که به پیوند و الانسی معروف است مشترکند.
- در دماهای پایین، این الکترونها مقیدند، و در رسانش شرکت نمی کنند.
- نیمرساناها در دماهای پایین نظیر عایق، و در دماهای زیاد نظیر رسانا رفتار می کند.

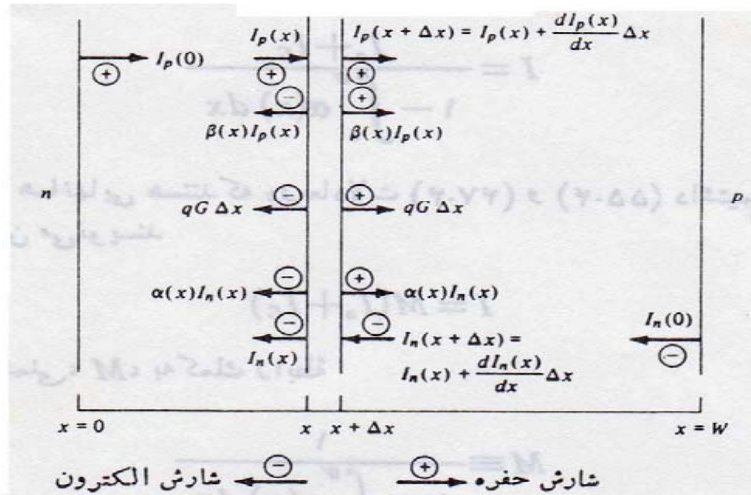
رسانش

- در دماهای بالا، انرژی گرمایی برخی از الکترونها را قادر می سازد که پیوند را بشکنند، و این الکترونها را آزادند در رسانش جریان شرکت کنند.



تهیج‌ج‌اه (حفره)

- هرگاه یک الکترون ظرفیت در یک نیم‌رسانا آزاد شود، یک تهیج‌ج‌اه در پیوند والانس می‌گذارد.
- این تهیج‌ج‌اه، ممکن است توسط یکی از الکترون‌های ظرفیت مجاورش پر شود، که نتیجه آن تغییر مکان در موضع تهیج‌ج‌اه است و ممکن است چنین تصور شود که تهیج‌ج‌اه در داخل ساختار بلور در حال حرکت است. این ذره مجازی حفره نامیده می‌شود.
- حفره، حامل بار مثبت و تحت تاثیر یک میدان الکتریکی خارجی در خلاف جهت الکترون حرکت می‌کند.



مؤلفه‌های جریان در یک پیوندگاه $p-n$ با پیش‌والات مخالف در وضعیت بهمتی.

$$I_p(x + \Delta x) - I_p(x) = \alpha(x)[I_n(x) + I_p(x)] \Delta x + qAG \Delta x$$

$$\frac{dI_p(x)}{dx} = \alpha(x)I + qAG$$

$$I = I_n(x) + I_p(x) = \text{const.}$$

$$-\frac{dI_n(x)}{dx} = \alpha(x)I + qAG$$

علامت منفی در طرف چپ این معادله نتیجه‌ای است که از کاهش الکترونها از x تا $x + \Delta x$ حاصل می‌شود.

$$I_p(x) - I_p(0) = I \int_0^x \alpha(x) dx + \int_0^x qAG dx$$

$$-I_n(W) + I_n(x) = I \int_x^W \alpha(x) dx + \int_x^W qAG dx$$

انرژی

- رابطه تکانه-انرژی یک الکترون در بلور:

$$E_k = \frac{P^2}{2m_e}$$

- m_e جرم موثر الکترون، E_k انرژی جنبشی، P تکانه بلور

$$I = \frac{I_o + I_G}{1 - \int_0^W \alpha(x) dx}$$

$$I = M(I_o + I_G)$$

که عامل تکثیر بهمنی، M ، به کمک رابطه

$$M \equiv \frac{1}{1 - \int_0^W \alpha(x) dx}$$

تعریف می شود. از لحاظ نظری، وضعیت شکست بهمنی وقتی رخ می دهد که M به بینهایت نزدیک شود. بنا بر این، شرط شکست عبارت است از

$$\int_0^W \alpha(x) dx = 1$$

ضریب یونش را

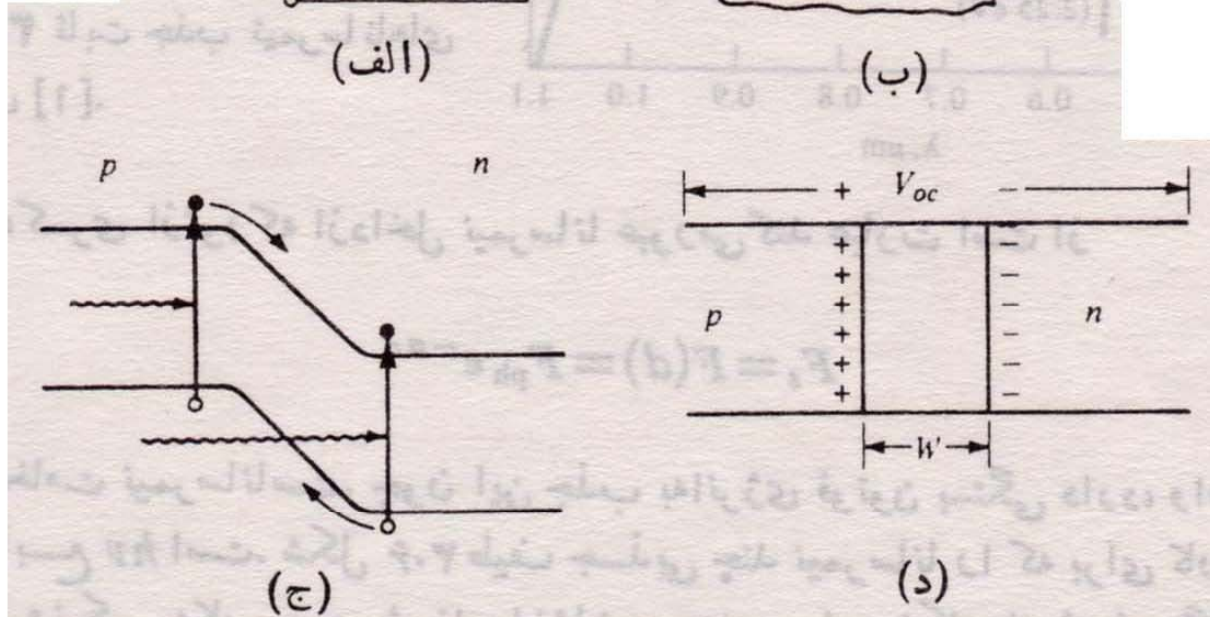
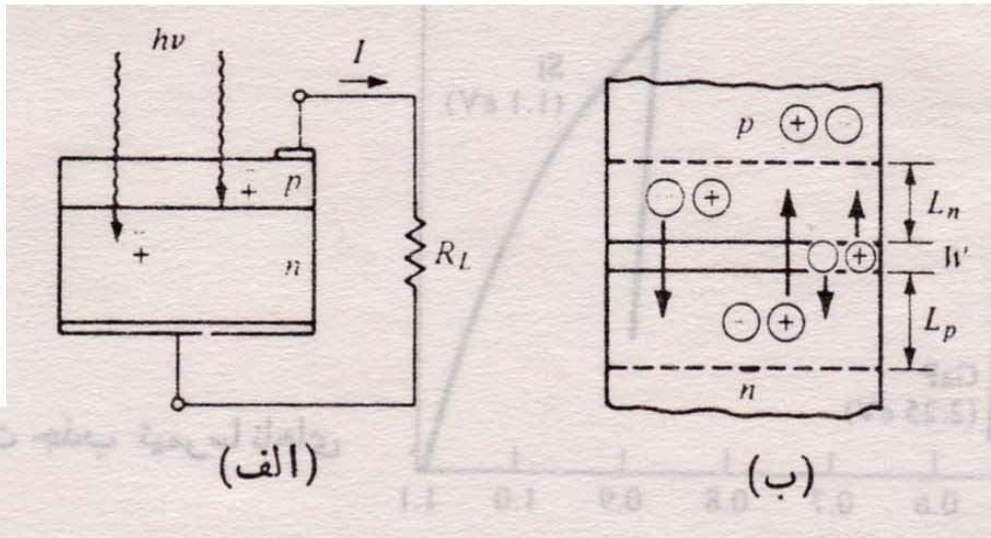
می توان با استفاده از فرمول تجربی

$$\alpha = A \exp \frac{-B}{|\mathcal{E}|}$$

به دست آورد، که در آن A و B ثابتهای مربوط به ماده هستند. 1فیز

گاف انرژی

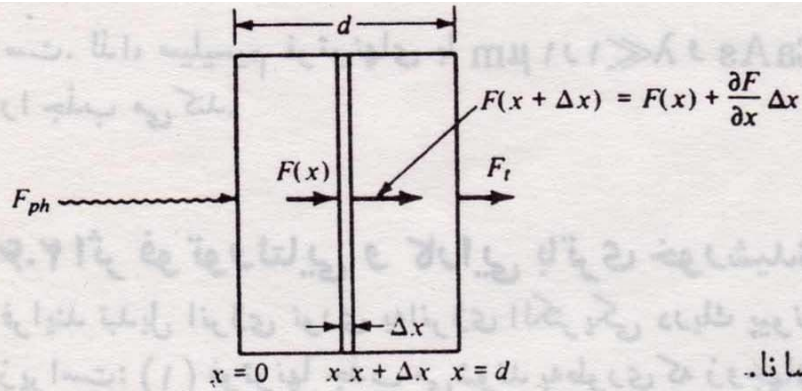
- در نیمرسانا، الکترونهاى ظرفیت گرد هم می آیند تا نواری از ترازهای انرژی، موسوم به نوار ظرفیت، را اشغال کنند. نوار ترازهای انرژی مجاز بعدی، موسوم به نوار رسانش، به اندازه گاف ممنوع انرژی E_g از نوار قبلی فاصله دارد.
- گاف انرژی سیلیسیم $E_g = 1.12 \text{ eV}$



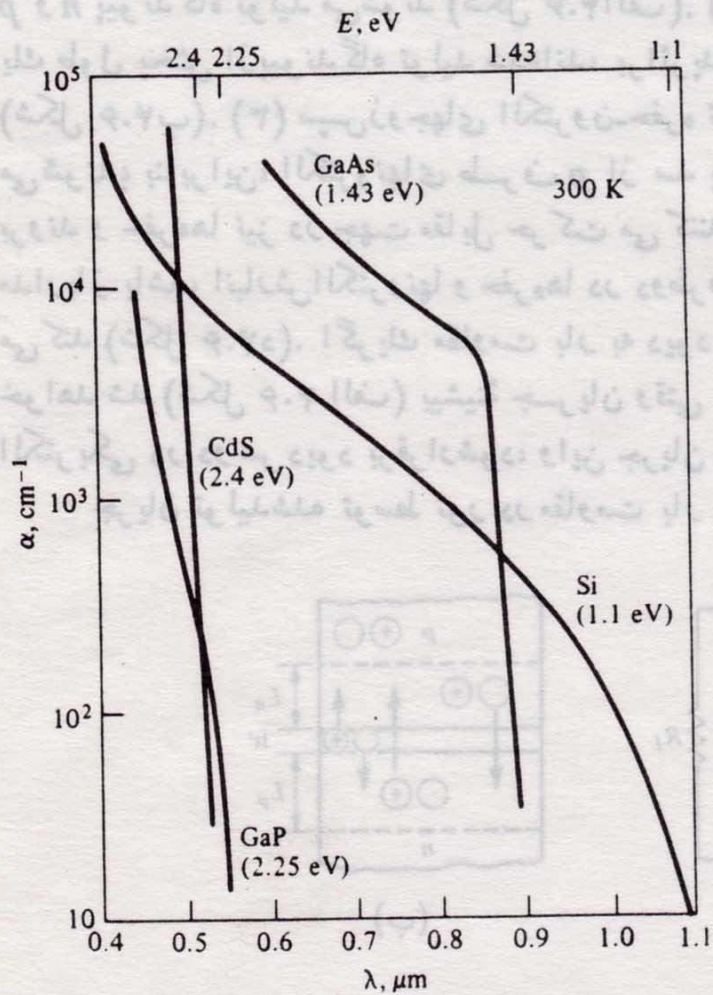
تبدیل انرژی نوری به انرژی الکتریکی؛ (الف) باتری خورشیدی با مقاومت بار، (ب) پخش الکترونها و حفره‌ها که جریان تولید می‌کند، (ج) نمودار نوار انرژی (ب) و (د) برقراری ولتاژ مدار کوتاه (نمایش طرح‌واره).

انواع گاف نوار

- گاف نوار مستقیم : مانند GaAs
 - گاف نوار غیر مستقیم : مانند Si
- نمودار



جذب نور در يك نيمرسانا.



ثابت جذب نيمرساناهای

گوناگون [1].

فبا 1

نیمرسانا

- نیمرسانای ذاتی
- نیمرسانای غیر ذاتی : رسانندگی بلور با افزودن ناخالصیها کنترل می شود.
 - نیمرسانای نوع P
 - نیمرسانای نوع n

مثال. ولتاژ مدار باز یک باتری $n^+ - p$ سیلیسیمی را برای آرایش بستریین 10^{15} و 10^{18} cm^{-3} محاسبه کنید. فرض کنید $L_n = 100 \mu\text{m}$ ، $D_n = 36 \text{ cm}^2/\text{s}$ ، و $I_L/A = 35 \text{ mA/cm}^2$ ، و این مقادیر مستقل از تراکم آرایش هستند.
 حل: چون در یک پیوند گاه $n^+ - p$ داریم: $N_d \gg N_a$

$$I_o = qAn_i^2 \left(\frac{D_p}{L_p N_d} + \frac{D_n}{L_n N_a} \right) \approx \frac{qAn_i^2 D_n}{L_n N_a} = \frac{1.3 \times 10^5 A}{N_a} \text{ A/cm}^2$$

$$V_{oc} = 26 \ln \left(1 + \frac{35 \times 10^{-3} N_a}{1.3 \times 10^5} \right) \text{ mV}$$

N_a, cm^{-3}	10^{15}	10^{16}	10^{17}	10^{18}
V_{oc}, mV	504	565	625	684

انرژی های یونش

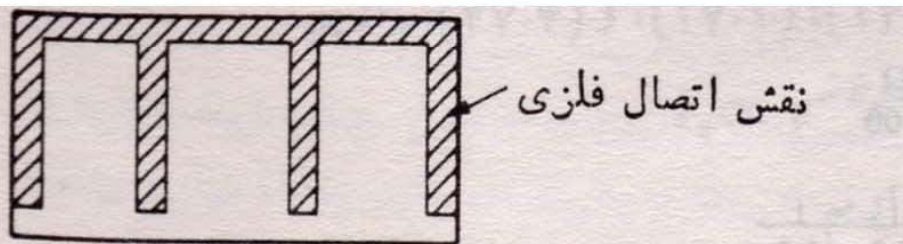
- انرژی یونش پذیرنده : تراز انرژی E_a ، که از روی انرژی لبه نوار ظرفیت E_v اندازه گرفته می شود.
- انرژی یونش بخشنده : E_d ، از لبه نوار E_c اندازه گیری می شود.

بازتاب سطحی

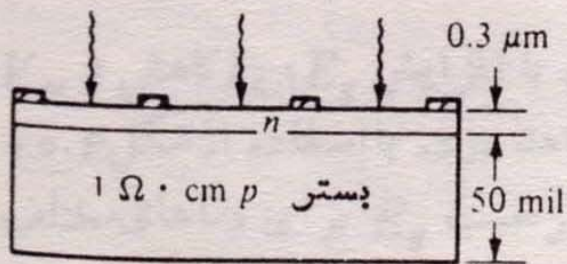
تعداد فوتون‌هایی که به داخل سطح نفوذ می‌کنند به دلیل بازتاب در سطح از تعداد فوتون‌های فرودی کمتر است.

$$R = \frac{(n-1)^2 + (\lambda\alpha/4\pi)^2}{(n+1)^2 + (\lambda\alpha/4\pi)^2}$$

که در آن $n = n_2/n_1$ و n_1 و n_2 به ترتیب ضریب شکست هوا و نیمرسانا هستند. علاوه بر این α ، ضریب جذب نیمرسانا است.



(نمای بالا)



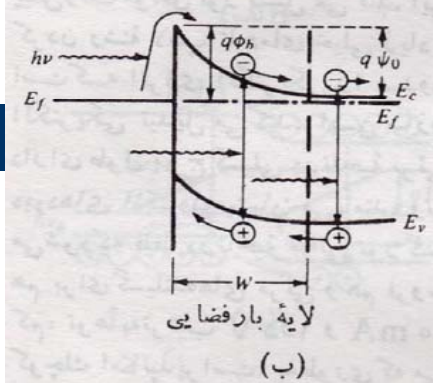
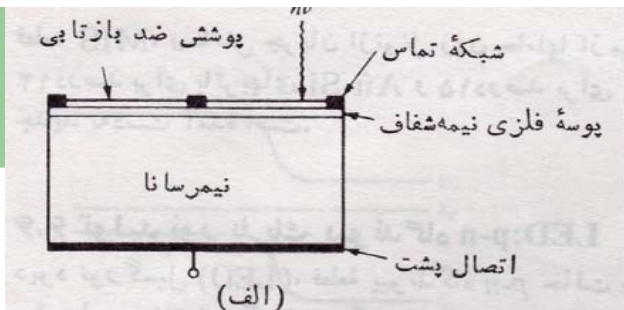
(نمای کناری)

نمای بالا و کناری یک

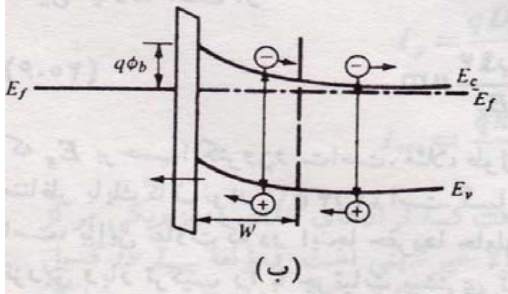
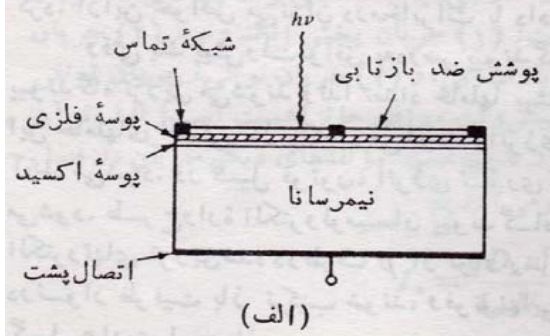
باتری خورشیدی p - n

انرژی و چگالی حالتها

- انرژی جنبشی الکترون: $E - E_c$
- انرژی جنبشی حفره: $E_v - E$



با تری خورشیدی سد شو تکی:
 (الف) ساختار قطعه و (ب) نمودار
 نوار انرژی.



با تری خورشیدی فلز- عایق
 نیم رسانا؛ (الف) ساختار قطعه و (ب)
 نمودار نوار انرژی.

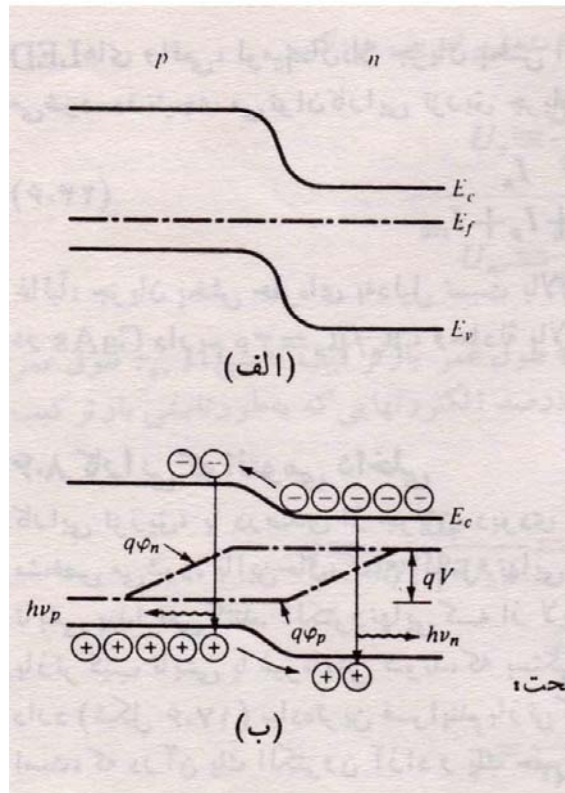
1 فیزیک قطعات نیمه ر

تابع توزیع

- احتمال اینکه تراز انرژی E توسط یک الکترون اشغال شود با تابع توزیع فرمی-دیراک به دست می آید :

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_f)/kT} + 1}$$

- E_f تراز فرمی، k ثابت بولتزمن، T دما بر حسب کلوین نمودار



يك ييوندگاه الكترولومينسان تحت:
 (الف) پيشولت صفر، (ب) پيشولت موافق V .

چگالی حاملها در تعادل گرمایی

- تعداد کل الکترونها در نوار رسانش با انتگرالگیری حاصلضرب چگالی حالتها و احتمال اشغال حاصل می شود

$$n = \int_{E_c}^{\infty} f(E)N(E)dE$$

$$= N_c e^{-(E-E_f)/kT}$$

تزریق حاملهای اقلیتی و کارایی تزریق

در یک LED با پیش ولت موافق بازشناخت: (۱) جریان پخش الکترونی، (۲) جریان پخش حفره‌ای، (۳) جریان باز ترکیب لایه بار فضایی، و (۴) جریان تونلی، جریان تونلی

$$I_n = \frac{q D_n n_i^2}{L_n N_a} (e^{qV/kT} - 1)$$
$$I_p = \frac{q D_p n_i^2}{L_p N_d} (e^{qV/kT} - 1)$$
$$I_{rec} = \frac{q n_i W}{\tau} e^{qV/2kT}$$

$$\gamma = \frac{I_n}{I_n + I_p + I_{rec}}$$

چگالی حاملها

- N_c چگالی موثر حالتها در نوار رسانش

$$N_c = 2 \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2}$$

- چگالی حفره ها در نوار ظرفیت

$$p = \int_{-\infty}^{E_v} [1 - f(E)] N(E) dE$$

- چگالی موثر حالتها در نوار ظرفیت

$$N_v = 2 \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2}$$

کارایی کوانتومی داخلی

$$U_r \equiv \frac{\Delta n}{\tau_r}$$

$$U_{nr} \equiv \frac{\Delta n}{\tau_{nr}}$$

که در آن Δn چگالی الکترون اضافی، τ_r طول عمر باز ترکیب تابشی، و τ_{nr} طول عمر غیر تابشی است. کارایی تابشی

$$\eta \equiv \frac{U_r}{U_r + U_{nr}} = \frac{1}{1 + \tau_r / \tau_{nr}} = \frac{\tau}{\tau_r}$$

که در آن τ طول عمر مؤثر است

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_r} + \frac{1}{\tau_{nr}}$$

$$\eta = \frac{1}{1 + c_n N_i / B N_a}$$

که از تقریب $n_o + p_o = N_a + N_a / n_i \approx N_a$ استفاده شده است.

$$\eta = \left[1 + \frac{N_i c_p r p}{N_a c_n \gamma n} \exp\left(-\frac{E_i - E_a}{kT}\right) \right]^{-1}$$

کارایی کوانتومی داخلی کلی

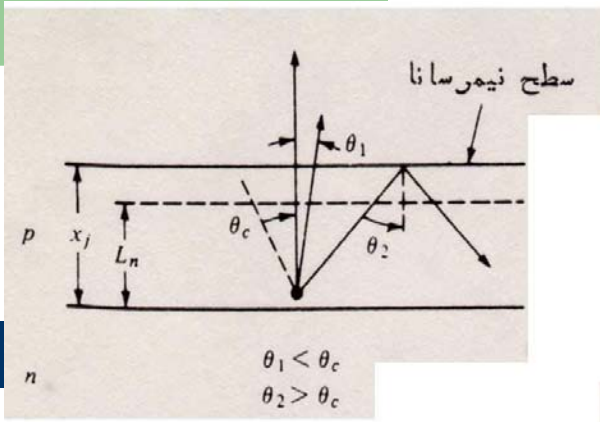
$$\eta_i = \eta \gamma$$

1 فیزیک قطعات نیمه

کارایی کوانتومی خارجی

$$\sin \theta_c = \frac{1}{n} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{\sqrt{K_s}}$$

که در آن n ضریب شکست نیم رسانا، با هوا (n_1) به عنوان مرجع خارجی است.



بازتاب داخلی و زاویه بحرانی

در یک LED.

$$\bar{T} = \frac{4n}{(1+n)^2}$$

گسیل کلی نور در داخل زاویه فضایی θ_c عبارت است از

$$\bar{T} = T \sin^2 \frac{\theta_c}{2}$$

$$\eta_{\text{ext}} = \frac{\eta_i}{1 + \bar{\alpha}V/AT} = \frac{\eta_i}{1 + \bar{\alpha}x_j/\bar{T}}$$

که در آن $\bar{\alpha}$ ضریب جذب متوسط، V حجم دیود، و A مساحت

np در نیمرسانا

$$np = N_c N_v e^{-E_g / kT}$$

- E_g انرژی گاف ممنوع با رابطه تجربی :

$$E_g = E_{g0} - \beta T$$

$$pn = K_1 T^3 e^{-E_{g0} / kT}$$

- حاصلضرب np در یک نیمرسانا در یک دمای معلوم و تحت تعادل گرمایی مقدار ثابتی است.
- حاصلضرب pn تنها به به چگالی حالت‌های انرژی مجاز و انرژی گاف ممنوع بستگی دارد، لیکن از چگالی ناخالصی یا مکان تراز فرمی مستقل است.

بهره جریان و مشخصه‌های جریان-ولتاژ

اکنون کارایی تزریق گسیلنده، γ ، و ضریب ترابری پایه β_T را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

$$\gamma \equiv \frac{I_{nE}}{|I_E|} = \frac{I_{nE}}{I_{nE} + I_{pE} + I_{rE}}$$

$$\beta_T \equiv \frac{I_{nC}}{I_{nE}}$$

علاوه بر این، نسبت منفی افزایش جریان گردآور به تغییر جریان گسیلنده از صفر تا I_E را به عنوان بهره جریان α تعریف می‌کنیم

$$\alpha \equiv - \frac{I_C - I_{C0}}{I_E}$$

قانون اثر جرم

- در نیمرسانای ذاتی
 n_i چگالی حامل ذاتی

$$n=p=n_i$$

- قانون اثر جرم، که برای هر دو نوع نیمرسانای ذاتی و غیر ذاتی تحت تعادل گرمایی صادق است:

$$np = n_i^2$$

$$\alpha = \frac{I_{nC}}{I_{nE} + I_{pE} + I_{rG}} = \gamma\beta_T$$

α عبارت است از حاصلضرب ضریب ترابری و کارایی گسیلنده.

$$I_C = -\alpha I_E + I_{CO}$$

که جریان خروجی گردآور را به جریان ورودی گسیلنده، با پایه به عنوان پایانه مشترک، مربوط می‌کند. بنابراین، α را بهره‌ی جریان پایه - مشترک نیز می‌نامند.

$$I_C = \frac{\alpha}{1-\alpha} I_B + \frac{I_{CO}}{1-\alpha} = h_{FE} I_B + I_{CEO}$$

$$h_{FE} \equiv \frac{\alpha}{1-\alpha}$$

$$I_{CEO} \equiv \frac{I_{CO}}{1-\alpha}$$

نماد h_{FE} که به β هم معروف است، بهره جریان گسیلنده-مشارک نامیده می‌شود.

تراز فرمی

- تراز فرمی در نیمرسانای ذاتی، با قرار دادن $E_f = E_i$

$$E_i = \frac{1}{2}(E_c + E_v) + \frac{3}{4}kT \ln \frac{m_h}{m_e}$$

- اگر جرم موثر الکترون و حفره مساوی باشند، تراز فرمی ذاتی در وسط گاف ممنوع واقع خواهد شد.

- در نیمرسانای ذاتی با قرار دادن $E_f = E_i$ به دست می آید:

$$n = n_i e^{(E_f - E_i)/kT}$$

$$p = n_i e^{(E_i - E_f)/kT}$$

به دست آوردن مؤلفه‌های جریان و عبارتهای مربوط به بهره

$$I_n = qAD_n \frac{dn_p}{dx}$$

$$D_n \frac{d^2 n_p}{dx^2} - \frac{n_p - n_{p0}}{\tau_n} = 0$$

جواب عمومی

$$n_p - n_{p0} = K_1 e^{-x/L_n} + K_2 e^{x/L_n}$$

است که در آن

$$n_p(0) = n_{p0} e^{V_E/V_T}$$

$$n_p(x_B) = 0$$

$$n_p - n_{p0} = \frac{n_{p0} (e^{V_E/V_T} - 1) \sinh[(x_B - x)/L_n]}{\sinh(x_B/L_n)}$$

در شرایط پیش ولت متعارف، داریم $V_E/V_T \gg 1$

$$n_p = \frac{n_{p0} e^{V_E/V_T} \sinh[(x_B - x)/L_n]}{\sinh(x_B/L_n)}$$

تراکم حفره در نیمرسانای n

$$n = p + N_d$$

$$n + N_a = p + N_d$$

$$n_n = \frac{\sqrt{N_d^2 + 4n_i^2} + N_d}{2}$$

$$p_n = \frac{\sqrt{N_d^2 + 4n_i^2} - N_d}{2}$$

- الکترون، حامل اکثریت
- حفره، حامل اقلیت

$$n_p = n_{p0} e^{V_E/V_T} \left(1 - \frac{x}{x_B} \right)$$

$$I_{nE} = \frac{qAD_n n_{p0}}{L_n} (e^{V_E/V_T} - 1) \coth \frac{x_B}{L_n}, \quad x=0 \quad \text{در}$$
$$I_{nC} = \frac{qAD_n n_{p0}}{L_n} (e^{V_E/V_T} - 1) \operatorname{csch} \frac{x_B}{L_n}, \quad x=x_B \quad \text{در}$$

$$\beta_T = \operatorname{sech} \frac{x_B}{L_n}$$

تراز فرمی در نوع n

- در بیشتر موارد، تراکم آلاینده بخشنده به مراتب بیشتر از تراکم ذاتی است؛ یعنی ، $n_i / N_d \ll 1$

$$n_n = N_d + \frac{n_i^2}{N_d} \approx N_d$$

$$p_n = \frac{n_i^2}{N_d}$$

$$E_f = E_c - kT \ln \frac{N_c}{N_d}$$

به ازای $x_B/L_n \ll 1$

$$I_{nE} = qAD_n \frac{n_i^2}{N_a x_B} (e^{V_E/V_T} - 1)$$
$$\beta_T = 1 - \frac{1}{2} \frac{x_B^2}{L_n^2}$$

$$I_{pE} = qAD_p \frac{n_i^{\gamma}}{N_{dE}x_E} (e^{V_E/V_T} - 1)$$

که در آن N_{dE} و x_E به ترتیب عبارت اند از تراکم بخشنده و عرض گسیلنده. اگر x_E در مقایسه با L_p ، طول پخش حفره در گسیلنده، بزرگ باشد x_E را باید با L_p جایگزین کرد.

$$I_{rE} = \frac{qAn_i W_E}{\gamma \tau_o} e^{V_E/2V_T}$$

که در آن W_E عرض لایه تهی گسیلنده است.

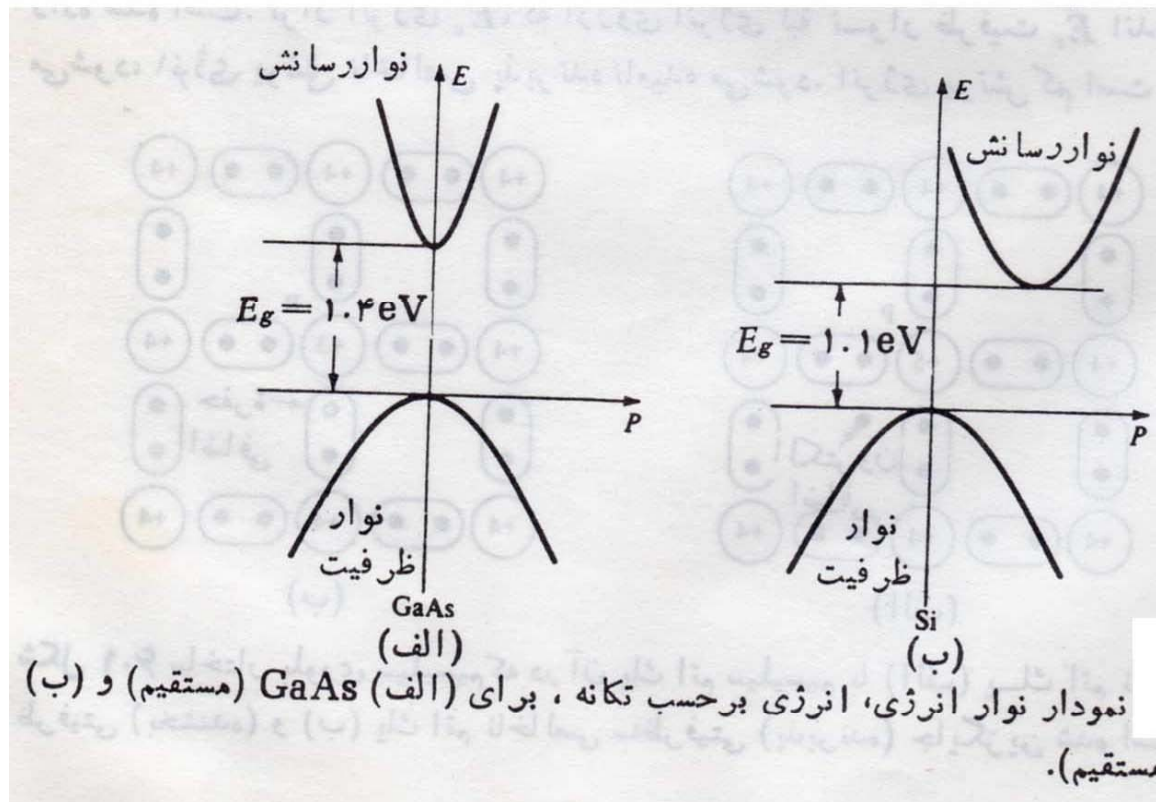
$$I_B = qAn_i^{\gamma} \left[\left(\frac{D_p}{N_{dE}x_E} + \frac{D_n x_B}{\gamma N_a L_n^{\gamma}} \right) (e^{V_E/V_T} - 1) + \frac{W_E}{\gamma \tau_o n_i} e^{V_E/2V_T} \right] \propto e^{V_E/\eta V_T}$$

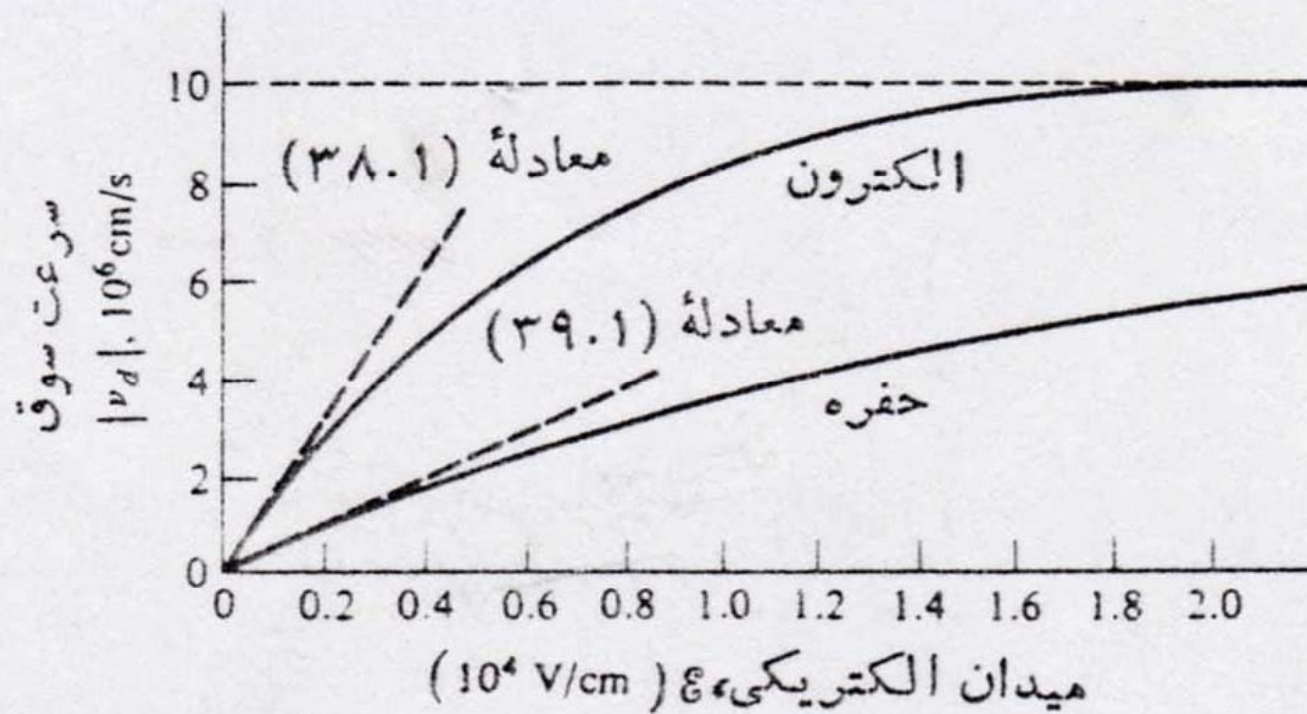
تراز فرمی در نوع p

$$n_p = \frac{n_i^2}{N_a}$$

$$p_p = N_a$$

$$E_f = E_v + kT \ln \frac{N_v}{N_a}$$

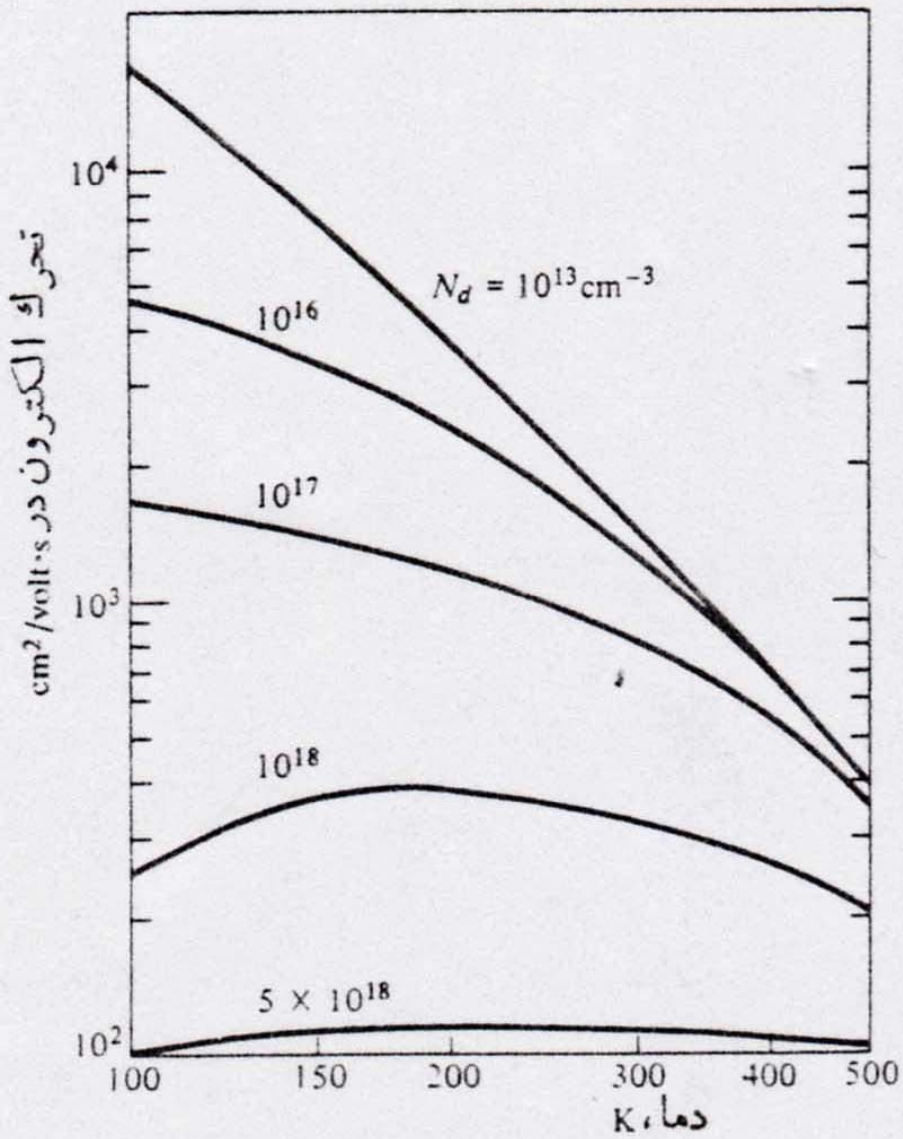




سرعت سوق به صورت تابعی از میدان الکتریکی برای الکترون و حفره

پراکندگی حفره ها و الکترونها

1. پراکندگی شبکه ای
2. اتمهای ناخالصی یونیده
3. اگر تراکم اتمهای ناخالصی خنثی زیاد باشد، این اتمها می توانند موجب پراکندگی شوند.
4. نیروی کولنی بین حاملها



تحرک به صورت تابعی

از دما در سیلیسیم.

سرعت سوق

$$\bar{a} = -q \varepsilon / m_e \cdot$$

$$\Delta v = \bar{a} \tau_m$$

$$v_d = \frac{\Delta v}{2} = -\frac{q \tau_m}{2 m_e \cdot} \varepsilon$$

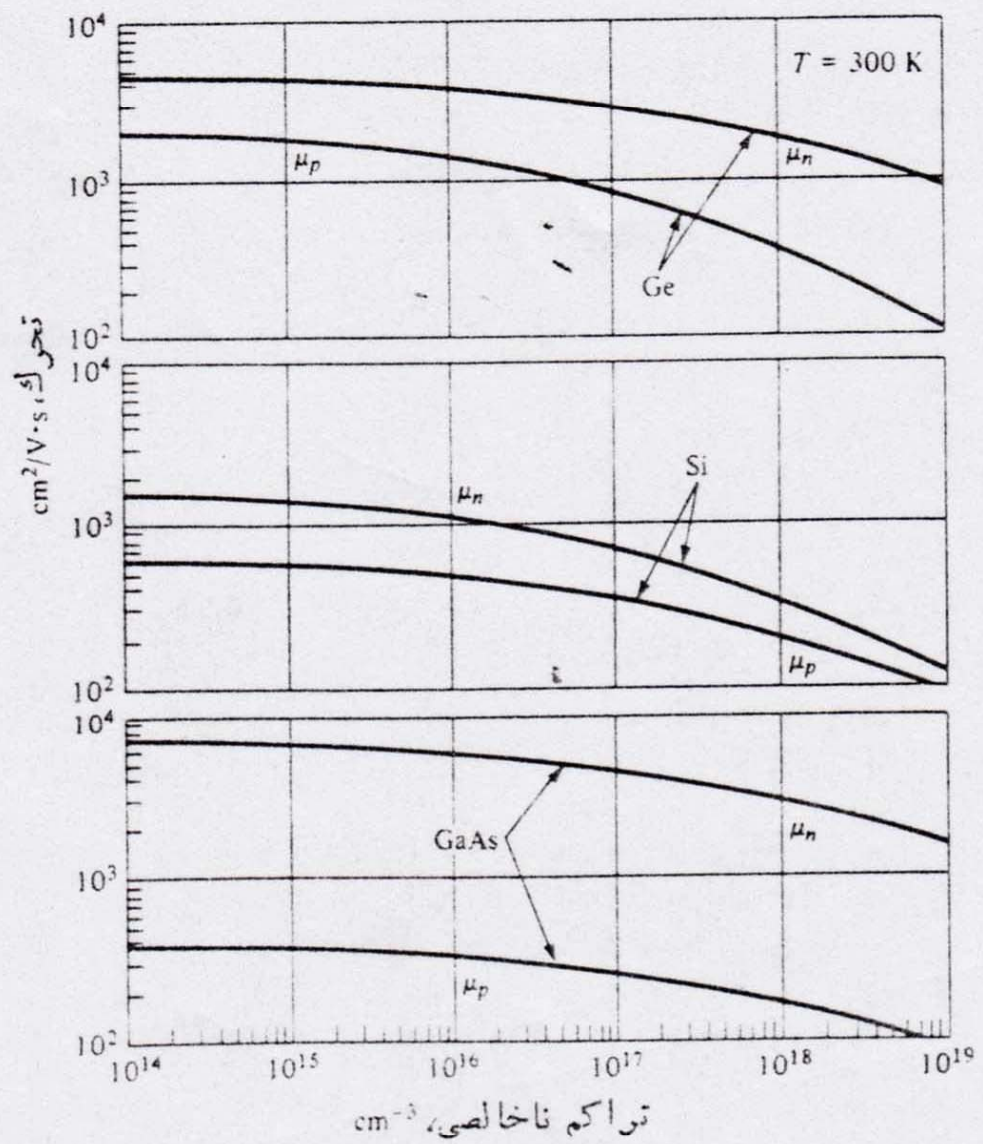
$$v_d = -\frac{q \tau_m}{2 m_e \cdot} \varepsilon = -\mu_n \varepsilon$$

$$\mu_n \equiv q \tau_m / m_e \cdot$$

$$v_d = \mu_p \varepsilon$$

● μ_n تحرک الکترون

● μ_p تحرک حفره



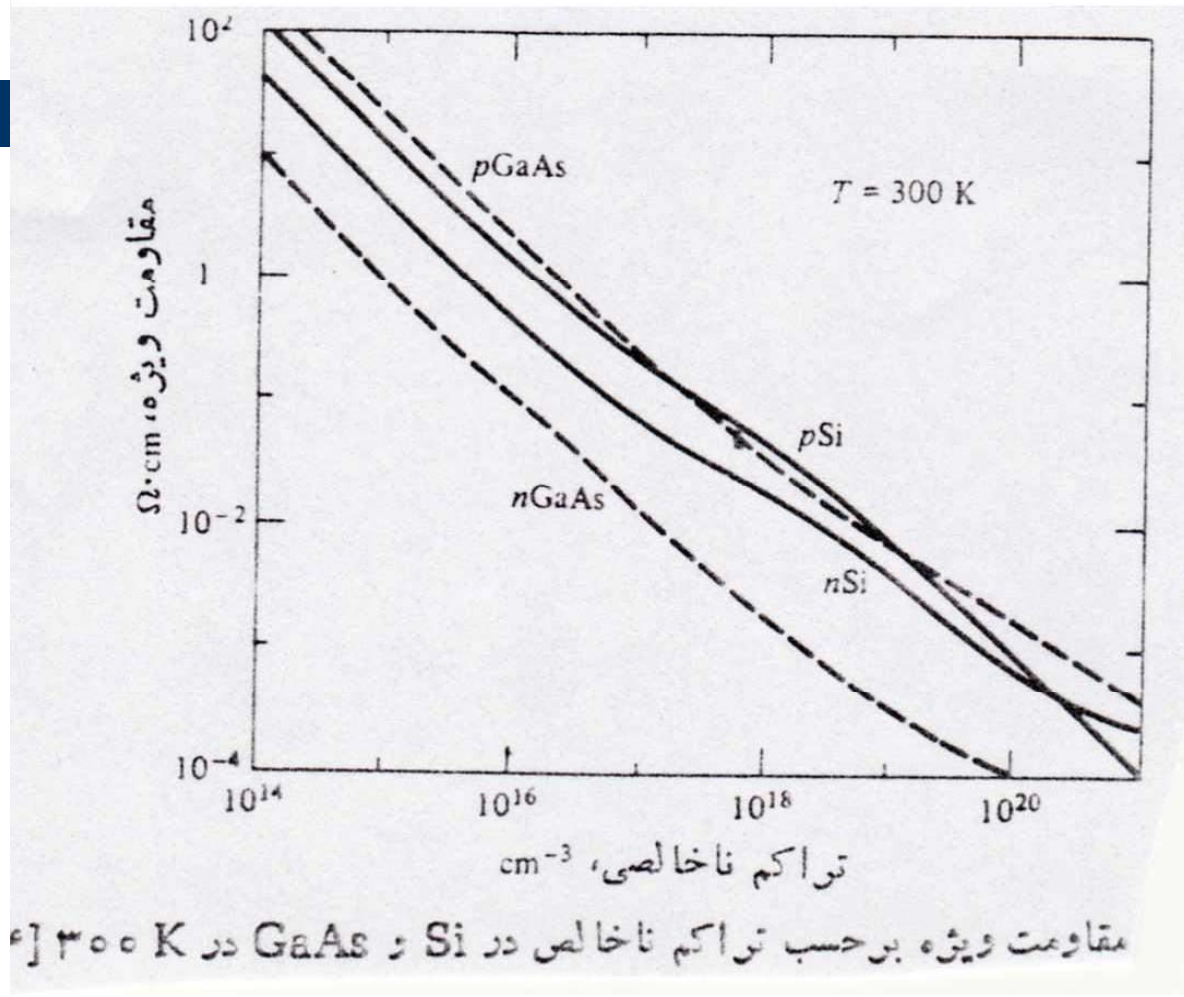
تحريك الكترولون و حفره به صورت تابعی از تراکم برای Ge، Si، و GaAs

300 K [4].

1 فیزیک قطعات نیمه رسانا

وابستگی تحرک

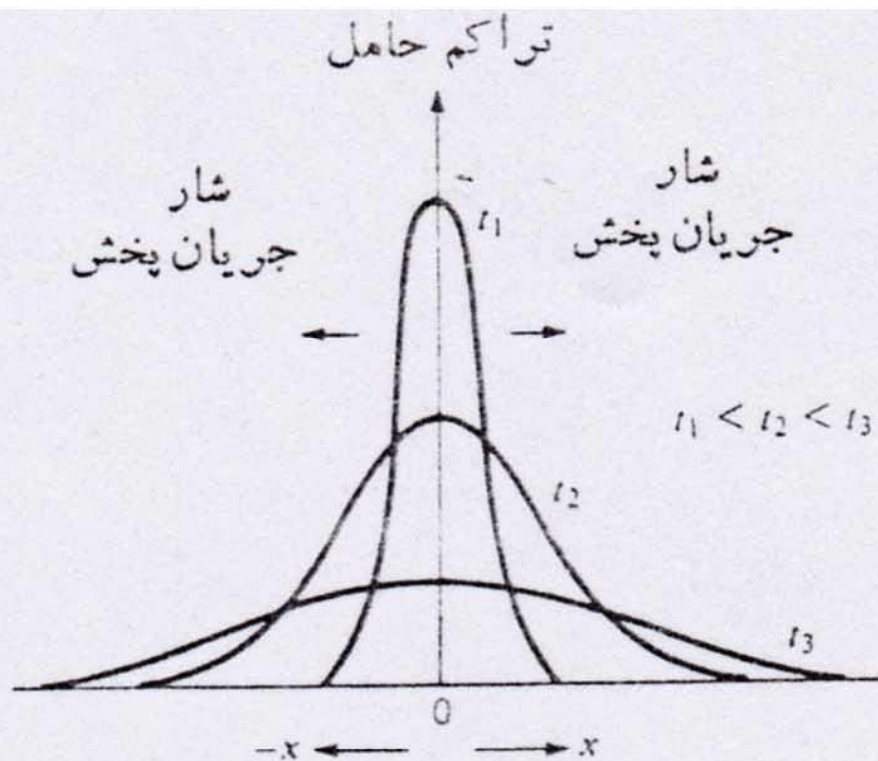
- تحرک با دما افزایش می‌یابد.
- تحرک با افزایش تراکم ناخالصی در یک دمای معین کاهش می‌یابد.
- نتیجه تجربی مهم دیگری برای تحرک، بصورت تابعی از تراکم ناخالصیهای بخشنده و پذیرنده در شکل در تراکمهای پائین ناخالصی، تحرک ثابت است.



رسانش

$$I_n = -qAnv_d = qAn\mu_n\mathcal{E}$$

- ترابری حاملهای تحت تأثیر یک میدان الکتریکی اعمال شده، جریانی به نام جریان سوق تولید می‌کند.
- n الکترون در واحد حجم است.
- در آن q قدر مطلق بار الکتریکی، A مساحت سطح مقطع، و L طول میله است.



تغییر فضایی تراکم حاملها

در زمانهای متفاوت.

مقاومت ویژه

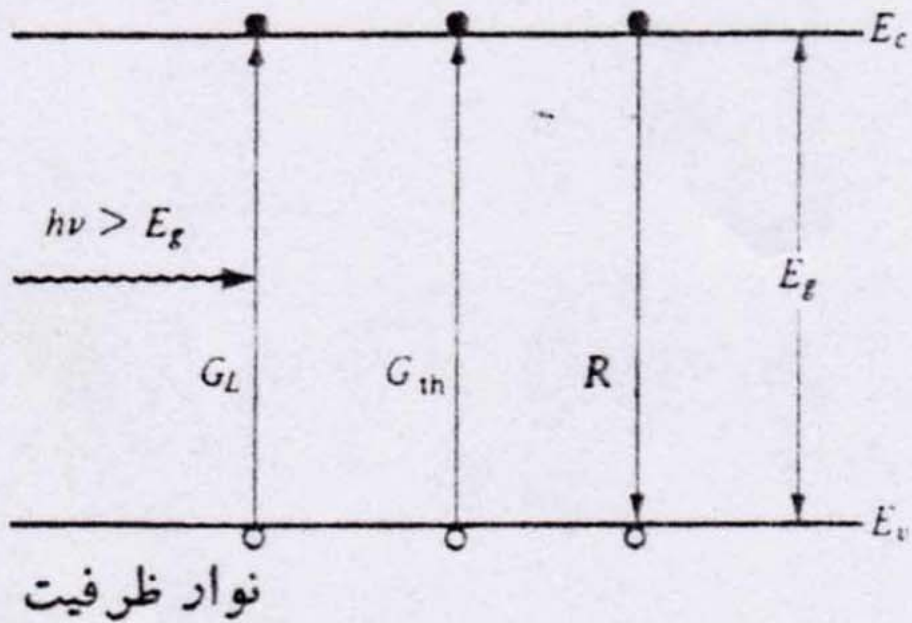
$$\frac{V}{I_n} = \frac{L}{qAn\mu_n}$$

$$R \equiv \rho \frac{L}{A} \equiv \frac{V}{I_n}$$

$$\frac{1}{\rho} = \sigma = q\mu_n n$$

- ϵ را با V/L جایگزین کرده و نسبت ولتاژ به جریان را پیدا کنیم، داریم
- مقاومت میله به کمک رابطه
- تعریف می‌شود که ρ مقاومت ویژه است.

نوار رسانش



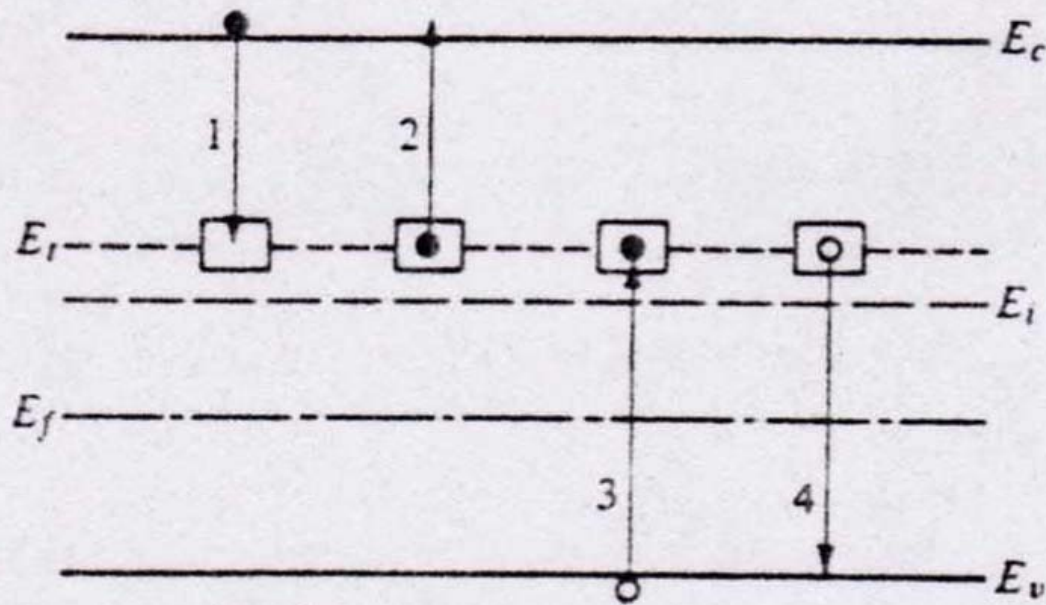
تولید و بازترکیب نوار به نوار
زوجهای الکترون-حفره.

جریان حفره

- که σ رسانندگی است. به کمک قیاس، جریان سوق حفره را می‌توان چنین نوشت.
- مقاومت ویژه کل نیمرسانا که شامل اثر الکترونها و حفره هاست، چنین خواهد شد.

$$I_p = qA\rho\mu_p\mathcal{E}$$

نوار رسانش



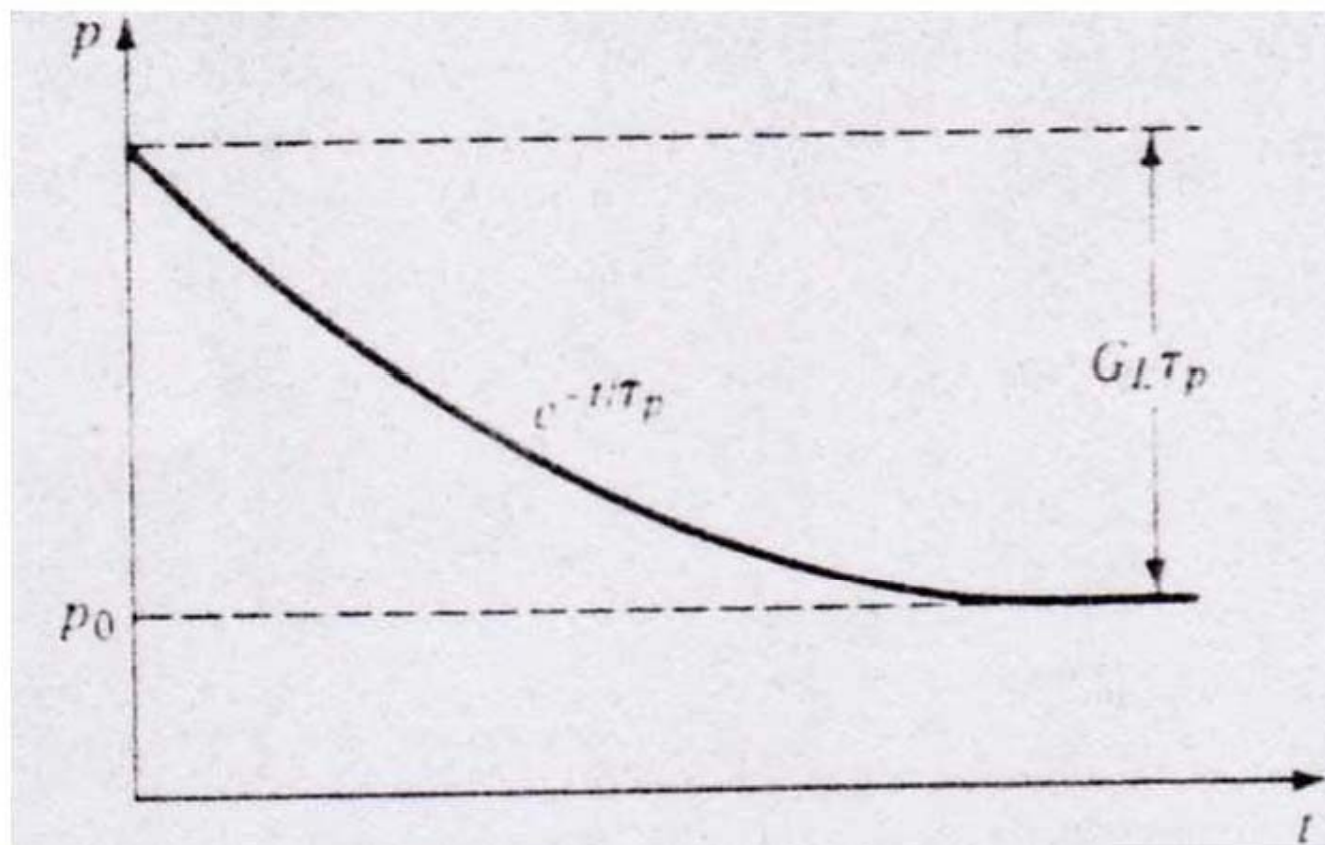
نوار ظرفیت

تولید و بازترکیب از طریق حالت‌های واسطه.

هدایت ویژه

- مقاومت ویژه نیمرسانا پارامتر مهمی در طراحی قطعات است 1 رابطه بین تراکم ناخالصی و مقاومت ویژه را برای هر دو نوع سیلیسیم و GaAs نوع n و p در دمای اتاق نشان می‌دهد. انحراف از خطی بودن در این منحنیها بعلت اثر غیرخطی تحرک است.

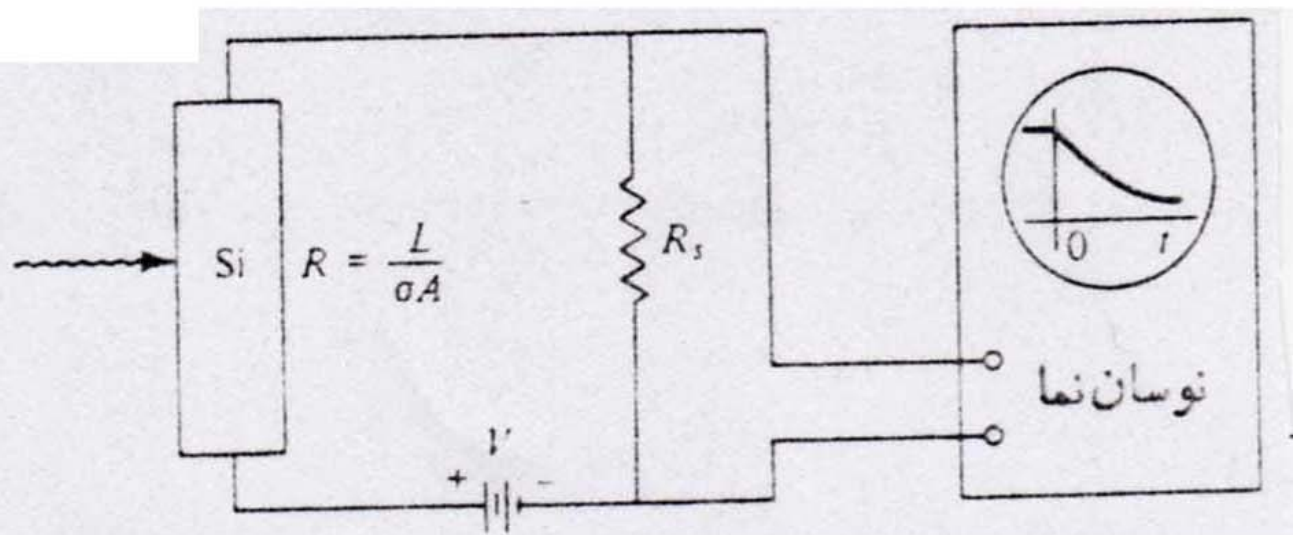
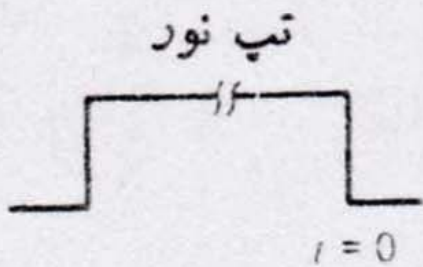
$$\frac{1}{\rho} = q\mu_n n + q\mu_p p$$



وایاشی حاملهای اضافی بعد از قطع منبع نور.

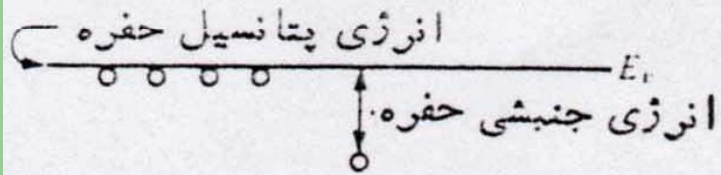
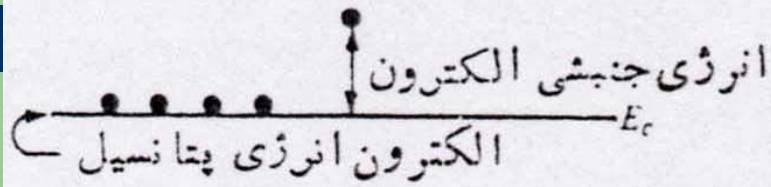
پخش

- پخش حاملها وقتی رخ می‌دهد که یک تغییر فضایی تراکم وجود داشته باشد، زیرا حاملها سعی می‌کنند از ناحیه با تراکم زیاد به ناحیه با تراکم کم حرکت کنند.

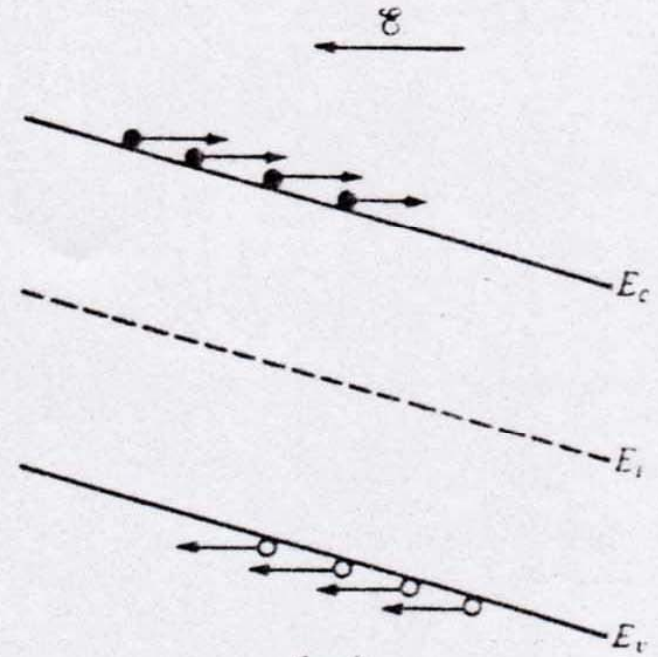


آزمایش واپاشی فوتورسانندگی.

- مقاومت ویژه برحسب تراکم ناخالص در Si و GaAs در 300 K

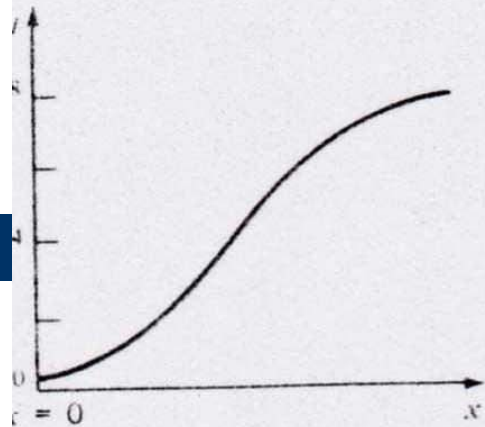


(الف)

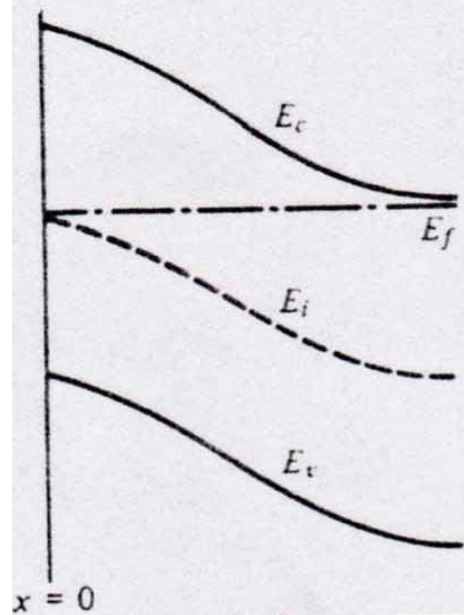


(ب)

نمودار نوار انرژی یک نیم رسانا تحت (الف) میدان الکتریکی صفر و (ب) میدان الکتریکی.



(الف)



(ب)

(الف) توزیع بخشنده و (ب) نمودار نوار انرژی متناظر برای نیم رسانایی که به طور غیر یکنواخت آلائیده شده است.

شار پخش

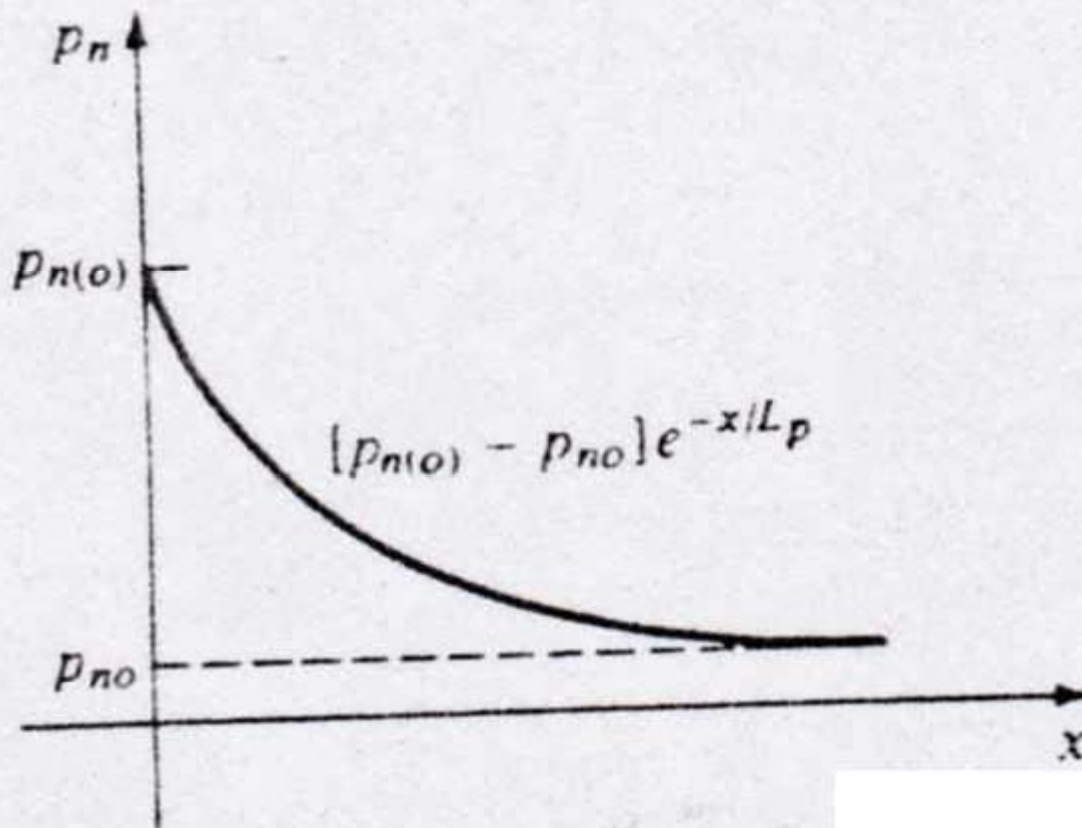
- شار پخش از قانون اول فیک پیروی می‌کند.

$$F = -D \frac{dN}{dx}$$

- که در آن F شار حاملها = تعداد عبور کرده $1 \text{ cm}^2/\text{s}$ ، D ثابت پخش، و N چگالی حاملها. بنابراین جریان پخش الکترونها و حفره ها از دو رابطه

$$I_n = qAD_n \frac{dn}{dx}$$

$$I_p = -qAD_p \frac{dp}{dx}$$

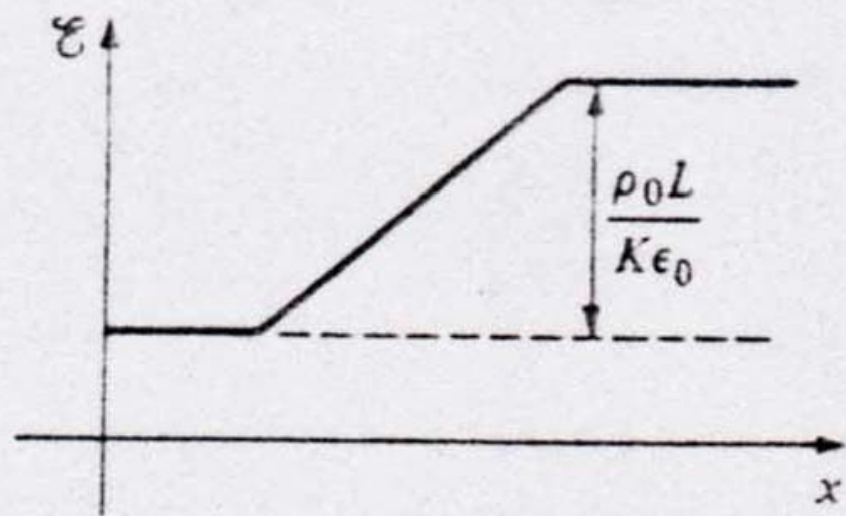
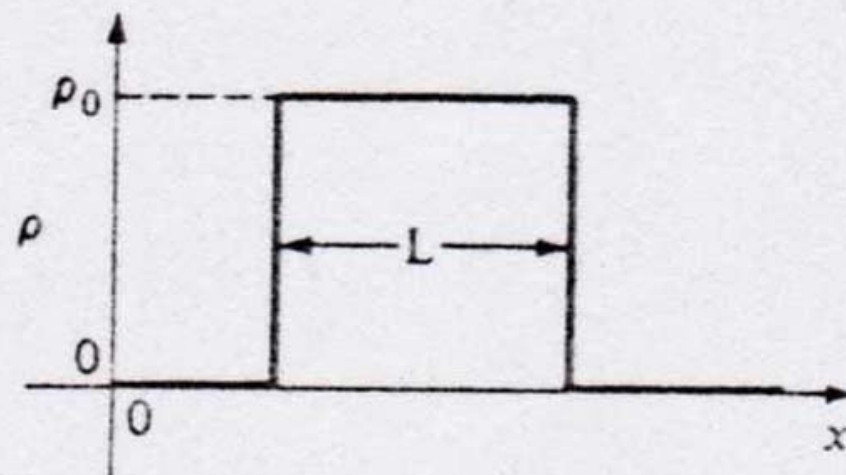


توزیع حامل اقلیتی حالت
 ما نا برای یک برش نیمرسانا با تزریق
 در $x=0$.

رابطه اینشتین

- بدست می‌آید که در آنها، D_p و D_n به ترتیب ثابتهای پخش برای الکترونها و حفره‌ها هستند. علامت منفی در معادله نشان می‌دهد که جریان حفره‌ای در خلاف جهت شیب حفره‌هاست. این مطلب در نشان داده شده است. در فصل 2 نشان داده خواهد شد که ثابتهای پخش توسط رابطه اینشتین با تحرک در ارتباطند.

$$\frac{D_p}{\mu_p} = \frac{D_n}{\mu_n} = \frac{kT}{q}$$

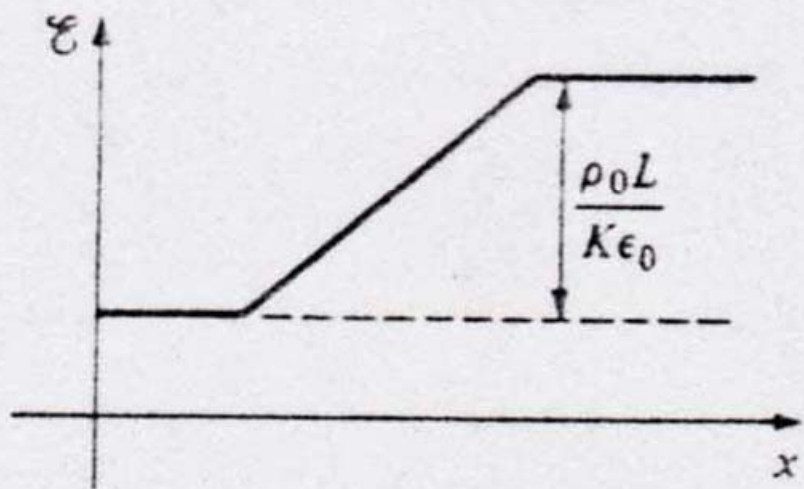
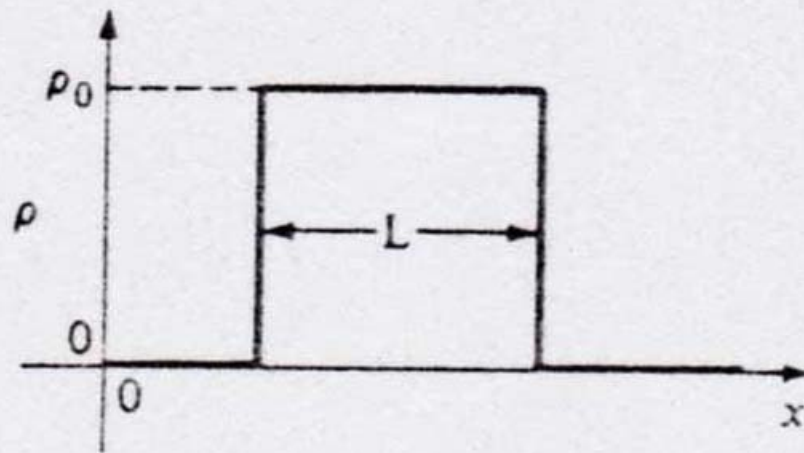


توزیع بار از نوع جعبه‌ای
و میدان الکتریکی مربوط به آن.

مثال

- برای یک نمونه سیلیسیم با آلایش نسبتاً سبک در دمای اتاق داریم:
 $D_n = 38 \text{ cm}^2/\text{s}$ و $D_p = 13 \text{ cm}^2/\text{s}$
جریانهای کل الکترونی و حفره ای از حاصلجمع مؤلفه های سوق و پخش بدست می آید.

$$I_n = qA(\mu_n n \mathcal{E} + D_n \frac{dn}{dx})$$

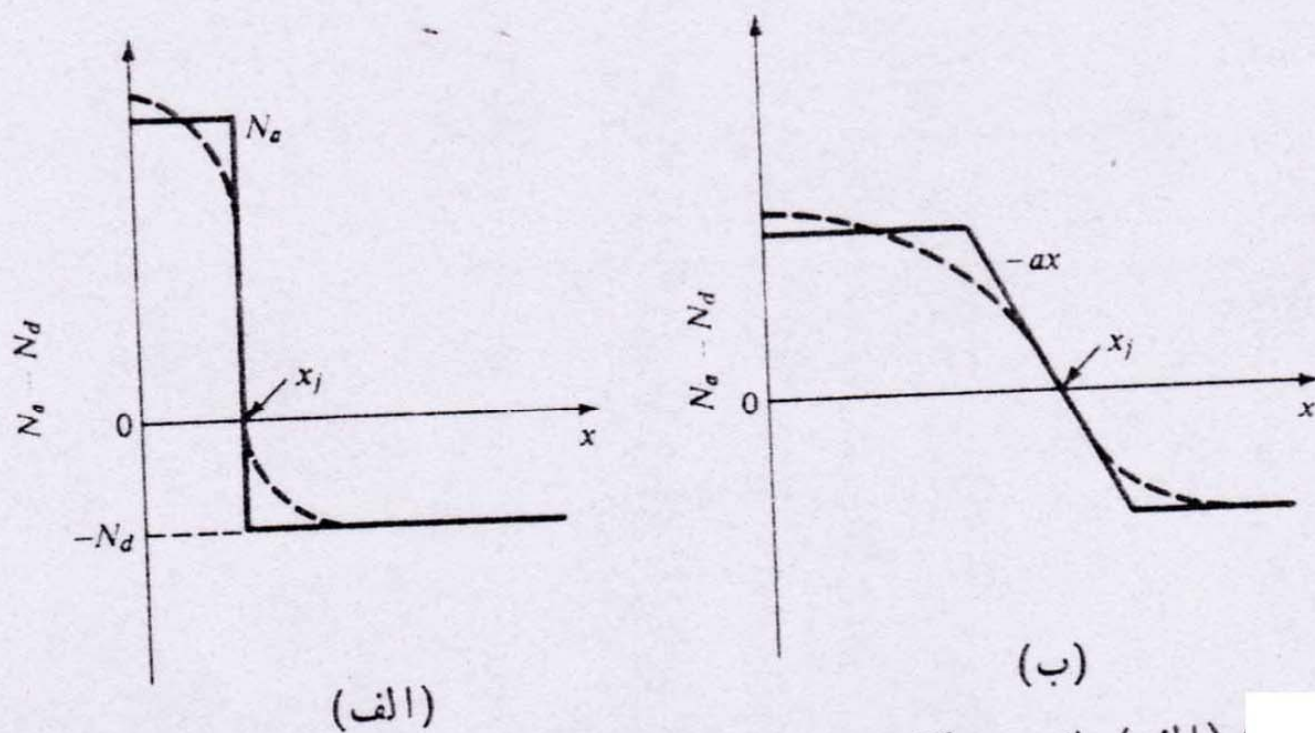


توزیع بار از نوع جعبه‌ای
و میدان الکتریکی مربوط به آن.

جریان کل

- شکل 23-1 شیب ثابت تراکم حالت پایای حفره ها، جریان پخش تولید می‌کند.

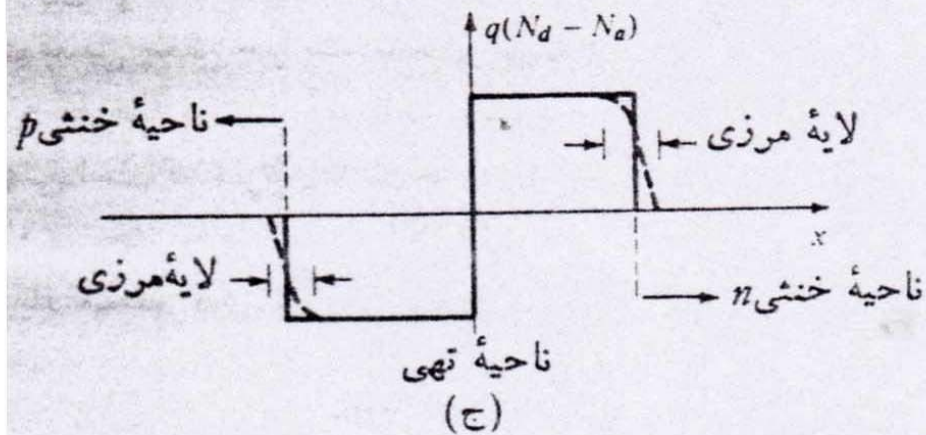
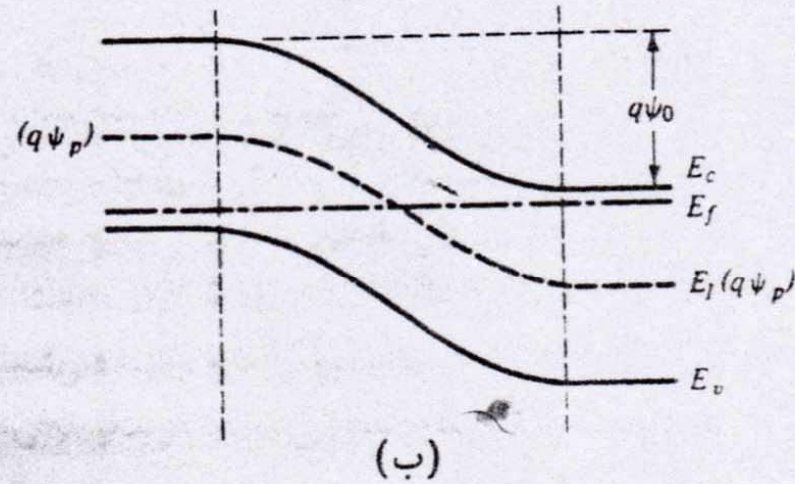
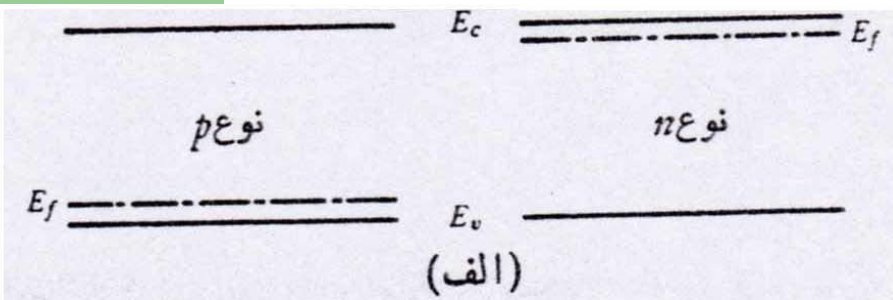
$$I_p = qA(\mu_p p \mathcal{E} - D_p \frac{dp}{dx})$$



(الف) يك پیوند گاه پنخشی کم عمق (نقطه چین) با تقریب پیوند گاه پله ای (خط پر) و (ب) يك پیوند گاه پنخشی عمیق (نقطه چین) با تقریب پیوند گاه شیبدار خطی (خط پر).

مشخصات عدم تعادل نیمرساناها

- عدم تعادل، شرطی را توصیف می‌کند که در آن چگالی حامل‌های آزاد، با مقادیر تعادل گرمایی آنها متفاوت اند. از آنجا که اکثر قطعات نیمرسانا تحت شرایط عدم تعادل عمل می‌کنند لازم است بدانیم که این حامل‌های آزاد چگونه وارد و منتقل می‌شوند. علاوه بر این، لازم است تعیین کنیم که چگونه تعادل گرمایی دوباره برقرار می‌شود. این فصل با موضوع وارد کردن بارهای اضافی بوسیله تولید و تزریق شروع می‌شود.

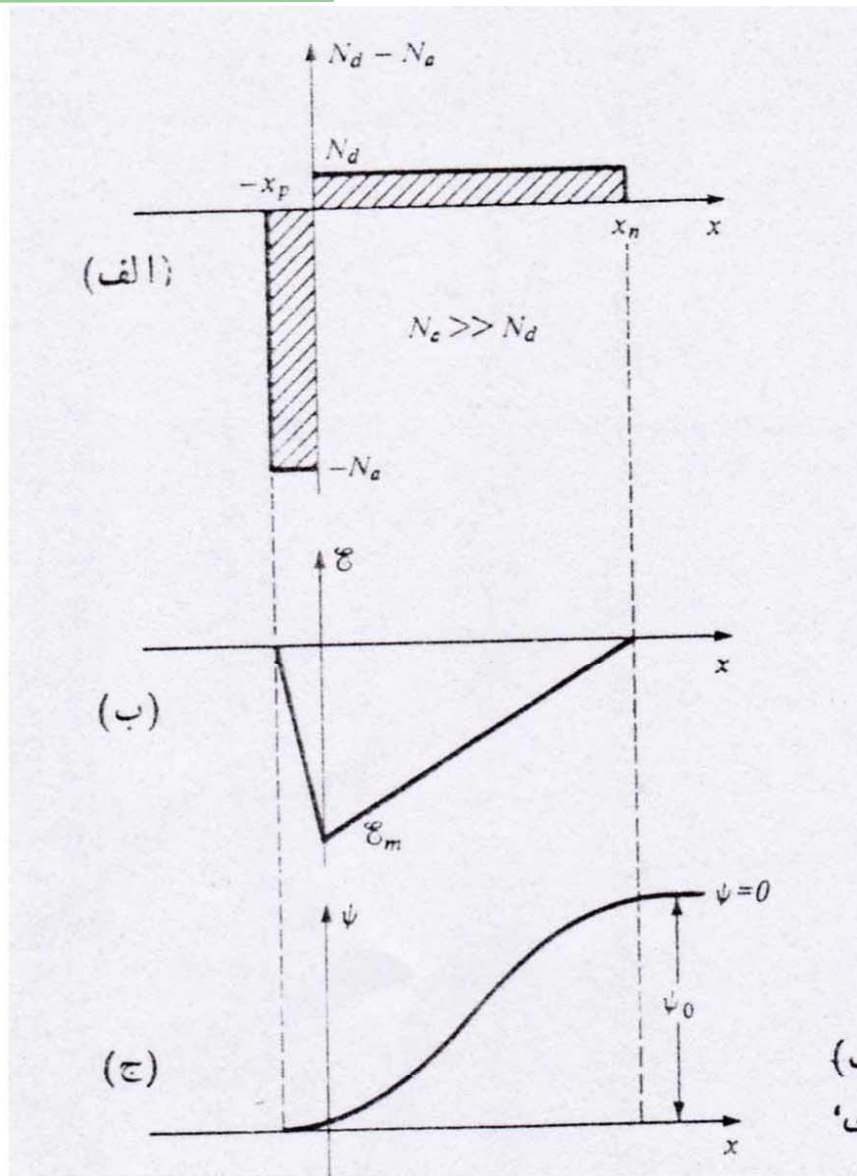


الف) سیلیسیم نوع p و نوع n قبل از تماس، (ب) نمودار نوار انرژی بعد از تماس،

و (ج) توزیع بار فضایی مربوط به (ب).

مشخصات عدم تعادل نیمرساناها

- نشان خواهیم داد که، بطور متوسط، حاملهای اضافی قبل از اینکه توسط فرایند بازترکیب نابود شوند برای مدتی دوام خواهند آورد. حاملهای اضافی، در خلال طول عمرشان می‌توانند در یک فاصله مفید سوق داده یا پخش شوند تا تولید جریان کنند. هدف اصلی از این فصل پیدا کردن قوانین بنیادی حاکم بر بازترکیب و ترابری الکترونها و حفره‌های غیرتعادلی است. این قوانین بنیادی را در فصلهای بعدی بکار می‌بریم تا مشخص‌های ولتاژ – جریان دیودها و ترانزیستورها را بدست آوریم.



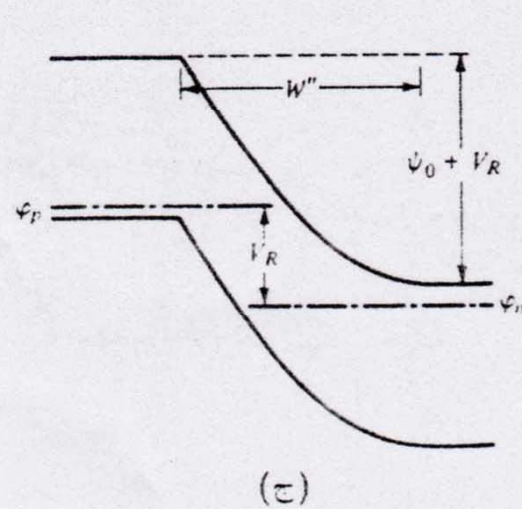
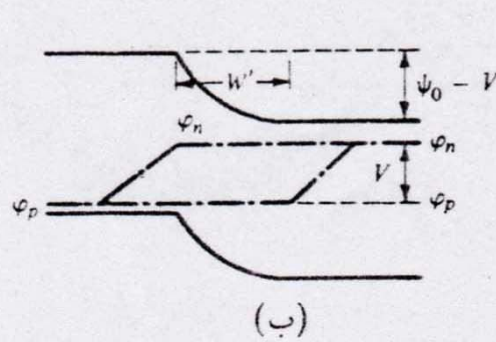
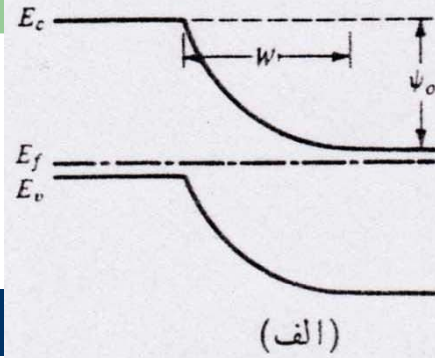
پیوندگاه پله‌ای یکطرفه؛ (الف) توزیع بار فضایی، (ب) میدان الکتریکی، و (ج) نمودارهای پتانسیل.

1 فیزیک قطعات نیمه رسانا

تولید، بازترکیب، و تزریق حاملها

- تحت تعادل گرمایی، حاملهای نیمرسانا دارای انرژی گرمایی متوسطی هستند که به دمای محیط بستگی دارد. این انرژی گرمایی، برخی از الکترونها را قادر می‌سازد که خود را به نمودار رسانش برسانند. گذار الکترون به سمت بالا، یک حفره در پشت سر خود جا می‌گذارد، بطوریکه یک زوج الکترون – حفره تولید می‌شود. این فرایند را تولید حامل می‌نامند که در شکل با G_{th} نمایش داده شده است. وقتی یک الکترون از نوار رسانش به نوار ظرفیت می‌رود، یک زوج

انرژی پتانسیل الکتروستاتیکی (ψ) $E = -q\psi$

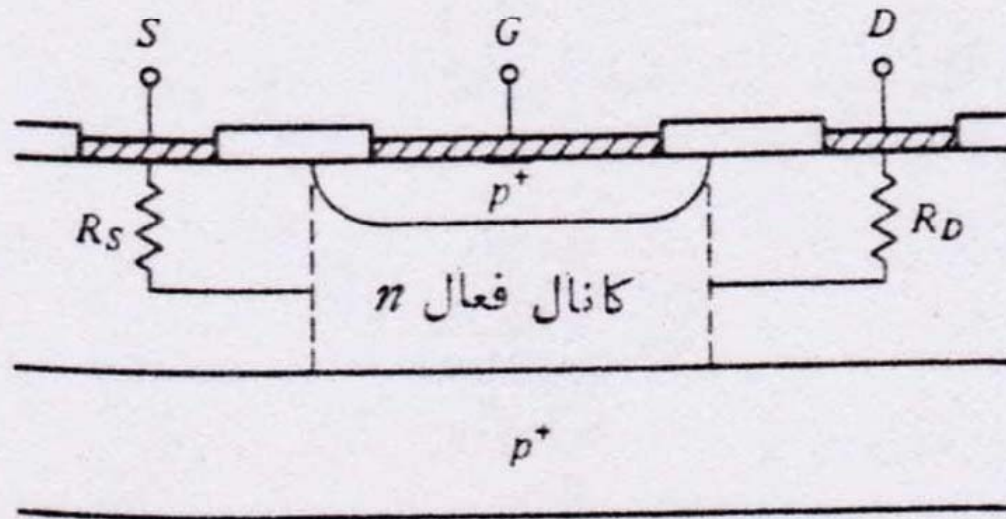


توزیع پتانسیل یک پیوندگاه
 پله‌ای یکطرفه تحت (الف) تعادل
 گرمایی با عرض لایه تهی W ، (ب)
 پیش‌ولت موافق V با عرض لایه تهی
 $W' < W$ ، و (ج) پیش‌ولت مخالف
 V_R با عرض لایه تهی $W'' > W$.
 اختلاف پتانسیل، یعنی ψ ، بدون $-q$ نوشته
 شده است.

1 فیزیکی

باز ترکیب

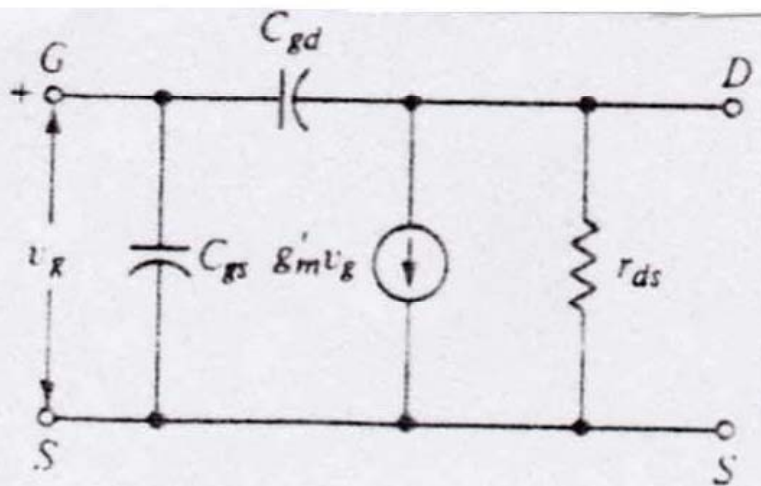
- الکترون – حفره نابود می‌شود. این فرایند معکوس، که باز ترکیب نامیده می‌شود، در شکل 1-2 با R نمایش داده شده است. تحت تعادل گرمایی، آهنگ تولید و آهنگ باز ترکیب باید مساوی باشند، بطوریکه تراکم حامل ثابت باقی بماند. بنابراین، شرط $pn = n_i^2$ برقرار می‌ماند.



مقاومت‌های سری در یک JFET.

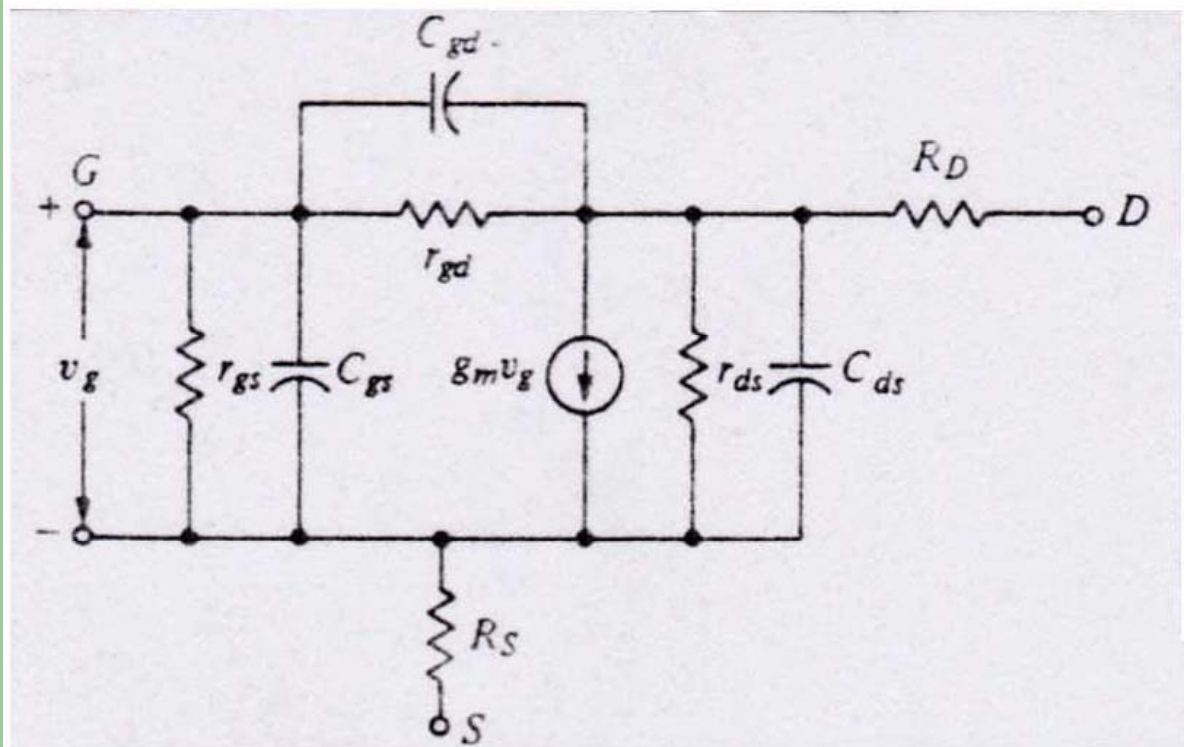
تزریق حامل

- شرط تعادل را می‌توان با وارد کردن حامل‌های آزاد و بیشتر کردن آنها از مقادیر تعادل گرمایی شان، آشفته کرد. این فرایند، که تزریق حامل نامیده می‌شود، می‌تواند به کمک وسایل نوری یا الکتریکی انجام شود. تزریق نوری شامل یک نور فرودی تکفام است که حاصل ضرب $h\nu$ بدست می‌آید، که ν بسامد نور و h ثابت پلانک است.



مدار معادل ساده شده سیگنال کم دامنه.

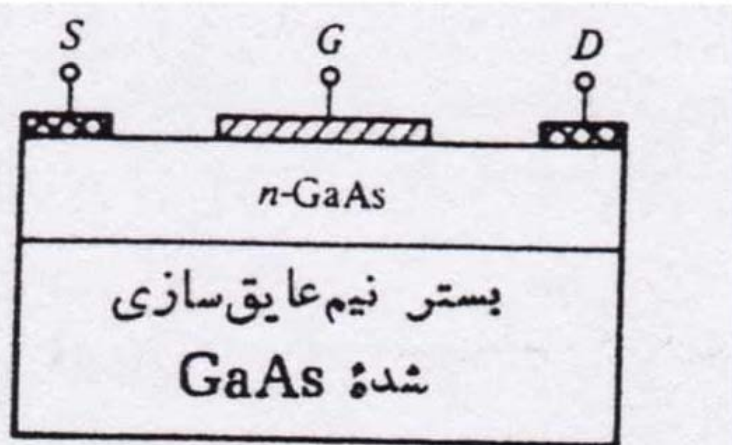
- وقتی انرژی نوری توسط یک الکترون واقع در نور ظرفیت جذب شود، الکترون به نوار رسانش برانگیخته می‌شود و یک حفره در نوار ظرفیت آفریده می‌شود. آهنگ تولید زوجهای الکترون – حفره توسط نور در شکل 1-2 با GL نشان داده شده است. تزریق حاملها، چگالیهای الکترون و حفره را افزایش می‌دهد بطوریکه $p_n > n_i^2$.



مدار معادل سیگنال کم داهنه.

حامل‌های اضافی

- حامل‌های زیادی را حامل‌های اضافی می‌نامند. الکترونها و حفره‌های اضافی همیشه تعدادشان یکی است، بطوریکه خنثی بودن بار فضایی پایدار می‌ماند. ساز و کارهای تزریق، بازترکیب و ترابری این حامل‌های اضافی، در تعیین مشخصات اکثر قطعات نیمرسانا از اهمیت خاصی برخوردارند.



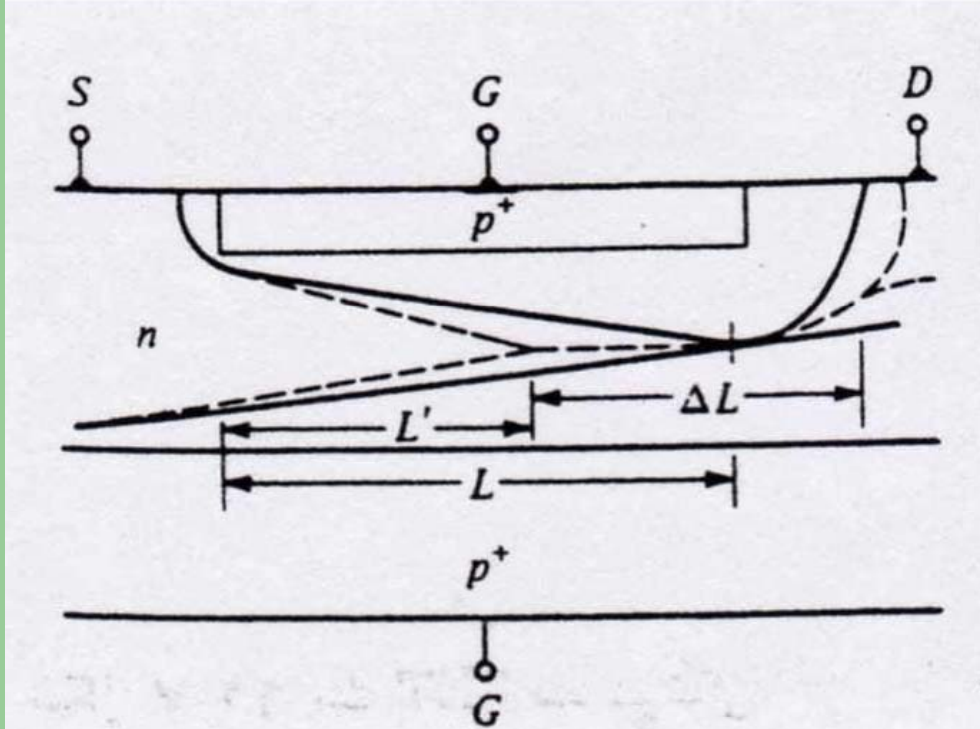
اتصال اهمی آلیاژی

دریچه فلزی

يك FET سد شوتکی.

تراز تزریق حاملها

- تعداد حاملهای تزریق شده، در نیمرسانا معمولاً رفتار قطعه را کنترل می‌کند. یک پولک سیستم نوع n را که بطور یکنواخت تحت تابش یک منبع نوری، با شرایط ثابت، است، در نظر بگیرید. قبل از اینکه منبع نور روشن شود، پولک سیستم در تعادل است و هیچ حامل اضافی وجود ندارد. چگالی حامل اکثریتی برابر با تراکم اتمهای بخشنده است، و چگالی حامل اقلیتی را می‌توان از معادله (1-28) محاسبه کرد. بعد از روشن شدن منبع نور، دو حالت مختلف ممکن است وجود

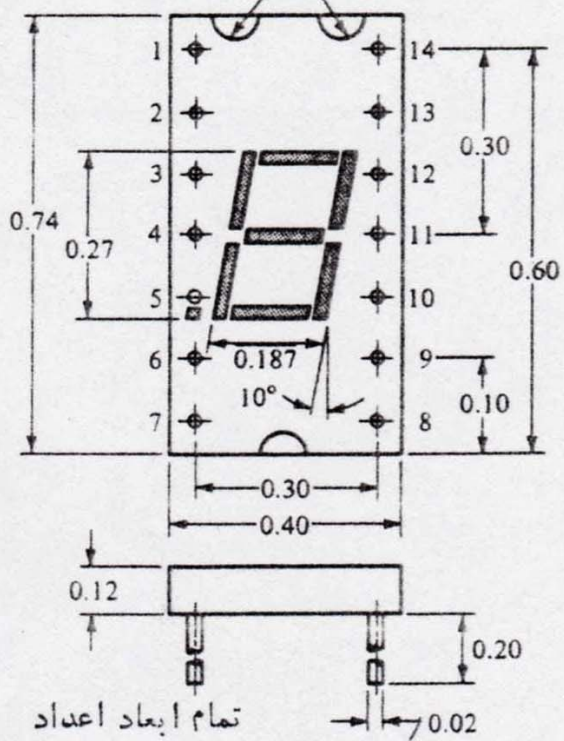


مدوله سازی طول کانال بعد از تنگش.

تزریق کم و زیاد

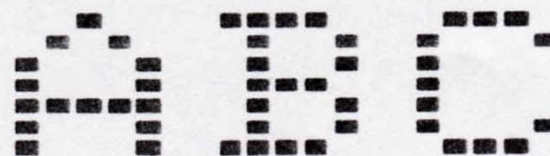
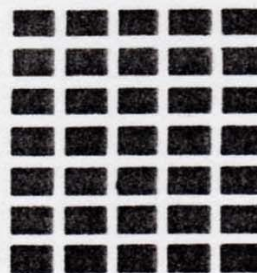
- داشته باشد . اگر چگالی حامل تزریق شده در مقایسه با تراکم بخشنده کم باشد، چگالی حامل اکثریتی اساساً بدون تغییر باقی می‌ماند، در حالی که چگالی حامل اقلیتی با چگالی حامل تزریق شده برابر است. این حالت را تزریق کم می‌نامند. اگر چگالی حامل تزریق شده از تراکم بخشنده تجاوز کند آن را تزریق زیاد می‌نامند.

ابعاد فیزیکی بسته بندی
علامتهای سمتگیری



تمام ابعاد اعداد
به اینجاست

(الف)

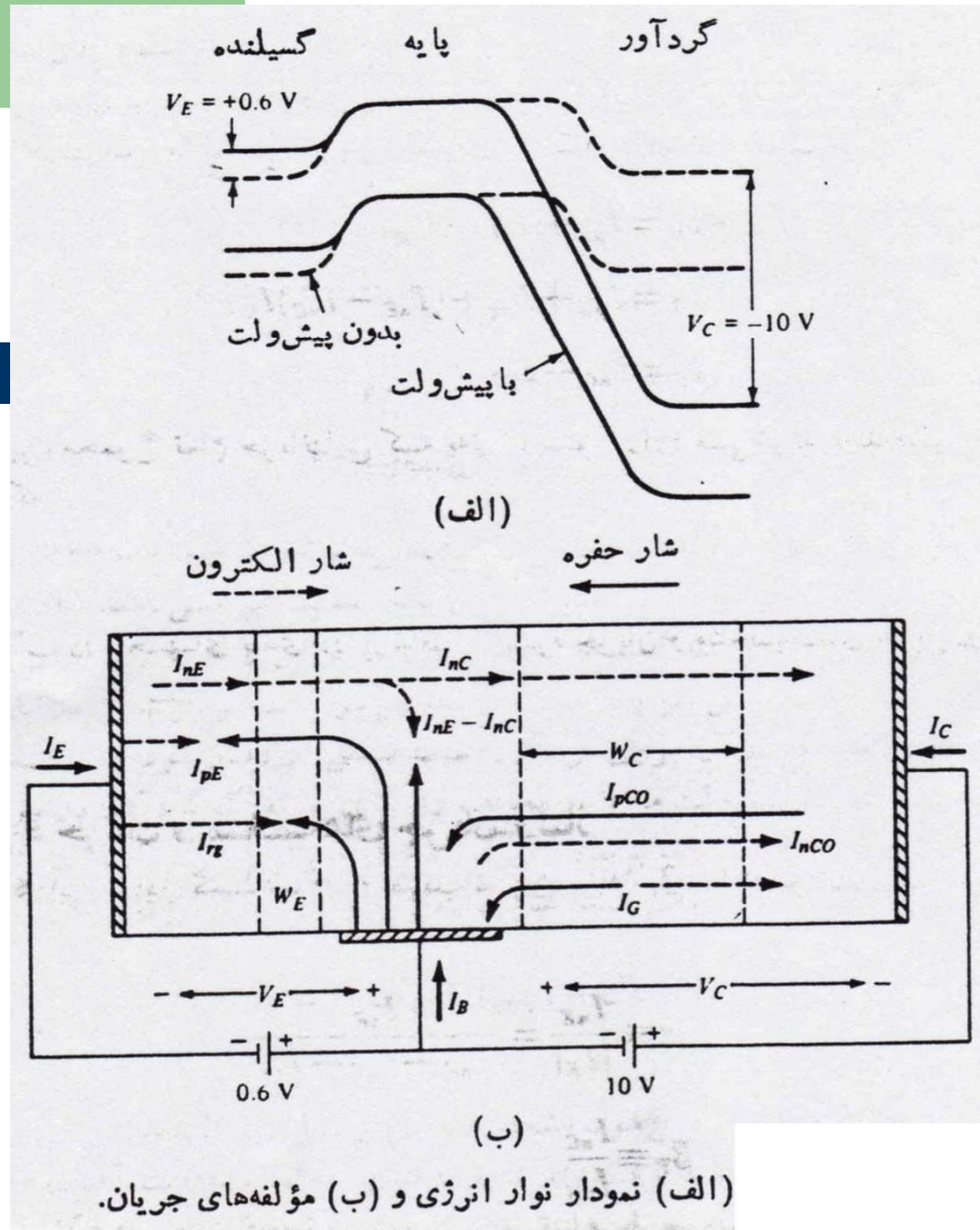


(ب)

(الف) نمایش LED هفت-بندی و (ب) آرایه ۵×۷ حرف - عددی [۱۲]

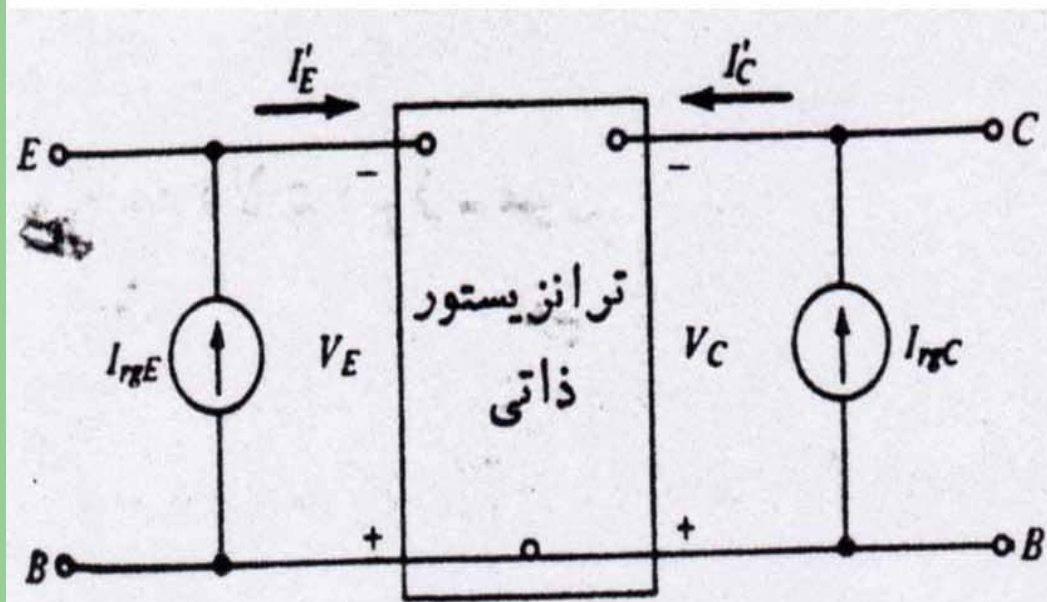
جدول سیلیسیم نوع n با $N_d=25/2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$

میزان تزریق			چگالی حامل، cm^{-3}
کم	زیاد	تعادل	Δn
10^{16}	10^{13}	0	اضافی
10^{16}	2.26×10^{15}	2.25×10^{15}	n_n اکثریتی
			1.225×10^{16}
10^{16}	10^{13}	10^5	p_n اقلیتی



سازوکارهای بازترکیب

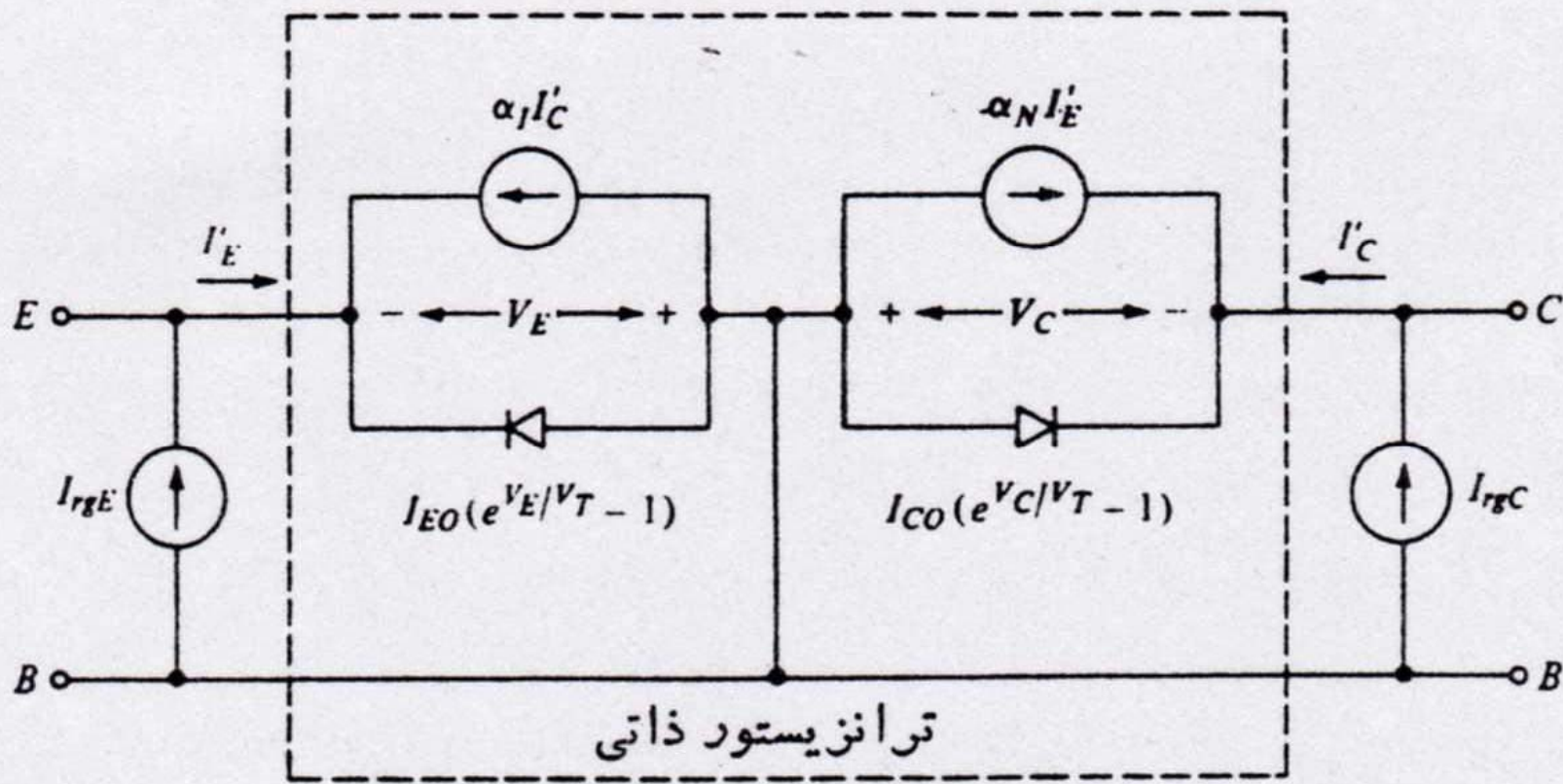
- الکترونهاى اضافى واقع در نوار رسانش ممکن است با حفره هاى نوار ظرفیت بازترکیب شوند.
- وقتى یک فوتون گسیل شود، فرآیند را بازترکیب تابشى مى نامند. از طرف دیگر، فقدان گسیل فوتون مبین یک فرآیند بازترکیب غیرتابشى است.
- مهمترین فرآیندهاى بازترکیب عبارتند از بازترکیبهاى مستقیم و غیرمستقیم، که ممکن است بطور همزمان در نیمرسانا رخ دهند.



مدار معادل، که در آن I_{Tg} از ترانزیستور ذاتی حذف شده است.

باز ترکیب مستقیم

- آهنگ این گذار متناسب است با الکترونهاى موجود در نوار رسانش و تعداد حالات اشغال نشده در نوار ظرفیت
- آهنگ باز ترکیب مستقیم $R = Bnp$
- که B یک ضریب احتمال است که ماهیت احتمالی باز ترکیب را بیان می‌کند.
- در تعادل، آهنگ باز ترکیب باید با آهنگ تولید گرمایی برابری کند. بنابراین، داریم $R = R_{th}$ و $G_{th} = R_{th} = Bn_0p_0$ که شاخص پائین 0 معرف شرط تعادل گرمایی است.



مدل ابرز - مول.

آهنگ باز ترکیب و تولید

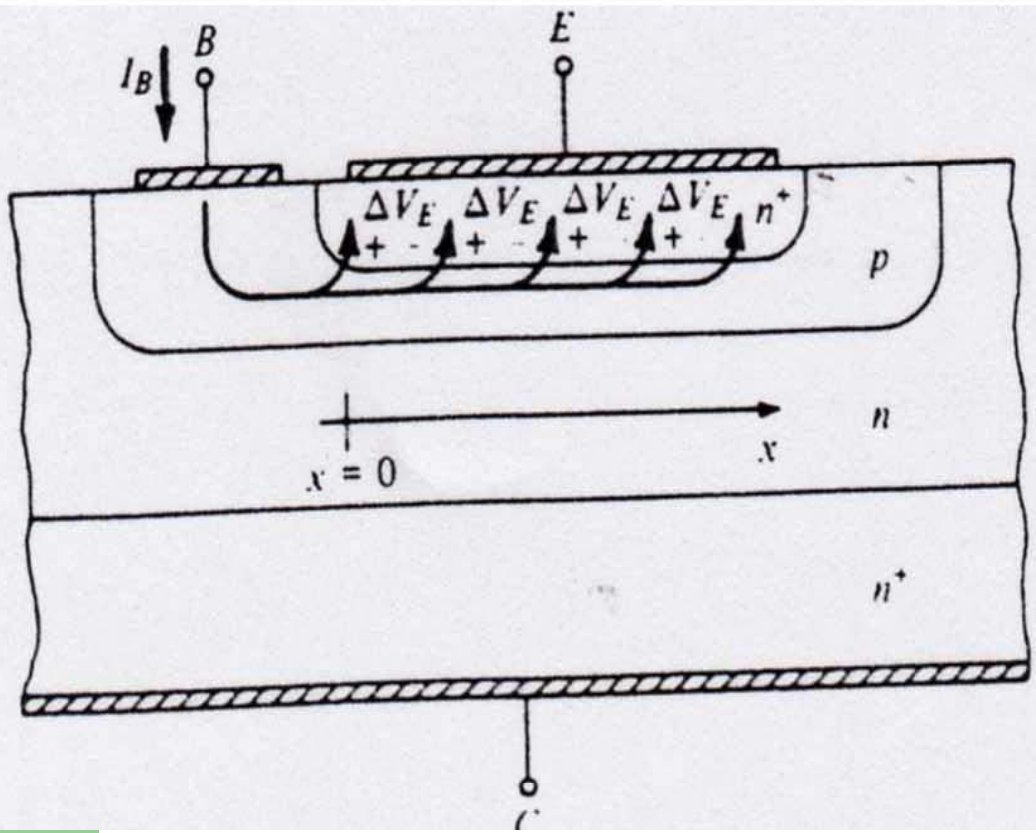
- وقتی یک منبع نور اعمال شود تا زوجهای الکترون-حفره را با آهنگ G_L تولید کند، چگالی حاملها بیشتر از مقادیر تعادلی آنها خواهد بود. آهنگهای باز ترکیب و تولید تبدیل شوند به

$$R = Bnp = B (n_0 + \Delta n)(p_0 + \Delta p)$$

$$G = G_{th} + G_L$$

- در آنها Δn و Δp چگالیهای بار اضافی اند که چنین تعریف می شوند.

$$\Delta n \equiv n - n_0 \quad \Delta p \equiv p - p_0$$



جریان جانبی پایه و افت
 اهمی در پایه، که به بیشترین پیش ولت
 موافق در $x=0$ منتهی می شود.

حالت پایا

- تحت نوردهی حالت پایا، آهنگهای بیان شده در معادلات باید مساوی باشند. بنابراین داریم.

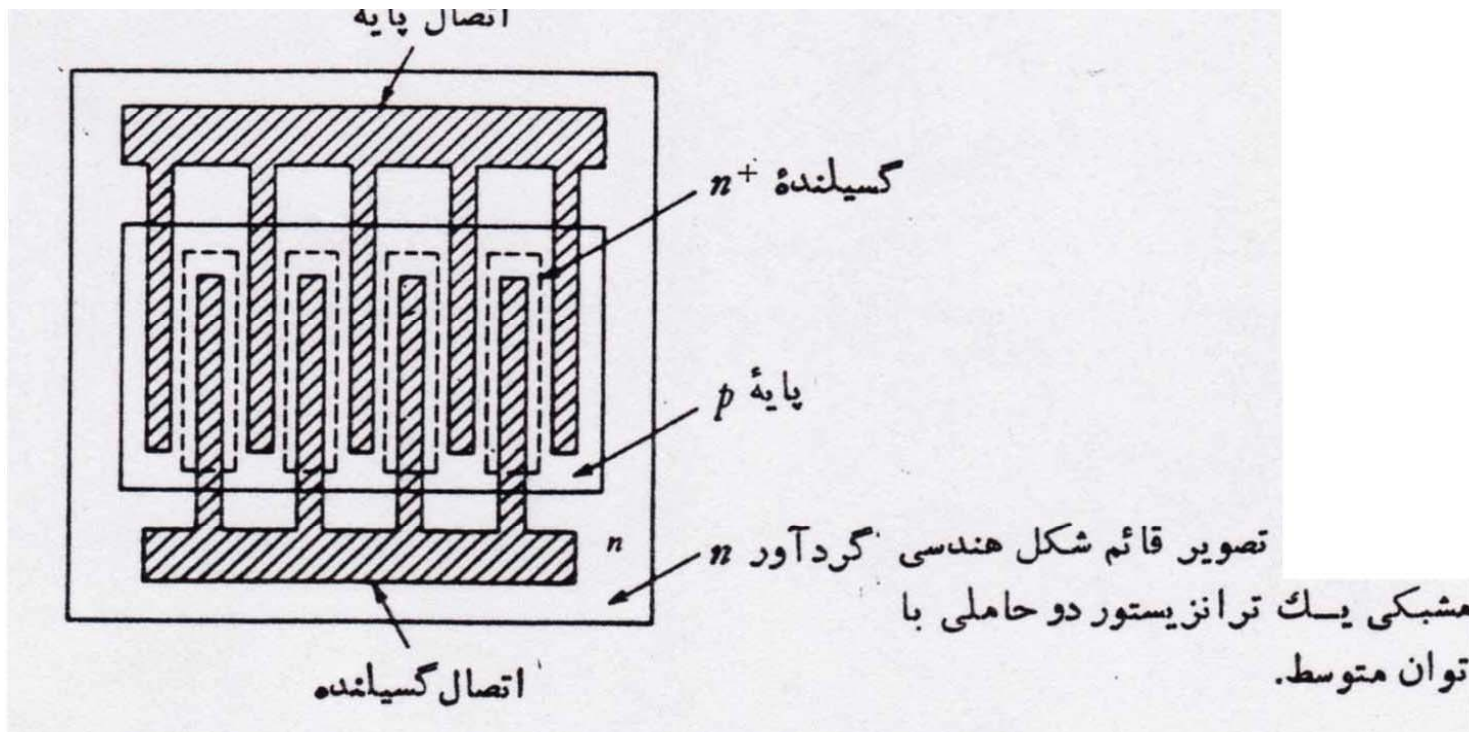
$$G_L = R - G_{th} \equiv U \quad \bullet$$

- که U آهنگ بازترکیب خالص است. با جایگذاری معادلات در خواهیم داشت:

$$G_L = B(n_0 + \Delta n)(p_0 + \Delta p) - Bn_0p_0 \quad \bullet$$

- چون $\Delta n = \Delta p$ ، بطوریکه خنثی بودن بار فضایی برقرار باشد، معادله را می‌توان چنین بازنویسی کرد.

$$B\Delta p^2 + B(n_0 + p_0)\Delta p = G_L \quad \bullet$$



طول عمر حاملها

- در تزریق کم، داریم $\Delta p \ll n_0 + p_0$. در نتیجه، معادله را می‌توان بصورت

$$\Delta p = \frac{G_L}{B(n_0 + p_0)} = G_L \tau = U \tau$$

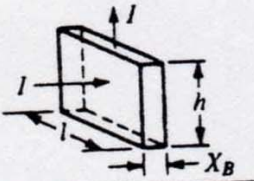
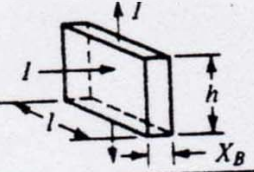
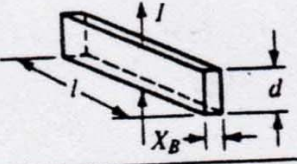
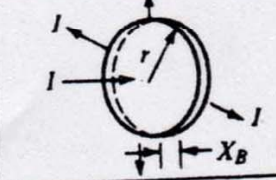
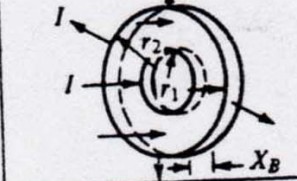
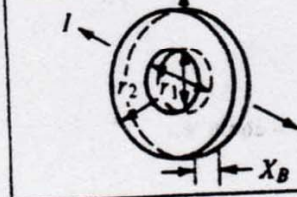
$$\tau \equiv \frac{\Delta p}{U} = \frac{1}{B(n_0 + p_0)}$$

- ساده کرد، که در آن

- کمیت τ طول عمر حامل حاملهای اضافی نامیده می‌شود.
- τ معرف زمان متوسطی است که یک حفره قبل از بازترکیب با الکترون آزاد باقی می‌ماند.

شکل هندسی

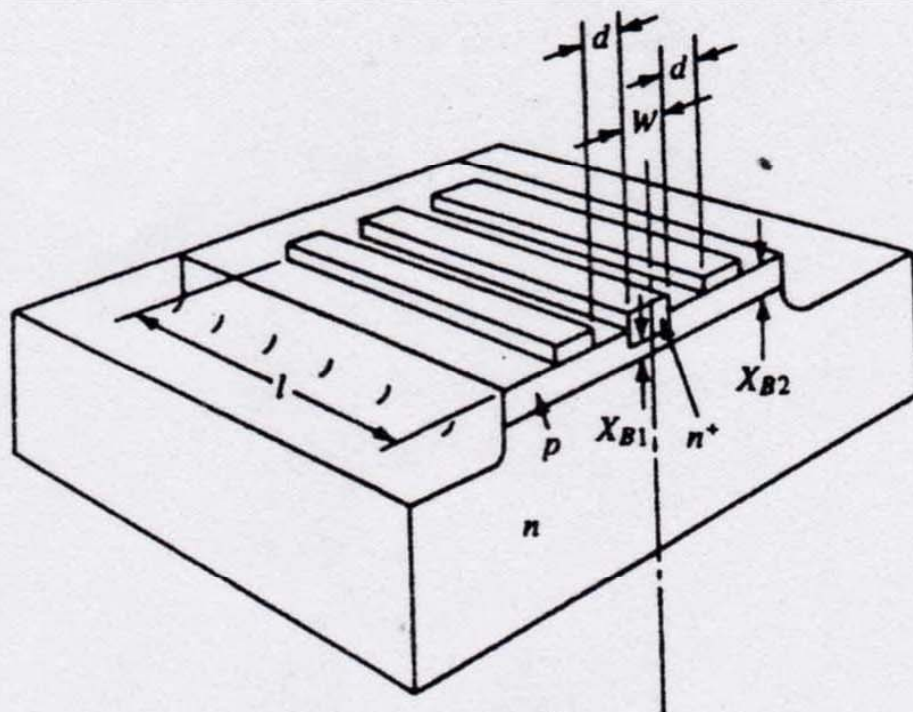
مقاومت

(الف)		$R = \frac{\rho}{3X_B} \frac{h}{l}$
(ب)		$R = \frac{\rho}{12X_B} \frac{h}{l}$
(ج)		$R = \frac{\rho}{X_B} \frac{d}{l}$
(د)		$R = \frac{\rho}{8\pi X_B}$
(ه)		$R = \frac{\rho}{4\pi X_B} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$
(و)		$R = \frac{\rho}{2\pi X_B} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$

جمع‌بندی فرمول‌های

مقاومت برای تعدادی عناصر با شکلهای هندسی متفاوت. این فرمولها را می‌توان در ترکیبهای تقریبی به کار برد و عبارتهایی تقریبی برای مقاومت پایه ترانزیستور به دست آورد [۵].

- در نیمرسانا با ساختار نوار انرژی مستقیم مثل GaAs، بازترکیب نوار به نوار سازوکار غالب است. انرژی آزاد شده توسط بازترکیب به شکل فوتون گسیل می‌شود، و فرایند تابشی است.

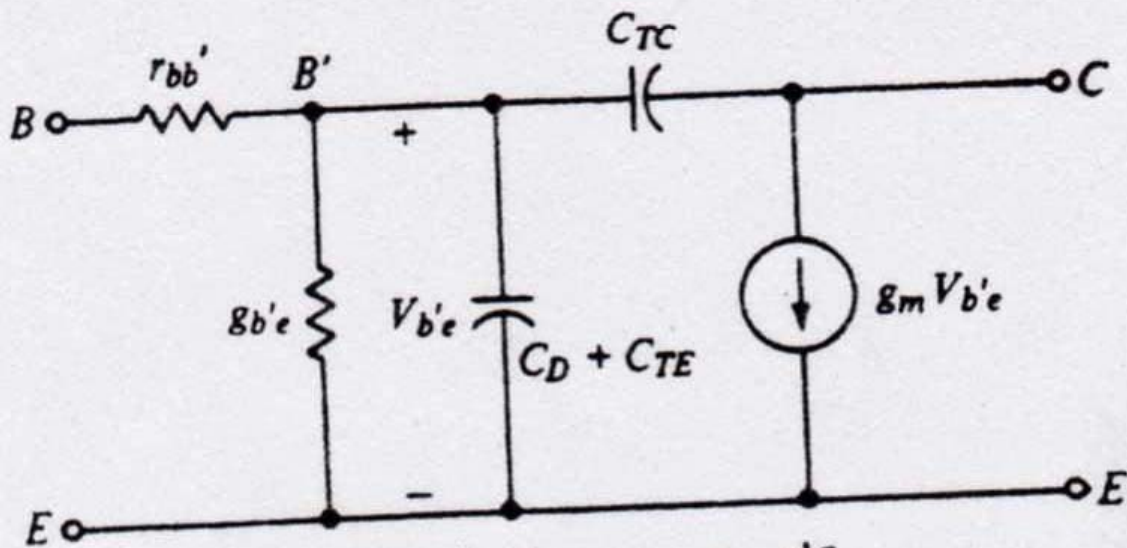


$$r'_B = \frac{\rho_B W}{1 \gamma X_{B1} L} + \frac{\rho_B d}{\gamma X_{B2} L}$$

يك عبارت تقريبي برای
مقاومت پاشیدگی پایه مربوط به شکل
هندسی نواری ترانزیستور [۵].

باز ترکیب غیر مستقیم

- در سیلیسیم یا ژرمانیم، پائینترین انرژی در نوار رسانش با بالاترین انرژی در نوار ظرفیت در فضای تکانه برهم منطبق نمی‌شوند. بنابراین، الکترون واقع در نوار رسانش هنگام گذار به طرف پائین باید تکانه و همچنین انرژی خود را تغییر دهد تا اصول پایستگی را برقرار سازد. در نتیجه، احتمال باز ترکیب نوار به نوار مستقیم در سیلیسیم یا ژرمانیم بسیار کم است. در حقیقت، حامل‌های واقع در سیلیسیم خیلی آسانتر از طریق مراکز باز ترکیب یا تله‌ها، که در داخل گاف ممنوع قرار گرفته‌اند، باز ترکیب می‌شوند. یک مرکز باز ترکیبی ممکن است متوالیاً یک حفره و سپس یک الکترون را به دام اندازد تا چرخه باز ترکیبی را کامل کند.

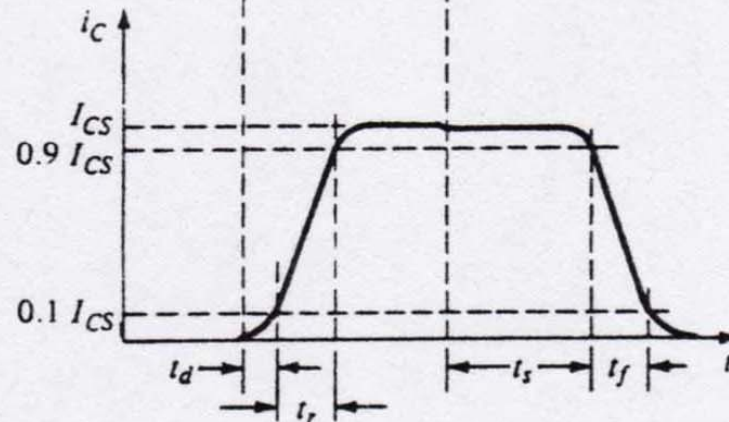
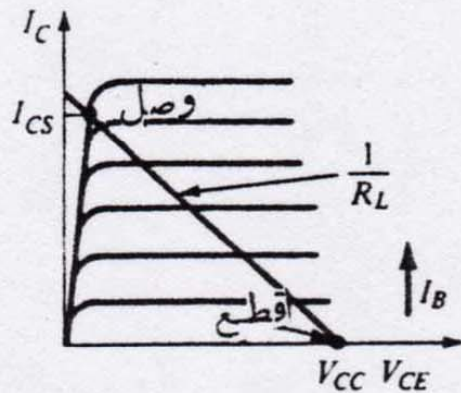
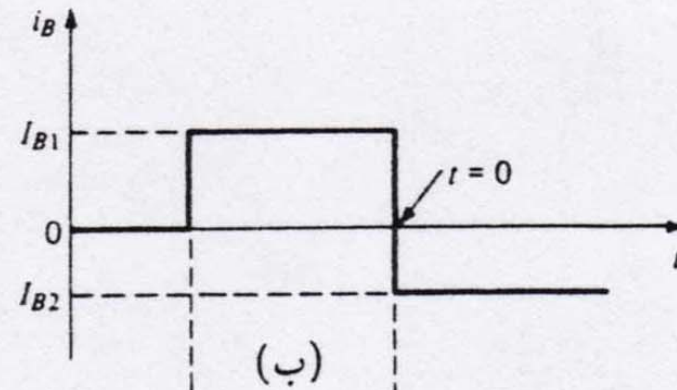
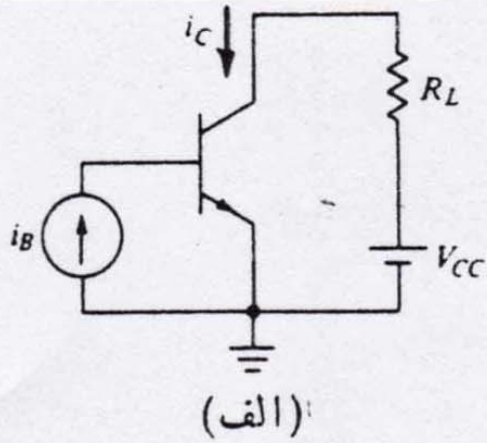


مقاومت پخشنده پایه $r_{bb'}$

مدار معادل دو رگه pi.

فرایندهای گذار

- چهار فرایند گذار نشان داده شده است:
 - (1) الکترون توسط یک مرکز خالی به دام می‌افتد،
 - (2) یک الکترون از مرکز اشغال شده گسیل می‌شود،
 - (3) یک مرکز اشغال شده، حفره ای را به دام می‌اندازد، و
 - (4) یک مرکز خالی، یک حفره گسیل می‌کند. چون احتمال اشتغال یک مرکز از تابع فرمی – دیراک که توسط معادله پیروی می‌کند، داریم:
- $$f_t = (e^{(E_t - E_f)/kT} + 1)^{-1}$$

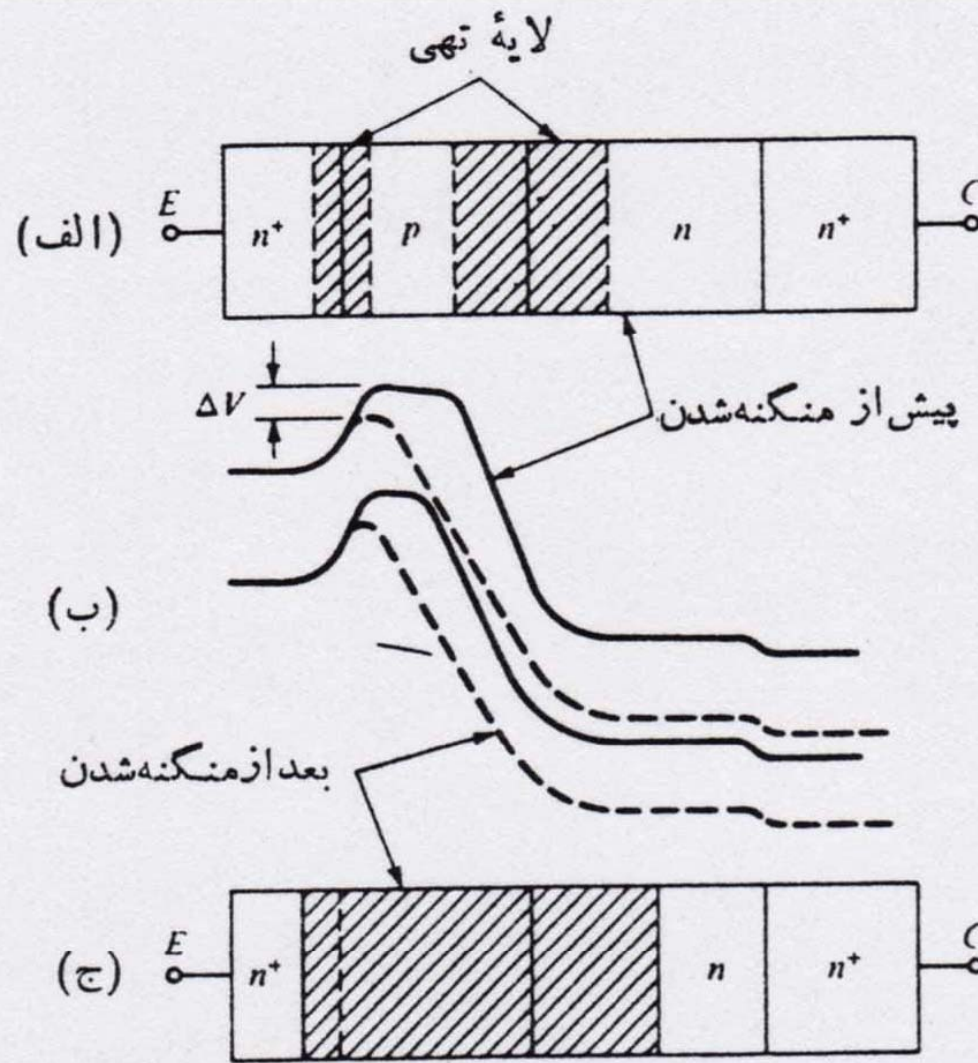


عمل کلیدزنی یک ترانزیستور دو حاملی؛ (الف) نمودار مدار، (ب) جریان پایه، (ج) مشخصه‌های $V-I$ خروجی، و (د) شکل موج جریان خروجی.

آهنگ به دام افتادن

- بنابراین تعداد مراکز اشغال شده مساوی $N_t f_t^0$ و تعداد مراکز خالی مساوی $N_t(1-f_t^0)$ است. شاخص بالا حالت تعادل را مشخص می‌کند.
- با دنبال کردن هماناستدلالی که برای بدست آوردن آهنگ باز ترکیب مستقیم بکار بردیم، در می‌یابیم که آهنگ به دام افتادن الکترون توسط مرکز خالی بصورت رابطه زیر است.

$$R_1 = c_n n N_t (1 - f_t)$$



منگنه شدن يك ترانزیستور $n-p-n$: (الف) نواحی بارفضایی قبل از منگنه شدن، (ب) نمودارهای نوار انرژی، و (ج) نواحی بارفضایی بعد از منگنه شدن.

- در آن چگالی الکترون در نوار رسانش و C_n ضریب به دام افتادن است، که مقدار نوعی آن $10^{-8} \text{cm}^3/\text{s}$ است.

آهنگ گسیل

- آهنگ گسیل الکترون به نوار رسانش از یک مرکز اشغال شده از رابطه $R_2 = e_n N_t f_t$ داده می‌شود که در آن e_n ضریب گسیل است.

آهنگ به دام افتادن و گسیل حفره

- به کمک قیاس، آهنگ به دام افتادن و گسیل حفره ها توسط مراکز را می توان بصورت زیر تعریف کرد:

$$R_3 = c_p p N_t f_t$$

$$R_4 = e_p N_t (1 - f_t)$$

- که c_p و e_p به ترتیب ضرایب به دام افتادن و گسیل حفره هستند.

تعادل گرمایی

- در تعادل گرمایی، تعداد الکترونهاى گسیل شده از مراکز باید با تعداد الکترونهاى به دام افتاده یکسان باشد، یعنی $R_1 = R_2$. با مساوى قرار دادن معادلات و استفاده از معادله، حاصل مى‌شود.

$$c_n n_i e^{(E_f - E_i)/kT} N_t (1 - f_t) = e_n N_t f_t$$

$$\frac{1 - f_t}{f_t} = e^{(E_t - E_f)/kT}$$

- علاوه بر این چون

$$e_n = c_n n_i e^{(E_t - E_i)/kT}$$

- داریم

آهنگ گسیل حفره

- با استفاده از همین روش و معادله ، آهنگ گسیل حفره عبارت است از

$$e_p = c_p n_i e^{(E_i - E_t)/kT}$$

عدم تعادل

- حال مورد عدم تعادل را با اعمال یک منبع انرژی خارجی، مثلاً، یک منبع نور، بررسی می‌کنیم، بطوریکه یک آهنگ تولید G_L بطور یکنواخت در سرتاسر نیمرسانا وجود دارد.

حالت پایا

- تحت شرایط حالت پایا، الکترونیایی که در نوار رسانش وارد و از آن خارج می‌شوند باید مساوی باشند. این را اصل موازنه جزء به جزء می‌نامند، و نتیجه آن این است که

$$G_L = R_1 - R_2$$

موازنه

- به همین ترتیب، موازنه جزء به جزء حفره ها در نوار ظرفیت منجر می شود به

$$G_L = R_3 - R_4$$

موازنه جزء به جزء

با مساوی قرار دادن معادلات، داریم

$$R_1 - R_2 = R_3 - R_4$$

$$C_n n N_t (1 - f_t) - e_n N_t f_t = c_p N_t f_t - e_p N_t (1 - F_t)$$

با فرض $C_n = C_p = C$ ، می توان f_t را از معادله به دست آورد.

$$f_t = \frac{n + n_i e^{(E_i - E_t)/kT}}{n + p + 2n_i \cosh[(E_t - E_i)/kT]}$$

آهنگ باز ترکیب خالص

بنابراین، آهنگ باز ترکیب خالص عبارت است از:

$$U \equiv R_1 - R_2 = \frac{cN_t(pn - n_i^2)}{n + p + 2n_i \cosh[(E_t - E_i)/kT]}$$

از معادله در می یابیم که در تعادل، یعنی $pn = n_i^2$ ، آهنگ باز ترکیب خالص صفر است. این نکته نیز جالب توجه است که آهنگ باز ترکیب پیشینه وقتی رخ میدهد که $E_t = E_i$.

کارآمدترین مراکز باز ترکیب

کارآمدترین مراکز باز ترکیب، در مرکز یا نزدیک به مرکز گاف ممنوع قرار گرفته اند. جز تراز E_i ، سایر مراکز کمتر مؤثر خواهند بود. زیرا احتمال به دام انداختن يك نوع از حاملها بیش از احتمال به دام انداختن يك نوع از حاملها بیش از احتمال به دام انداختن نوع دیگر است.

آهنگ برای باز ترکیب کم

وقتی نتایج اخیر را بر سیلیسیم نوع n با مرکزی واقع در E_i اعمال میکنیم، آهنگ باز ترکیب خالص برای تزریق کم $n_n \approx n_{no}$ تبدیل میشود به

$$U = C_p N_t \frac{P_n n_n - n_i^2}{n_n + p_n + 2n_i} \approx c_p N_t (p_n - p_{no})$$

بنابراین، آهنگ باز ترکیب خالص عبارت است از:

$$U \equiv R_1 - R_2 = \frac{cN_t(pn - n_i^2)}{n + p + 2n_i \cosh[(E_t - E_i)/kT]}$$

از معادله در می یابیم که در تعادل، یعنی $pn = n_i^2$ ، آهنگ باز ترکیب خالص صفر است.

آهنگ بیشینه

آهنگ باز ترکیب بیشینه وقتی رخ میدهد که $E_t = E_i$. به عبارت دیگر، کارآمدترین مراکز باز ترکیب، در مرکز یا نزدیک به مرکز گاف ممنوع قرار گرفته اند. جز تراز E_i ، سایر مراکز کمتر مؤثر خواهند بود. زیرا احتمال به دام انداختن يك نوع از حاملها بیش از احتمال به دام انداختن نوع دیگر است.

طول عمر حفرة

● با استفاده از

$$n_n = n_{no} \gg p_n + 2n_i \quad \text{و} \quad n_i^2 = n_{no} p_{no}$$

نیم رسانای نوع n

$$\tau_p = \frac{1}{c_p N_t}$$

طول عمر الکترون

● طول عمر حامل اقلیتی

طول عمر حامل اقلیتی در
نیم رسانای نوع p از رابطه

$$\tau_n = \frac{1}{c_n N_t}$$

2-4- پاسخ باز ترکیب گذرا

معني فيزيكي طول عمر حامل به بهترين وجهي توسط پاسخ گذرا بعد از قطع ناگهاني منبع نور نمايش داده ميشود. معادله عمومي كه آهنگ تغيير حاملهاي اضافي.

$$d \frac{\Delta p}{dt} = G_L - \frac{\Delta p}{\tau_p} \qquad d \frac{\Delta p}{dt} = G_L - U$$

تراكم حامل اضافي حالت پايا در $t \ll 0$ عبارت است از $\Delta p = G_L \tau_p$

آزمایش فوتورساندگی

$$\Delta p = G_L \tau_p e^{-t/\tau_p}$$

$$\sigma = q[\mu_n n(t) + \mu_p p(t)]$$

$$n(t) = n_0 + \Delta n(t), p(t) = p_0 + \Delta p(t), \Delta n = \Delta p$$

$$\sigma(t) = \sigma_0 + q(\mu_n + \mu_p) \Delta p(t)$$

$$\sigma_0 = q(\mu_n n_0 + \mu_p p_0)$$

بسامد نوسان نما

در مدار مربوط به آزمایش، ولتاژی که توسط نوسان نما اندازه گرفته می شود، عبارت است از

$$v = \frac{R_s V}{R + R_s} \approx \frac{R_s V}{R}, \quad R \gg R_s$$

$$R = L / \sigma A$$

با استفاده از

$$v = \frac{\sigma R_s V}{L}$$

باز ترکیب سطحی

حضور ناپیوستگی در ساختار شبکه در سطح نیمرسانا، تعداد زیادی حالت‌های انرژی را در گاف ممنوع تولید می‌کند. این حالت‌های انرژی، که حالت‌های سطحی نامیده می‌شوند، آهنگ باز ترکیب را در ناحیه سطح به شدت زیاد می‌کند.

باز ترکیب سطحی

آهنگ باز ترکیب سطحی در واحد سطحی

$$U_s = c N_{ts} [p_n(\circ) - p_{no}]$$

که $p_n(0)$ عبارت است از چگالی حامل اقلیتی سطحی متوسط و N_{ts} عبارت است از چگالی مراکز باز ترکیب متوسط بر واحد سطح در لایه سطحی. چون حاصلضرب cN_{ts} دارای بعد سانتی متر بر ثانیه است، آن را سرعت باز ترکیب سطحی S می نامند.

$$U_s = S [p_n(\circ) - p_{no}]$$

$$-q D_p \left. \frac{d p_n}{d x} \right|_{x=\circ} = q U_s = q S [p_n(\circ) - p_{no}]$$

میدان و پتانسیل های الکتریکی

میدان الکتریکی \mathcal{E} به صورت شیب منفی پتانسیل V تعریف می شود.

$$\mathcal{E} = -\frac{dV}{dx}$$

$$-qV = E$$

می توانیم میدان الکتریکی را چنین بیان کنیم

$$\mathcal{E} = \frac{1}{q} \frac{dE_i}{dx} = -\frac{d\psi}{dx}$$

$$\psi = -\frac{E_i}{q}$$

پتانسیل فرمی

نماد ψ پتانسیل الکتروستاتیکی ، پتانسیل فرمی

$$\phi \equiv -\frac{E_f}{q}$$

$$n = n_i e^{(\psi - \phi)/V_T}$$

$$p = n_i e^{(\psi - \phi)/V_T}$$

$$V_T \equiv \frac{kT}{q}$$

رابطه اینشتین

در 300 k، مقدار V_T برابر 8/25 mV است.

تبادل گرمایی

در تبادل گرمایی، پتانسیل فرمی ثابت است، و میتوان آن را به عنوان مرجع صفر کرد. بنابراین،

$$p = n_i e^{-\psi/V_T}$$

$$I_p = q A (\mu_p p \varepsilon - D_p \frac{d p}{d x}) = 0$$

$$\frac{D_p}{\mu_p} = V_T = \frac{kT}{q}$$

نیم رسانای ناهمگن

توزیع ناخالصی ناهمگن، به یک میدان الکتریکی داخلی منتهی می شود. یک قرص سیلیسیم از نوع n با توزیع ناخالصی نمایش یافته را در نظر بگیرید.

با فرض اینکه اتمهای ناخالصی یونیده اند، چگالی الکترون n (الف) برابر $N_d(x)$ است.

$$E_i = E_f - kT \ln \frac{N_d(x)}{n_i}$$

انرژی فرص ناهمگن

- به ازای $N_d = n_i$ داریم: $E_i - E_f$. به ازای مقادیر $N_d > n_i$ ، انرژی E_i وسط گاف زیر E_f است و تفاضل $E_f - E_i$ با افزایش N_d زیاد می شود.

پتانسیل و میدان

$$\psi = V_T \ln \frac{N_d(x)}{n_i}$$

$$\mathcal{E} = -\frac{V_T}{N_d} \frac{d N_d}{d x}$$

ترازهای فرمی وار

تحت شرایط عدم تعادل، می توان دو کمیت E_{fR} و E_{fn} را برای جانشینی تراز فرمی معرفی کرد.

مثال. ترازهای فرمی وار در 300 K (دمای اتاق) را برای نیمرسانایی با

$$G_L = 10^{18} \text{ cm}^{-3} \text{ s}^{-1}, n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3}, \tau_n = 10 \mu\text{s}, N_a = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

حل:

$$\Delta n = \Delta p = \tau_n G_L = 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

$$p = p_0 + \Delta p = N_a + \Delta p \approx 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

بنابراین:

$$n = n_0 + \Delta n = \frac{n_i^2}{N_a} + \Delta n = 10^4 + 10^{13} \approx 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

ادامه مثال

در 300 K داریم $kT = 26 \text{ meV}$

$$E_{fn} - E_i = kT \ln \frac{n}{n_i} = 0.026 \ln \frac{10^{13}}{10^{10}} = 0.18 \text{ eV}$$

$$E_i - E_{fp} = 0.026 \ln \frac{10^{16}}{10^{10}} = 0.36 \text{ eV}$$

تراز فرمی وار برای حفره ها

حاصلضرب p_n در وضعیت عدم تعادل

$$pn = n_i^2 \exp \frac{\varphi_p - \varphi_n}{V_T}$$

در حالت تعادل، $\varphi_n = \varphi_p = \varphi$ ، $pn = n_i^2$. با افزایش تزریق،
تفاضل $E_{fn} - E_i$ افزایش می یابد. بنابراین، E_i از E_{fn} دور می شود به طرف E_c

می رود
افزایش قطعات نیمه رسانا

چگالی جریان

$$\frac{dn}{dx} = \frac{n}{V_T} \left(\frac{d\psi}{dx} - \frac{d\phi_n}{dx} \right)$$

$$J_n = \frac{I_n}{A} = -q \mu_n \frac{d\phi_n}{dx} = -\sigma(x) \frac{d\phi_n}{dx}$$

$$J_p = \frac{I_p}{A} = -q \mu_p \frac{d\phi_p}{dx} = -\sigma(x) \frac{d\phi_p}{dx}$$

که J_p و J_n به ترتیب چگالی جریان الکترون و حفر اند، اینها قوانین اصلاح شدة اهم هستند.

معادلات حاکم بر نیم‌رسانا

پیوستگی شارش حاملها مستلزم این است که آهنگ تغییر تعداد حفره ها در Δx مساوی با حفره های باز ترکیبی به علاوه حفره های ترك کننده نمود باشد. شارش خالصی حفره به خارج از نمو عبارت است از :

$$\frac{J_p(x + \Delta x)}{q} - \frac{J_p(x)}{q} = \frac{1}{q} \frac{\partial J_p}{\partial x} \Delta x$$

$$U \Delta x = \frac{p - p_0}{\tau_p} \Delta x$$

$$-\frac{\partial p}{\partial t} \Delta x$$

معادله پیوستگی

$$\frac{1}{q} \frac{\partial J_p}{\partial x} + \frac{p - p_0}{\tau_p} = - \frac{\partial p}{\partial t}$$

$$- \frac{1}{q} \frac{\partial J_n}{\partial x} + \frac{n - n_0}{\tau_n} = - \frac{\partial n}{\partial t}$$

$$J_p = \frac{I_p}{A} = q \left(\mu_p p \varepsilon - D_p \frac{d p}{d x} \right)$$

$$J_n = \frac{I_n}{A} = q \left(\mu_n n \varepsilon - D_n \frac{d n}{d x} \right)$$

پیوستگی جریان الکترون

جواب عمومی

توزیع حامل اقلیتی حالت پایا در یک تراشه همگن نیمه نامتناهی از نیمرسانای نوع n را مشروط بر اینکه یک چگالی $p_n(0) - P_{no}$ تولید شده باشد، در نیمرسانای همگن، $\mathcal{E} = 0$

$$J_p = -q D_p \frac{d p_n}{d x}$$

$$D_p \frac{d^2 p_n}{d x^2} - \frac{p_n - P_{no}}{\tau_p} = 0$$

$$p_n - P_{no} = A e^{x/L_p} + B e^{-x/L_p}$$

جواب عمومی

طول پخش

که در آن $L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$ ، و به طور پخش حفره های معروف است .
چون به ازای $x = \infty$ هیچ حامل اضافی تولید نمی شود،

در $x = \infty$ یا $A = 0$ ، $p_n - p_{no} = 0$

$p_n(0) - p_{no}$ حاصل می شود . $Bp_n(0) - p_{no}$

$$p_n = p_{no} + [p_n(0) - p_{no}]e^{-x/L_p}$$

اثر بار فضایی

نیمرسانا به صورت يك كل، خنثي است. مي توان با استفاده از معادله پواسون نواحي باردار را توصيف و رابطه آنها با ميدان الكتريكي را پيدا كرد

$$\frac{d\varepsilon}{dx} = \frac{\rho}{K\varepsilon_0}$$

$$\varepsilon = \int \frac{\rho dx}{K\varepsilon_0}$$

بار خالص فضایی

بار خالص فضایی در نیمرسانا عبارت است از مجموع بارهای مثبت منهای مجموع بارهای منفی.

بار خالص فضایی

$$\rho = q[p + N_d - (n + N_a)]$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{q}{K \epsilon_0} [(n - p) + (N_a - N_d)]$$

پیوندگاه p-n

مرز متالورژیکی بین یک ناحیه p و یک ناحیه n را پیوندگاه p-n می نامند. روش تشکیل یک پیوندگاه p-n، عبارت از پخش ناخالصی است، توزیع ناخالصی حاصل یا به تابع خطای مکمل نزدیک است و یا به تابع گاوسی. در عمل، پیوند p-n پخشی را معمولاً با یک پیوندگاه پله ای با یک پیوندگاه شیبدار خطی تقریب می زنند.

پیوند در تعادل

تراز فرمی در ماده نوع n نزدیک به لبه نوار رسانش، و در ماده نوع p نزدیک به لبه نوار ظرفیت است. وقتی این مواد به هم متصل می شوند، تراز فرمی در وضعیت تعادل باید ثابت باشد. در غیر این صورت، یک شارش جریان وجود خواهد داشت.

شرط ثابت بودن تراز فرمی

- شرط ثابت بودن تراز فرمی این است که الکترونها از طرف n به طرف p ، و حفره های در جهت مقابل انتقال یابند.

معادله پواسون

رابطه بين توزيع بار و پتانسيل الكتروستاتيكي توسط معادله پواسون داده مي شود.

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -\frac{\rho}{K\epsilon_0} = \frac{q}{K\epsilon_0}[(n-p) - (N_d - N_a)]$$

با انتخاب پتانسيل فرمي به عنوان مرجع صفر مي توان آنها را به صورت زير نوشت

$$n = n_i e^{\psi/V_T}$$

نواحی

$$p = n_i e^{-\psi / V_T}$$

معادلات را می توان در نواحی گوناگون پیوندگاه p-n به کار برد. این نواحی عبارتند از

- (1) نواحی خنثی دور از پیوندگاه
- (2) ناحیه تهی، جایی که بارهای ثابت وجود دارند لیکن حاملهای آزاد وجود ندارند، و
- (3) لایه های مرزی بین نواحی خنثی و تهی.

ناحیه خنثی

در نواحی خنثی، چگالی بار فضایی کل صفر است.

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = 0$$

$$n - p - N_d + N_a = 0$$

برای ناحیه خنثی نوع n ، $N_0=0$ ، $p \ll n$ ،
 $N_0=p=0$.

$$\psi_n = V_T \ln \frac{N_d}{n_i}$$

ناحیه خنثی p

برای ناحیه خنثی نوع p، پتانسیل ناحیه خنثی نوع p

$$\psi_p = -V_T \ln \frac{N_a}{n_i}$$

اختلاف پتانسیل بین نواحی خنثی طرف n و طرف p

$$\psi_o = \psi_n - \psi_p = V_T \ln \frac{N_d N_a}{n_i^2}$$

ψ_o به پتانسیل داخلی یا پتانسیل پخشی معروف است. به شرط تعادل گرمایی در یک پیوندگاه p-n وجود دارد.

1 فیزیک قطعات نیمه رسانا

ناحیه تهی

برای ناحیه کاملاً تهی شده، چگالی حاملهای آزاد صفر ($n=p=0$)

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -\frac{q}{K\epsilon_0}(N_a - N_d)$$

در لایه های مرزی

عرض لایه مرزی تقریباً 3 برابر طول مشخصه ای معروف به طول دبی غیرذاتی L_D است.

$$L_D = \left(\frac{K\epsilon_0 V_T}{q|N_d - N_a|} \right)^{1/2}$$

L_D مقیاسی برای تیزی لبه ناحیه تهی است.

1 فیزیک قطعات نیمه رسانا

تقریب ناحیه تهی

با چشمپوشی از لایه های مرزی، ناحیه بار فضایی یک پیوندگاه پله ای را می توان به خوبی توسط توزیع نوع جعبه ای نمایش یافته نشان داد. در این ناحیه، حاملهای آزاد را می توان نادیده گرفت، به طوری که معادله پواسون برای طرف n و طرف p به شکل ساده زیر در می آید.

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \begin{cases} -\frac{qN_d}{K\varepsilon_0}, & 0 < x < x_n & \text{به ازای} \\ -\frac{qN_a}{K\varepsilon_0}, & -x_p < x < 0 & \text{به ازای} \end{cases}$$

عرض لایه بار فضایی

خنثایی بار فضایی برای نیمرسانا، به عنوان یک کل، مستلزم این است که بارها در دو طرف پیوندگاه مساوی باشند. لذا

$$N_a x_p = N_d x_n$$

x_n و x_p ، به ترتیب عرض لایه تهی در طرف p و طرف n است. عرض لایه بار فضایی کل از رابطه

$$W = x_p + x_n$$

پیوندپله ای یکطرفه

پیوندگاه پله ای یکطرفه، تقریبی عالی برای پیوندگاه پخشی با عمق کم است. مثلاً اگر $N_a \gg N_d$ ، داریم $X_n > X_p$ و $W \sim X_n$. آن است که لایه بار فضایی در طرفی که آلایش زیاد است، قابل چشمپوشی است.

می توان تنها با حل معادله پواسون در طرفی که آلایش کم است

$$\frac{d\psi}{dx} = -\frac{q N_d}{K \epsilon_0} (x - x_n)$$

میدان بیشینه

به ازای $x = x_n$ داریم $d\psi / dx = 0$
چون $\mathcal{E} = -d\psi / dx$

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \left(1 - \frac{x}{x_n} \right)$$

$$\mathcal{E}_m = \frac{-q N_d x_n}{k \epsilon_o}$$

\mathcal{E}_m میدان الکتریکی بیشینه

$$\psi = \frac{-q N_d x_n^2}{2 k \epsilon_o} \left(1 - \frac{x}{x_n} \right)^2$$

عرض لایه تهی

که شرط مرزی $\psi = 0$ در $x = x_n$ به کار رفته است.

$$\psi_0 = |\psi(0)| = \frac{-q N_d x_n^2}{2 k \epsilon_0}$$

ψ_0 پتانسیل داخلی است زیرا مساوی اختلاف پتانسیل بین x_n و 0 است.

عرضه لایه تهی

$$W = x_n = \left(\frac{2 K \epsilon_0 \psi_0}{q N_d} \right)^{1/2}$$

مثال

مثال. يك ديود p-n سيليسيومي از نوع پيونديگاه پله اي ، به ترتيب، با $N_d=10^{16} \text{cm}^{-3}$ و $N_a=4 \times 10^{18}$ در طرف n و طرف p آلاييده شده است. پتانسيل داخلي، عرض لايه تهي، و ميدان بيشينه را در پيش ولت صفر و دمائي اتاق محاسبه كنيد.

$$\psi_o = 0.026 \ln \frac{4 \times 10^{18} \times 10^{16}}{2.25 \times 10^{20}} = 0.83 \text{V}$$

$$W = x_n = \left(\frac{2K \epsilon_o \psi_o}{q N_d} \right)^{1/2} = 3.25 \times 10^{-5} \text{cm}$$

$$\epsilon_m = \frac{-q N_d x_n}{k \epsilon_o} = -5 \times 10^4 \text{V/cm}$$

پیوند شیبدار خطی

در يك پیوندگاه شیبدار خطي، توزیع بار فضایی در لایه تهی از رابطه

$$N_d - N_a = ax$$

a شیب تراکم ناخالصي است. معادله پواسون

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -\frac{q}{K \epsilon_0} ax$$

عرض در هنگام تعادل

عرض لایه تهی و ولتاژ داخلی به هنگام تعادل عبارتند از

$$W = \left(\frac{12 K \epsilon_0 \psi_0}{q a} \right)^{1/3}$$

$$\psi_0 = 2V_T \ln \frac{aW}{2n_i}$$

پیش ولت دادن به پیوندگاه

وقتی يك منبع ولتاژ خارجی به دو سر پیوندگاه p-n وصل شود، تعادل گرمایی آشفته می شود و جریانی در نیمرسانا به راه میافتد. اگر يك ولتاژ مثبت V در طرف p نسبت به طرف n اعمال کنیم، ارتفاع سد پتانسیل در پیوندگاه p-n، به $-V - \psi_0$ کاهش مییابد. این قطبیت ولتاژ در جهت پیش ولت موافق، p-n به دست می دهد.

اتصال پیش ولت مخالف

اگر ولتاژ منفي $-VR$ به طرف p نسبت به طرف n اعمال شود، ارتفاع سد پتانسیل به افزایش می یابد. سد پتانسیل افزایش یافته مانع انتقال حاملها از میان پیوندگاه می شود. شارش جریان از میان پیوندگاه فوق العاده کم، و مقاومت ظاهري پیوندگاه بسیار زیاد خواهد بود.

پیش و لت مخالف

عرض لایة تهی برای پیوندگاه پله ای به

$$W = \left[\frac{2K \varepsilon_0 (\psi_0 + V_R)}{q N_d} \right]^{1/3}$$

و برای پیوندگاه شیبدار خطی

$$W = \left[\frac{12K \varepsilon_0 (\psi_0 + V_R)}{q a} \right]^{1/2}$$

تراکم حامل‌های اقلیتی در مرز پیوندگاه

$$\psi_s = V_T \ln \frac{p_{po} n_{no}}{n_i^2} = V_T \ln \frac{n_{no}}{n_{po}}$$

$$n_{no} = n_{po} e^{\psi_o / V_T}$$

$$p_{po} = n_{no} e^{\psi_o / V_T}$$

از چگالی‌های تعادلی الکترون در طرف n و در طرف p. n_{po} و n_{no} به ترتیب عبارتند

به همین ترتیب، داریم

تراکم حاملها

با اعمال پیش ولت موافق V ، پتانسیل پیوندگاه $\psi_0 - V$ کاهش می‌یابد.

$$n_n = n_p e^{(\psi_0 / V) V_T}$$

n_p و n_n چگالیهای الکترون در لبه لایه بار فضایی برای تزریقهای کم، چگالی الکترون تزریق شده در طرف n در مقایسه با n_{n0} کوچک

$$\text{است. } n_n = n_{n0}$$

$$n_p = n_{p0} e^{V / V_T}$$

به همین ترتیب داریم

$$P_n = P_{n0} e^{V / V_T}$$

اثر بار فضایی و تقریب پخش

- رفتار حاملها را در طرف خنثای n ، وقتی به آن حفره تزریق
- یک میدان آنی توسط بار مثبت ناشی از حفره های اضافی تزریق شده برقرار
- ناحیه با بار اضافی، میدان کوچکی وجود دارد.
- حاملهای اکثریتی را شکل می دهد تا خنثی بودن بار فضایی را برقرار کنند در حالی که حاملهای اقلیتی به سختی تحت تأثیر این میدان قرار می گیرند.

تقریب پخش

- در ناحیه ای که حاملها به آن تزریق شده‌اند، شرط خنثایی بار فضایی برقرار است. حاملهای اقلیتی، که خنثی شده‌اند، غیرباردار هستند، و بر اثر پخش در ناحیه خنثی انتقال می‌یابند. این پدیده به تقریب پخش معروف است.

$$E = 0$$

$$I_p = -qAD_p \frac{dp_n}{dx}$$

معادلات

و معادله پیوستگی حفره

$$\frac{\partial P_n}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p_n}{\partial x^2} - \frac{p_n - p_{no}}{\tau_p}$$

معادله پخش برای حفره هاست.

جریان الکترون و معادلات پخش در طرف p پیوندگاه عبارتند از

$$I_n = qAD_n \frac{dn_p}{dx}$$

$$\frac{\partial n_p}{\partial t} = D_n \frac{\partial^2 n_p}{\partial x^2} - \frac{n_p - n_{po}}{\tau_n}$$

دیود کوتاه

در برخی از دیودها، طول طرف کم آلییده تر، W_n ، ممکن است در حدود طول پخش باشد. این دیود را دیود کوتاه می نامیم. جریان حامل اقلیتی در انتهای دورتر طرف n دیود پیوندی p^+-n توسط

$$I_p / x-w_n = qS\Delta_{p_n} A$$

S سرعت بازترکیب سطحی

جریان بازترکیب

پیش ولت موافق، تراکم حاملها را در لبه های لایه بار فضایی افزایش می دهد، $p_n > n_i^2$.

در لایه بار فضایی پیوندگاه انتظار بازترکیب وجود دارد. جریان بازترکیب توسط

$$I_{rec} = qA \int_0^W U dx$$

تعریف می شود.

بازترکیب حداکثر وقتی رخ می دهد که $n = p$

جریان تونلی

- وقتی طرف p و طرف n هر دو به میزان زیادی با ناخالصیها آلاینده شوند، برخی از حاملها ممکن است به داخل سد پتانسیل نفوذ و یک جریان اضافی تولید کنند. (1) تراز فرمی در داخل نوار رسانش یا نوار ظرفیت قرار گرفته باشد؛ (2) عرض لایه بار فضایی چندان باریک باشد که احتمال تونل زنی زیاد باشد، و (3) در یک تراز انرژی، الکترونیایی در نوار رسانش نوع n و حالات خالی در نوار ظرفیت نوع p وجود داشته باشند.

وابستگی مشخصات V-I به دما

$$\left. \frac{DV}{DT} \right|_{I=const.} = \frac{V}{T} - V_T \left(\frac{1}{I} \frac{dI}{dT} \right)$$

و

$$\left. \frac{DI}{DT} \right|_{V=const.} = I \left(\frac{1}{I} \frac{dI}{dT} - \frac{V}{TV_T} \right)$$

جریان اشباع

$$I_s = qAn_i^{\checkmark} \left(\frac{D_p}{L_p N_d} + \frac{D_n}{L_n N_a} \right)$$

پارامترهای داخل پرانتز به تغییر دما نسبتاً غیر حساس اند.

$$I_s \propto n_i^{\checkmark} \propto T^{\checkmark} e^{-E_{go}/kT}$$

وابستگی دمایی شدت جریان

$$\frac{I}{I_0} \frac{dI}{dT} = \frac{3}{T} + \frac{E_E}{kT^2} \approx \frac{E_{go}}{kT^2}$$

جمله $3/T$ قابل اغماض است.

$$\frac{dV}{dT} = \frac{qV - E_{go}}{qT}$$

$$\frac{dI}{dT} = \frac{E_{go} - qV}{kT^2}$$

ظرفیت پخشی

برای یک پیوندگاه $p^+ - n$ ، $i_p(0) = i$ و $i_p(0) = I$. لذا، رسانش
ظاهری (گذرای) دیود به

$$y = \frac{i_p(\omega)}{V_a} = \frac{I}{V_T} \sqrt{1 + j\omega\tau_p} \approx \frac{1}{V_T} + j \frac{\omega\tau_p I}{2V_T}$$

با بکار بردن $\omega\tau_p \gg 1$

ظرفیت پخشی

$$\frac{dI}{I dT} = \frac{E_{go} - qV}{kT^2}$$

ظرفیت گذار، نمایه سازی ناخالصی، و دیود ظرفیت متغیر (و راکتور)

$$Q = qAN_dW = A\sqrt{2qK\varepsilon(\psi_0 + V_R)N_d}$$

ظرفیت و سیگنال کم دامنه لایه بار فضایی

$$C \equiv \frac{dQ}{dV_R}$$

$$C = A \left[\frac{qK\varepsilon N_d}{2(V_R + \psi_0)} \right]^{1/2}$$

C را ظرفیت گذار یا ظرفیت لایه تهی می نامند.

$$\frac{1}{C^2} = \frac{2}{qK\varepsilon N_d A^2} (V_R + \psi_0)$$

تراکم ناخالصی

در یک پیوندگاه p-n با نمایه ناخالصی نامعلوم، می‌توان با استفاده از منحنی ظرفیت - ولتاژ، توزیع ناخالصی را در طرفی که آلایش آن کمتر است پیدا کرد.

$$dQ = qAN(W)dW$$

$N(W)$ تراکم ناخالصی در لبه لایه بار فضایی W است.

$$D\mathcal{E} = \frac{dV}{W}$$

$$D\mathcal{E} = \frac{dQ}{K\epsilon \cdot A}$$

$$\frac{dQ}{dV} = \frac{AK\epsilon}{W} \equiv C$$

$$N(W) = \frac{2}{qK\epsilon \cdot A^2} \frac{1}{d(1/C^2)/dV}$$

مثال

مثال. یک پیوندگاه p-n را که توسط پخش دومرحله ای به داخل یک نمونه $N_d = 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ تراکم سطحی بور 10^{18} cm^{-3} ، و عمق پیوندگاه $5 \mu\text{m}$ است. پتانسیل داخلی 0.8 V است؛ ظرفیت پیوندگاه را در پیش ولت مخالف 5 V بدست آورید.

حل: $N_{BC} = 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ و $N_o = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ $N_{BC} / N_o = 2 \times 10^{-3}$

$$\frac{\psi_o + V_R}{N_{BC}} = \frac{0.8}{2 \times 10^{15}} = 4 \times 10^{-16}$$

$$C = 4 \times 10^3 \text{ pF} / \text{cm}^2$$

حال

دیود ظرفیت متغیر

ظرفیت یک پیوندگاه p-n با پیش ولت مخالف، برای مدارهای کوک شونده LC که در آنها بسامد تشدید توسط یک ولتاژ خارجی کنترل می‌شود مفید است. به دیود ظرفیت متغیر معروف است.

$$C = C_0 (V_R + \psi_0)^{-n}$$

آن V_R ولتاژ معکوس است.

بسامد تشدید

برای پیوندگاه پله ای یکطرفه $n = 2/1$. بسامد تشدید یک مدار LC

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{(V_R + \psi.)^{n/2}}{\sqrt{LC}}$$

$n = 2$ خصوصیت ویژه در دیود «ظرفیت متغیر» فوق آنی بدست می آید.

انباشت بار و گذار معکوس: دیود بازیافت پله ای

با یک پیش ولت موافق ثابت، حاملها به دیود پیوندی p-n تزریق و در آنجا انبار می‌شود. انباشت بار موقتی حاملهای اقلیتی را بازیافت معکوس گذار می‌نامند.

معادله کنترل بار

بار انباشته کل در طرف n را چنین تعریف می‌کنیم.

$$Q_s = qA \int_0^{W_R} \Delta p_n dx$$

که W_n ضخامت طرف n از پیوندگاه تا محل اتصال اهمی

$$I_p(\cdot) - I_p(W_n) = \frac{dQ_s}{dt} + \frac{Q_s}{\tau_p}$$

این معادله را معادله کنترل بار می‌نامند.

بار انباشته

در یک دیود طویل $I_p(W_n)$ صفر است. جریان پیش رو حالت پایای دیود با قرار دادن $dQ_s/dt = 0$ بدست می‌آید.

$$I_f = I_p(\cdot) = \frac{Q_{sf}}{\tau_p}$$

Q_{sf} بار انباشته در حالت پایای وضعیت پیش ولت موافق است لذا

$$Q_{sf} = I_f \tau_p$$

زمان انباشت

جریان منفی I_r با مخالفت کردن پیش ولت در $t = 0$ معادله کنترل بار به

$$-I_r = \frac{dQ_s}{dt} + \frac{Q_s}{\tau_p}$$

تبدیل می‌شود.

$$Q_s(t) = \tau_p [-I_r + (I_f + I_r)e^{-t/\tau_p}]$$

حال زمان انباشت t_s را لحظه ای تعریف می‌کنیم که در آن تمام بار انباشته

از بین رفته باشد، یعنی $Q_s \cong 0$

$$\operatorname{erf} \sqrt{\frac{t_s}{\tau_p}} = \frac{I_f}{I_r + I_f}$$

$$t_s = \tau_p \ln \left(1 + \frac{I_f}{I_r} \right)$$

شکست بهمنی در پیوندگاههای p-n

پیوندگاه p-n وقتی به وضعیت شکست می‌رسد که اندک افزایشی در پیش ولت مخالف، جریان خیلی زیادی را تولید کند.

باتری خورشیدی و دیود نور گسیل

سازوکار تبدیل انرژی نوری به انرژی الکتریکی را اثر فوتوولتایی می‌گویند. تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی نوری، اثر الکترو لومینسان نامیده می‌شود. پیوندگاه p-n که تحت اعمال جریان با پیش ولت موافق نور گسیل می‌کند، به دیود نور گسیل (LED)

جذب (در آشامی) نوری در نیمرسانا

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{hc}{E_{ph}} = \frac{1/24}{E_{ph}} \mu m$$

وقتی نیمرسانایی تحت نوردهی قرار می‌گیرد، فوتونهای با انرژی کمتر از E_g توسط نیمرسانا جذب نمی‌شوند.

جذب فوتون

به ازای $E_{ph} = E_g$ ، فوتونها جذب می‌شوند زوجهای الکترون -
حفره خلق می‌کنند. انرژی اضافی $E_{ph} - E_g$ به شکل گرما
تلف می‌شود.

شار فوتون

چشمه نوری نور تکفام با $h\nu > E_g$ و شار F_{ph} فوتونهای جذب شده در Δx

$$\alpha F(x) \Delta x$$

که α ضریب تناسب است و ضریب جذب نامیده می‌شود. از پیوستگی نور

$$F(x + \Delta x) - F(x) = \frac{dF(x)}{dx} \Delta x = -\alpha F(x) \Delta x$$

یا

$$-\frac{dF(x)}{dx} = \alpha F(x)$$

با شرط مرزی $F = F_{ph}$ در $x = 0$

$$F(x) = F_{ph} e^{-\alpha x}$$

$$F_t = F(d) = F_{ph} e^{-\alpha d}$$

که d ضخامت نیمرسانا است. α تابع $h\nu$ است.

1 فیزیک قطعات نیمه رسانا

اثر فوتوولتایی و کارایی باتری خورشیدی

فرایند تبدیل انرژی نوری به انرژی الکتریکی در یک پیوندگاه p-n شامل مراحل اساسی زیر است:

(1) فوتونها جذب می‌شوند بطوریکه زوجهای الکترون - حفره در هر دو طرف p و n پیوندگاه تولید می‌شوند.

(2) الکترونها و حفره هایی که در فاصله یک طول پخش از پیوندگاه تولید شده‌اند، بر اثر پدیده پخش به ناحیه بار فضایی می‌رسند

(3) سپس زوجهای الکترون - حفره توسط میدان الکتریکی قوی از هم جدا می‌شوند.

حساسیت چشم و روشنایی

واکنش چشم انسان، که ضریب درخشانی نامیده می‌شود، روشنایی LED را بعنوان مقیاسی برای اثر مرئی تابش

$$B = 1150 \cdot L \frac{J}{\lambda} \frac{A_j}{A_s} \eta_{ext}, fL$$

λ طول موج گسیل بر حسب μm ، J چگالی جریان، A/cm^2 ، L ضریب درخشانی در lm/W ، A_j مساحت پیوندگاه p-n و A_s مساحت سطح مشاهده شده گسیلنده. واحد روشنایی فوت لمبرت (fL) است.

گسیلنده های GaAs

LED های GaAs نوعی را با بخش ناخالصی حالت جامد می‌سازند، عنصر نوع p که به داخل یک بستر نوع n آلاینده با قلع، تلور، یا سیلیسیم پخش شده است، بکار می‌رود.

LED های GaP ها

- دیودهای گالیم فسفید، با گاف انرژی $3/2 \text{ eV}$ ، بسته به ساز و کار بازترکیب، نور سرخ یا سبز گسیل می‌کنند، بازترکیب در نیمرسانای با گاف غیرمستقیم مثل GaP، از طریق ترازهای ناخالصی رخ می‌دهد.

دیود GaP سرخ

ساز و کار تابش در دیود سرخ از طریق یک زوج ناخالصی
بخشنده – پذیرنده صورت می‌گیرد. وقتی بخشنده ها و پذیرنده ها
بطور همزمان در نیمرسانا حضور داشته باشند، بخشی از حالات
بخشنده و پذیرنده اشغال خواهد بد.

انرژی فوتو تابشی

$$h\nu = E_g - (E_d + E_a) + \frac{q^2}{K_s \epsilon \cdot r}$$

دیود GaP ی سبز

- گسیل نور سبز در GaP مشاهده شده این اثر را به بازترکیب در اتم ازت در جایگاه یک اتم فسفر نسبت می‌دهند.
- جانشین فسفر توسط یک اتم ازت را ایزوالکترونیک (هم الکترونی) می‌نامند.

ترانزیستور با اثر میدان پیوندی (JFET):

- یک نیمرسانای سه پایانه است که در آن شارش جریان جانبی توسط میدان الکتریکی عمودی اعمال شده از خارج کنترل می‌شود.

تولید JFET

- JFET را می‌توان به روش پخش مضاعف، با کانال و دریچه بالایی پخشی تولید کرد.
- JFET هایی هستند که کانال آنها از نوع n است، زیرا کانال ناخالصیهای بخشنده آرایش یافته و جریان کانال ناشی از الکترونهاست.

تنگش

- وقتی نواحی بار فضایی به هم می‌رسند و تمام حامل‌های آزاد از ناحیه وصل شده کاملاً تخلیه می‌شوند. این وضعیت را تنگش می‌نامند.
- افزایش باز هم بیشتر ولتاژ در رو بعد از تنگش، جریان در رو را چندان افزایشی نخواهد داد.

پیوندگاه دريچه

پیوندگاه های دريچه، از نوع پیوندگاه های پله ای یکطرفه هستند،

عرض لایه تهی در $JFET$

$$W(x) = \left\{ \frac{2K\epsilon_0[V(x) + \psi_0 - V_G]}{qN_d} \right\}^{1/2}$$

که در آن $V(x) - V_g$ ولتاژ سرتاسر پیوندگاه x با پیش ولت مخالف در x است.

جریان دررو

جریان دررو گرادیان الکترونها صفر است و مؤلفه جریان پخش را می‌توان نادیده گرفت.

$$I_D = -q\mu_n n A \varepsilon = 2q\mu_n N_d (a - W) Z \frac{dV}{dx}$$

I_p معروف جریان در رو و $2(a-W)Z$ سطح مقطع است.

رسانایی کانال بدون لایه های تهی

$$G_{\cdot} = \frac{\gamma q a Z \mu_n N_d}{L}$$

ولتاژ تنگش داخلی

عرض لایه بار فضایی در نقطه تنگش دقیقاً برابر با عرض کانال است. ولتاژ تنگش با قرار دادن $W = a$ و $V - V_G = V_p$

$$V_p + \psi_s = \frac{qa^2 N_d}{2K\epsilon_s} = V_{PO}$$

که V_p ولتاژ اعمال شده خارجی برای رسیدن به وضعیت تنگش، یعنی، ولتاژ تنگش است. V_{PO} ولتاژ تنگش داخلی

ناحیه خطی

شیب منحنیهای $I - V$ در نزدیکی مبدأ تابعی از ولتاژ دریاچه است. این ناحیه کار، ناحیه خطی نام دارد.

رابطه جریان - ولتاژ ناحیه خطی با قرار دادن $V_D \ll \psi_0 - V_G$ بدست می آید.

$$(\psi_0 - V_G)^{3/2} \left(1 + \frac{V_D}{\psi_0 - V_G}\right)^{3/2} \approx (\psi_0 - V_G)^{3/2} \left(1 + \frac{3}{2} \frac{V_D}{\psi_0 - V_G}\right)$$

$$I_D = G_0 \left(1 - \sqrt{\frac{\psi_0 - V_G}{V_{PO}}}\right) V_D$$

ناحیه اشباع

در نقطه تنگش

$$V_D - V_G = V_P$$

مشخصه های جریان - ولتاژ بعد از تنگش، ناحیه اشباع نامیده می شود زیرا جریان در رو اشباع است.

جریان اشباع در رو

جریان در رو در اشباع، I_{DS}

$$I_{DS} = G_o \left(\frac{2}{3} \sqrt{\frac{\psi_o - V_G}{V_{PO}}} - 1 \right) (\psi_o - V_G) + \frac{G_o V_{PO}}{3}$$

جریان اشباع در رو را بصورت تابعی از ولتاژ دريچه بیان می‌کند. این را مشخصه انتقال می‌نامند.

$$I_{DS} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_G}{V_{PO}} \right)^2$$

I_{DSS} ، جریان اشباع در رو در ولتاژ دريچه صفر، را مشخص می‌کند.

جریان نشتی دريچه

- جریان نشتی دريچه، مجموع جريانهای اشباع معکوس، تولید، و نشتی سطحی
- در هر JFET صفحه ای، مؤلفه نشتی سطحی معمولاً ناچیز

ولتاژ شکست

شکست در انتهای دررو کانال رخ می‌دهد زیرا دارای بالاترین
پیش ولت مخالف است.

ولتاژ شکست

$$V_B = V_{DO} + V_G$$

ترانزیستورهای دوپیوندی دوحاملی

- قطعه ای است سه پایانی و کارآمدومی تواند هم به عنوان تقویت کننده به کار برده شود و هم به عنوان کلید (BJT)

ترانزیستورهای n-p-n-p

- قطعاتی با پایداری دوگانه هستند که کار آنها بستگی به سازوکار فیدبک داخلی دهر دوه به حالت‌های پایدار با مقاومت ظاهری بالا و پایین می انجامد.
- قطعات توان پایین برای مدارهای کلیدزنی و منطقی و قطعات توان بالا برای کلیدهای ac کنترل فاز مبدل‌های توان و برشگرهای dc کاربرد دارند.

ترانزیستور نوع n-p-n

- متشکل از یک لایه سیلیسیومی نوع p که بین دو لایه سیلیسیوم نوع n ساندویچ شده است

ترانزیستور نوع p-n-p

متشکل از یک لایه نوع n که بین دو لایه از ماده نوع p ساندویچ شده است

مشخصه های اساسی ترانزیستور

- گسیلنده
- پایه
- گردآور

ناحیه قطع

- وضعیتی است که پیوندگاههای گسیلنده و گردآور هر دودارای پیش ولت مخالف باشند

ناحیه فعال عادی

- پیوندگاه گسیلنده دارای پیش ولت موافق و پیوندگاه گردآور دارای پیش ولت مخالف است

ناحیه اشباع

- هر دو پیوندگاه دارای پیش ولت موافقند
- در ناحیه فعال عادی ترانزیستور به عنوان یک تقویت کننده عمل میکند
- یک کلید ترانزیستوری بین نواحی اشباع (وصل) و قطع (خاموش) افت و خیز میکند

ترانزیستورهای پایه شیبدار

- توزیع شیبدار ناخالصی در پایه میدان الکتریکی داخلی ایجاد میکند.
- این میدان که حفره‌ها را در جای خود نگه میدارد در جهتی است که به ترابری الکترونها تزیق شده در بیشتر نواحی پایه کمک میکند.

عدد گومل

- تعداداتمهای ناخالصی در پایه را عددگومل گویند
- هرچه عددگومل کوچکتر باشد عرض پایه باریکتر و جریان الکترون بیشتر خواهد بود.

جریان پایه

- جریان حامل اکثریتی است که عمود بر جهت جریان حامل اقلیتی تزریق شده از گسیلنده شارش می یابد.
- این جریان پایه یک افت پتانسیل جانبی در هر دو ناحیه غیر فعال و فعال پایه تولید میکند.

اثر تجمع جریان

- در ناحیه فعال تزریق حامل اقلیتی از لبه پایه به طرف داخل آن نزول میکند. تزریق نایکنواخت حامل باعث ایجاد نایکنواختی در امتداد پیوندگاه گسیلنده میشود و یک چگالی زیادتر جریان در نزدیکی لبه ها خواهد بود که اثر تجمع جریان نام دارد.

مقاومت پخش پایه

- عبارت است از حاصل جمع مقاومت‌های پایه فعال و غیرفعال

پاسخ ترانزیستورها به بسامد

انواع بسامدها:

- بسامد قطع پایه-مشترک
- بسامد گسیلنده-مشترک
- حاصلضرب بهره در پهنای نوار

www.salampnu.com

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

- ✓ نمونه سوالات پیام نور : بیش از ۱۱۰ هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه
- تستی و تشریحی
- ✓ کتاب ، جزوه و خلاصه دروس
- ✓ برنامه امتحانات
- ✓ منابع و لیست دروس هر ترم
- ✓ دانلود کاملاً رایگان بیش از ۱۴۰ هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور

www.salampnu.com